การออกแบบเครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556

#### **DESIGN OF DIELECTRIC HEATING SYSTEM**

Kongsak Ratniyomchai

ะ ราวักยาลัยเทคโนโล

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Telecommunication Engineering

Suranaree University of Technology

Academic Year 2013

## การออกแบบเครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ผศ. ดร.ชุติมา พรหมมาก) ประธานกรรมการ (ผศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา) กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) (ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์) กรรมการ

> (รศ. ร.อ. คร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

(ศ. คร.ชูกิจ ถิ่มปีจำนงค์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม คงศักดิ์ รัตน์นิยมชัย : การออกแบบเครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก (DESIGN OF DIELECTRIC HEATING SYSTEM) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา, 116 หน้า.

การให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กคริก (dielectric heating) ได้รับความสนใจอย่างมาก และมีการ ใช้ประ โยชน์อย่างแพร่หลาย ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมด่าง ๆ ทางการแพทย์และทางการเกษตร เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน ซึ่งลักษณะของการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก ทำงาน โดยอาศัยกลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านกลิ่นความถี่วิทยุส่งผ่านเข้าไปในเนื้อวัสดุ โดยวัสดุ ที่สามารถใช้การให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกได้จะต้องเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อกลิ่น แม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวคือ จะต้องเป็นวัสดุที่มีโกรงสร้างโมเลกุลแบบมีขั้ว ส่วนใหญ่จะใช้ในงาน อุตสาหกรรมครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมการ อบแห้ง การถนอมอาหารและการกำจัดแมลงศัตรูพืช เป็นค้น ซึ่งการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก ที่ย่านกลิ่นความถี่วิทยุ โดยส่วนใหญ่จะออกแบบเป็นวงจรขยายสัญญาณ ใช้ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ ในการให้ความร้อน ซึ่งงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบเป็นวงจรขยายสัญญาณ ใช้ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ ในการให้ความร้อน ซึ่งงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบเป็นวงจรขยายสัญญาณ ใช้ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ ในการให้ความร้อน ซึ่งงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบเทรื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกย่านกลิ่นความถี่ วิทยุ ซึ่งใช้หลักการส่งผ่านกลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังเนื้อวัสดุ โดยประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ ภาควงจรขยายสัญญาณกำลังสูง (power amplifier) ซึ่งวงจรขยายสัญญาณกำลังงาน ส่วนที่สองคือ โหลดซึ่งเป็นแผ่นเพลตจะเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก และ สามารถนำเครื่องที่ได้ออกแบบนำไปประยุกต์ใช้ในการให้ความร้อนสำหรับวัสดุโดอิเล็กตริก และ

้<sup>ว</sup>ทยาลัยเทคโนโลยี่<sup>ส</sup>ุรี

สาขาวิชา<u>วิศวกรรมโทรคมนาคม</u> ปีการศึกษา 2556 ลายมือชื่อนักศึกษา\_\_\_\_\_ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา\_\_\_\_\_

## KONGSAK RATNIYOMCHAI: DESIGN OF DIELECTRIC HEATING SYSTEM. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. CHANCHAI THONGSOPA, Ph.D., 116 PP.

#### RADIO FREQUENCY CIRCUIT/POWER AMPLIFIER/DIELECTRIC HEATING

Nowadays, the dielectric heating technique are extremely interested and widely applied for industry, medical profession, and agricultural. Because of the dielectric heating has highly efficiency and be saved energy of the system. A feature of dielectric heating function using radio frequency electromagnetic waves which are transmitted in material. the material that can be used to heat the dielectric, it must be qualified material that respond to electromagnetic waves. In other words, the material could be polar molecules structure, which is mostly applied for household and large industries, e.g. ceramic industry heating is mostly designed by using an amplified circuit at radio frequency of 65 MHz . In this research thesis the dielectric heating is designed at radio wave frequency by using transmitted electromagnetic waves principle into material. The two main components of the system the power amplifier and load. The power amplifier is a MOSFET BLF578 to design push pull circuit in AB class for the power supply. Moreover, the electromagnetic field is constructed by using the plate to heat a dielectric. Furthermore, the dielectric heating technique can be adapted to heat for dielectric material.

School of <u>Telecommunication Engineering</u>	Student's Signature
Academic Year 2013	Advisor's Signature

#### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งด้านวิชาการและ ด้านดำเนินงานวิจัย จากบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ชาญชัย ทองโสภา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมาโคยตลอค รวมทั้งช่วยตรวจทานและแก้ไข วิทยานิพนธ์เล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ชุติมา พรหมมาก หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม รองศาสตราจารย์ คร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.รังสรรค์ ทองทา ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก คร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ คร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.วิภาวี หัตถกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.มนต์ทิพย์ภาอุฑารสกุล ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ คร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ปียาภรณ์ กระฉอดนอก อาจารย์ คร.บุญส่ง สุตะพันธ์ และอาจารย์ คร.ธนเสฎฐ์ ทศดีกรพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม

โทรกมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ความรู้ทางวิชาการและให้โอกาสในการศึกษา ขอขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ บัณฑิตศึกษาทุกท่าน รวมถึงมิตรสหายทั้งในอดีต และปัจจุบันที่คอยให้ความช่วยเหลือ และคอยให้กำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา รวมถึงญาติพี่น้องของผู้วิจัยทุกท่าน ที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น และให้การสนับสนุนทางการศึกษาอย่างดียิ่ง มาโดยตลอด อีกทั้งเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ในยามที่ผู้วิจัยท้อแท้และทุกข์ใจ ทำให้ผู้วิจัยประสบ ความสำเร็จในชีวิตเรื่อยมา สำหรับคุณงามความคือันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบ ให้กับบิดามารดา รวมถึงญาติพี่น้องซึ่งเป็นที่รักและเการพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ผู้สอนที่เการพ ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้วิจัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน จนสำเร็จการศึกษา

คงศักดิ์ รัตน์นิยมชัย

## สารบัญ

บทคัดเ	บทคัดย่อ (ภาษาไทย)ก				
บทคัดเ	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ				
กิตติกร	รรมปร	ะกาศ	ค		
สารบัญ	ນູ		্ থ		
สารบัญ	บูตาราง	a	ช		
สารบัญ	บูรูป <u></u>		<b>ന</b>		
คำอธิบ	ายสัญ	ลักษณ์และคำย่อ	ฏ		
บทที่					
1	บทนํ	n	1		
	1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1		
	1.2	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2		
	1.3	ข้อตกลงเบื้องต้น2			
	1.4	ขอบเขตของการวิจัย2			
	1.5	วิธีดำเนินการวิจัย2			
	1.6	ประโยชน์ที่กาดว่าจะได้รับ3			
	1.7	ปริทัศน์วรรณกรรม3			
	1.8	รายละเอียดในวิทยานิพนธ์			
2	ทฤษ	ฎีวงจรความถี่วิทยุและการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก <u></u>	10		
	2.1	กล่าวนำ	10		
	2.2	หลักการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก	10		
		2.2.1 คุณสมบัติของไคอิเล็กตริก	10		
		2.2.2 กลไกการให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริก <u>.</u>			
	2.3	หลักการพื้นฐานของการกระจายความร้อนด้วยคลื่นสนามไฟฟ้า			
		2.3.1 หลักการกระจายคลื่นสนามไฟฟ้า			
		2.3.2 วงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรม (Series resonance circuit)			

# สารบัญ (ต่อ)

	2.4	วงจรา	งยายสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ16		
		2.4.1	คุณลักษณะวงจรขยายสัญญาณ <u>.</u> 17		
		2.4.2	การออกแบบวงจรขยายสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุแบบ พุช-พูล18		
		2.4.3	บาลัน (BALUN)19		
		2.4.4	การเคลื่อนที่ของคลื่นสัญญาณผ่านสายโอแอกเชียล20		
		2.4.5	มอสเฟตทรานซิสเตอร์ (MOSFET: Metal Oxide Semiconductor		
			Field Effect Transistor)22		
		2.4.6	การแมตช์อิมพีแคนซ์ของวงจรขยายสัญญาณกลื่นความถี่วิทยุ25		
	2.5	สรุป_			
3	การอ	อกแบบ	<b>เวงจรขยายสัญญาณคลื่นความถ</b> ี่วิทยุและแผ่นเพลต		
	สำหรั	รับเครื่อ	งให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก34		
	3.1	กล่าว	นำ34		
	3.2	การออ	รออกแบบวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุ		
		3.2.1	การออกแบบบาลัน โดยการวนแผนภูมิสมิท37		
		3.2.2	การออกแบบวงจรแมตช์ซิ่งอิมพีแคนซ์โดยการวนแผนภูมิสมิท41		
		3.2.3	การออกแบบบาลัน โดยใช้โปรแกรม Smith V3.1044		
		3.2.4	การออกแบบวงจรแมตช์ซิ่งอิมพิแคนซ์โคยใช้โปรแกรม Smith V3.1050		
		3.2.5	วงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุที่ความถี่ 65 เมกกะเฮิรตซ์ <u></u> 55		
	3.3	การออ	อกแบบแมตซ์ซิ่งแผ่นเพลตสำหรับเครื่องให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริก <u></u> 63		
		3.3.1	การวิเคราะห์การส่งผ่านความร้อนแก่วัสดุไดอิเล็กตริก65		
		3.3.2	การวิเคราะห์พลังงานที่เกิดขึ้นในไดอิเล็กตริก65		
		3.3.3	การพิจารณาพลังงานและความถี่ที่เหมาะสมต่ออัตรา		
			การเกิดความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก67		
		3.3.4	การวิเคราะห์กำลังงานของเครื่องสำหรับการให้ความร้อน		
			แก่ไดอิเล็กตริก71		
	3.4	สรุป			

# สารบัญ (ต่อ)

Y
หบา
110

4	การและผลการทดลอง <u>.</u>			
	4.1	กล่าวนำ	75	
	4.2	การวัดและเก็บผลการทดลองวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุ		
		สำหรับเครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก	75	
		4.2.1 วงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุ	75	
	4.3	การวัดและเก็บผลการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกผ่านแผ่นเพลต		
	4.4	สรุป		
5	สรุปเ	งลการวิจัยและข้อเสนอแนะ		
	5.1	สรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์		
	5.2	ปัญหาและข้อเสนอแนะ		
	5.3	แนวทางการพัฒนาในอนาคต		
รายการอ้างอิง				
ภาค	ภาคผนวก93			
	ภาคผ	นวก ก. รายละเอียดข้อมูลทรานซิสเตอร์เบอร์ BLF578	93	
	ภาคผ	นวก ข. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์	108	
ประ	วัติผู้เขี	ยนขายาลัยเกลโนโลยีฉุร	116	

# สารบัญตาราง

ตาราง	ฑารางที่ หน้า		
2.1	ตารางแสดงอินพุตอิมพิแคนซ์และเอาท์พุตอิมพิแคนซ์ของ BLF578		
3.1	แสดงค่าอินพุต / เอาต์พุตอิมพิแคนซ์ ที่ได้จากการคำนวณ		
3.2	ตารางแสดงค่าองค์ประกอบในแผนภูมิสมิทของวงจรบาลันทางค้านอินพุต <u></u>	46	
3.3	ตารางแสดงค่าองค์ประกอบในแผนภูมิสมิทของวงจรบาลันทางด้านเอาท์พุต	48	
3.4	ตารางแสดงค่าองค์ประกอบในแผนภูมิสมิทของวงจรแมตช์ซิ่งอิมพิแคนซ์		
	ด้านอินพุต	51	
3.5	ตารางแสดงค่าองค์ประกอบในแผนภูมิสมิทของวงจรแมตช์ชิ่งอิมพิแคนซ์		
	ด้านเอาท์พุต	54	
3.6	ตารางแสดงค่าต่าง ๆ ของวงจรขยายกำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุด้านอินพุต	58	
3.7	ตารางแสดงค่าต่าง ๆ ของวงจรขยายกำลังส่งสัญญาณกลื่นวิทยุด้านเอาท์พุต	60	
3.8	ค่าความหนาแน่นของกำลังงานที่เกิดขึ้นในตัวมอดข้าว ณ เวลาใดๆ	66	
3.9	ค่าความเข้มสนามไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการให้ความร้อนในตัวมอดข้าวในแต่ละ		
	ช่วงความถี่โดยใช้เวลา 5 วินาที		
3.10	ค่าความความเข้มของสนามไฟฟ้าที่เวลาใด ๆ	70	
3.11	แสดงผลการคำนวณแรงดันตกคร่อม กรแสภายในวงจรและกำลังงานของแหล่งจ่าย		
	ที่เวลาใดๆ	72	
4.1	ค่าจากการทคลองวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ <u>์</u>	78	
4.2	ค่าที่ได้จากการคำนวณของวงจรงยายสัญญาณที่ความถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ์		
4.3	แสดงอัตราการตายของมอดข้าวโดยใช้เวลา 10 วินาทีที่กำลังงาน 20 - 200 วัตต์		
4.4	แสดงอัตราการตายของมอดข้าวโดยใช้เวลา 5 วินาทีที่กำลังงาน 140 - 240 วัตต์		
4.5	แสดงอัตราการตายของมอดข้าวโดยใช้เวลา 1 วินาทีที่กำลังงาน 340 - 420 วัตต์		

# สารบัญรูป

รูปที		หน้า
1.1	หลอดแมกนีตรอนที่ใช้เป็นแหล่งกำลังงานสำหรับให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก	4
1.2	การเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าและไคโพลเนื่องจากคลื่นสนามไฟฟ้า	5
1.3	การให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริกย่านความถี่วิทยุและย่านความถี่ไมโครเวฟ	
	กับมอดข้าวสาถีจนมีอัตราการตายที่ 99-100%	6
1.4	การใช้คลื่นความถี่ 39 MHz และ 2450 MHz เปรียบเทียบกับอุณหภูมิ	
	ของข้าวสาลีต่อการตายของมอดข้าว	7
1.5	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการสูญเสียยังผลไคอิเล็กตริก	
	กับความถี่ของมอดข้าวและข้าวสาลี	
2.1	โครงสร้างวงจรเครื่องให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริก	11
2.2	อะตอมระหว่างประจุบวกต่อประจุลบของตัวกลาง	
2.3	วงจรชีวิตมอดข้าว	
2.4	รูปแบบตัวปล่อยคลื่นสนามไฟฟ้าแบบแผ่นเพลต	14
2.5	วงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรม	
2.6	ลักษณะวงจรขยายสัญญาณ	17
2.7	แสดงโครงสร้างของวงจรขยายกำลังสัญาณคลื่นวิทยุแบบพุช - พูล	
2.8	แสดงการทำงานของบาลัน	
2.9	แสดงโครงสร้างของบาลัน	20
2.10	แสดงขนาดของสายโกแอกเชียล	
2.11	แสดงรูปแบบมอสเฟต BLF578	
2.12	กราฟแสคงอินพุตและเอาท์พุตอิมพีแคนซ์ของมอสเฟต	
2.13	โครงข่ายแมตช์ซิ่งอิมพีแดนซ์	
2.14	โครงข่ายแมตช์ชิ่งอินพุตอิมพีแคนซ์	
2.15	โครงข่ายแมตช์ซิ่งเอาต์พุตอิมพีแคนซ <u>์</u>	
2.16	โครงสร้างของแผนภูมิสมิท	
2.17	การกำหนดจุดบนแผนภูมิสมิท	28

# ~1<u>a</u>

y\_

# สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	۹	าน้ำ
2.18	ทิศทางการเคลื่อนที่ของการแมตซ์อุปกรณ์บนแผนภูมิสมิท	_29
2.19	การอ่านค่าความยาวของส่วน โค้งบนแผนภูมิสมิท	.30
2.20	แสดงการแมตช์อิมพีแคนซ์บนแผนภูมิสมิทโดยใช้โปรแกรม Smith V3.10	31
2.21	แสดงวงจร โครงข่ายแมตช์อิมพีแคนซ์ <u></u>	32
3.1	โครงสร้างของเครื่องให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริกที่ออกแบบ	.34
3.2	การหาค่าความยาวบนแผนภูมิสมิทเพื่อจำกัดค่าจริงค้านบาลันอินพุต <u></u>	38
3.3	วงจร โครงข่ายแมตช์ซิ่งบาลันอินพุต	39
3.4	การหาก่ากวามยาวบนแผนภูมิสมิทเพื่อจำกัดก่างริงด้านบาลันเอาต์พุต <u>.</u>	40
3.5	วงจร โครงข่ายแมตช์ซิ่งบาลันเอาต์พุต	41
3.6	การหาค่าความยาวบนแผนภูมิสมิทเพื่อจำกัดค่าจริงค้านแมตซ์ซิ่งอิมพีแคนซ์อินพุต <u></u>	42
3.7	วงจร โครงข่ายแมตช์ซิ่งอิมพีแคนซ์อินพุต	43
3.8	การหาก่ากวามยาวบนแผนภูมิสมิทเพื่อจำกัดก่าจริงด้านแมตซ์ซิ่งอิมพีแดนซ์เอาต์พุต <u></u>	43
3.9	วงจร โครงข่ายแมตช์ซิ่งอิมพีแคนซ์เอาต์พุต	.44
3.10	แสดงการวนแผนภูมิสมิทเพื่อหาค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า	
	และค่าความจุไฟฟ้าของวงจรบาลันทางค้านอินพุต	45
3.11	วงจรโครงข่ายแมตช์ซึ่งของวงจรบาลันทางด้านอินพุต	46
3.12	แสดงกวามยาวของสายโคแอกเซียลและก่ากวามจุไฟฟ้าสำหรับแมตซ์ชิ่งบาลันอินพุต <u></u>	47
3.13	แสดงการวนแผนภูมิสมิทเพื่อหาค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า	
	และค่าความจุไฟฟ้าของวงจรบาลันทางค้านเอาต์พุต	48
3.14	วงจร โครงข่ายแมตช์ซิ่งของวงจรบาลันทางค้านเอาต์พุต	48
3.15	แสดงกวามยาวของสายโกแอกเซียลและก่ากวามจุไฟฟ้าสำหรับแมตซ์ชิ่งบาลันเอาต์พุต <u></u>	49
3.16	แสดงการวนแผนภูมิสมิทเพื่อหาค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า	
	และค่าความจุไฟฟ้าของวงจรแมตช์ชิ่งอิมพิแคนซ์ทางค้านอินพุต <u>.</u>	50
3.17	วงจร โครงข่ายแมตช์ซิ่งอิมพิแคนซ์ทางค้านอินพุต	51
3.18	แสดงกวามยาวของสายโกแอกเซียลและก่ากวามจุไฟฟ้าสำหรับแมตซ์ชิ่งด้านอินพุต <u></u>	.52

# สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.19	แสดงการวนแผนภูมิสมิทเพื่อหาก่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า	
	และค่าความจุไฟฟ้าของวงจรแมตช์ชิ่งอิมพิแคนซ์ทางค้านเอาต์พุต <u>.</u>	
3.20	วงจรโครงข่ายแมตช์ชิ่งอิมพิแดนซ์ทางค้านเอาต์พุต <u>.</u>	
3.21	แสดงกวามยาวของสายโกแอกเซียลและก่ากวามจุไฟฟ้าสำหรับแมตซ์ชิ่งด้านเอาต์พุต	
3.22	โครงสร้างของวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์ชนิค LDMOS	
3.23	วงจรไบอัสทรานซิสเตอร์ LDMOS ที่ออกแบบ	
3.24	วงขยายสัญญาณกำลังส่งสูงย่านความถี่วิทยุด้านอินพุต	58
3.25	วงขยายสัญญาณกำลังส่งสูงย่านความถี่วิทยุด้านเอาต์พุต <u></u>	
3.26	วงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุ	61
3.27	แผงวงจรพิมพ์ที่พร้อมลงอุปกรณ์ <u></u>	61
3.28	แสดงแผงวงขยายสัญญาณกำลังส่งสูงย่านคลื่นวิทยุเมื่อลงอุปกรณ์สำเร็จ <u>.</u>	
3.29	วงจรที่ประกอบสำเร็จพร้อมทั้งติดตั้งระบบระบายความร้อน	
3.30	วงจรงยายสัญญาณที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์ <u></u>	<u>63</u>
3.31	แสดงการค่าตัวอุปกรณ์ที่ทำการแมตซ์ชิ่งแผ่นเพลต	
	สำหรับการให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริก	
3.32	แผ่นเพลตที่ใช้ในการทคลองจริง <u>เป็นอย่างออ</u> ่น	
3.33	ความสัมพันธ์ของพลังงานที่เกิดขึ้นในตัวมอดข้าวต่อเวลา <u>.</u>	
3.34	ค่ากวามเข้มสนามไฟฟ้าที่ใช้ในการให้กวามร้อนในตัวมอดข้าวในแต่ละช่วงกวามถี่โดย	
	ใช้เวลา 5 วินาท <u>ี</u>	
3.35	ความสัมพันธ์ของความเข้มสนามไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการฆ่ามอดข้าวต่อเวลา	70
3.36	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งจ่ายกำลังงานกับความเข้มสนามไฟฟ้า <u>.</u>	
3.37	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งจ่ายกำลังกับระยะเวลา	74
4.1	แสดงบล๊อกไดอะแกรมแสดงลักษณะการทดลองวงจรขยายสัญญาณกำลังสูง	
4.2	แสดงการวัดผลการทดลองวงจรขยายสัญญาณกำลังสูง	
4.3	แสดงสัญญาณอินพุตของวงจรขยายสัญญาณกำลังสูง	77
4.4	แสดงสัญญาณเอาต์พุตของวงจรขยายสัญญาณกำลังสูง	77

# สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.5	เปรียบเทียบอัตราขยายสัญญาณช่วงความถี่ 60 - 80 เมกกะเฮิรตซ์ที่กำลังงานต่ำ <u></u>	78
4.6	กราฟแสดงกวามสัมพันธ์ระหว่างกำลังของสัญญาณเอาต์พุต ( $\mathrm{P}_{_{\mathrm{out}}}$ )	
	กับกำลังของสัญญาณอินพุต (P <sub>in</sub> ) ที่กวามถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ <u>์</u>	. 80
4.7	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยาย (Gain) กับกำลังของสัญญาณเอาต์พุต (P <sub>out</sub> )	
	ที่ความถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ <u>์</u>	81
4.8	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน (Effiiciency)	
	กับกำลังเอาต์พุต (P,,,) ที่ความถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ์	
4.9	บล๊อกไดอะแกรมแสดงลักษณะการวัดผลการให้ความร้อนผ่านแผ่นเพลต	82
4.10	การวัดผลจริงสำหรับการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกผ่านแผ่นเพลต	83
4.11	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตายของมอดข้าวเทียบกับกำลังงานที่ใช้ที่	
	เวลา 10 วินาที	. 84
4.12	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตายของมอดข้าวเทียบกับกำลังงานที่ใช้ที่	
	เวลา 5 วินาที	
4.13	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตายของมอดข้าวเทียบกับกำลังงานที่ใช้ที่	
	เวลา 1 วินาที	
4.14	แสดงการเปรียบเทียบผลการกำนวณและผลการวัดจริง	

# คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

A	=	amplitude
Κ	=	stability factor
S-parameter	=	scattering parameter
$S_{11}$	=	input reflection coefficient
$S_{12}$	=	reverse transmission coefficient
$S_{21}$	=	forward transmission coefficient
$S_{22}$	=	output reflection coefficient
Γ	=	reflection coefficient
$\Gamma_{in}$	=	input reflection coefficient
$\Gamma_{out}$	=	output reflection coefficient
$\Gamma_T$	=	load reflection coefficient
$\Gamma_s$	=	source reflection coefficient
Δ	=	delta factor
$Z_{in}$	=	input impedance
$Z_{out}$	=	output impedance
$Z_s$	=	source impedance
$Z_{\scriptscriptstyle L}$	=	load impedance
$\mathcal{E}_r$	=	relative permittivity
$\mathcal{E}_0$	=	permittivity of free space
${\mathcal E}$ "	=	dielectric loss factor of the material
$\mu_0$	=	permeability of free space
f	=	frequency
ω	=	angular frequency
$C_p$	=	Specific heat of the material
ρ	=	density of the material
E	=	electric field intensity
$\Delta t$	=	time duration

# คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (ต่อ)

$\Delta T$	=	temperature rise in the material
IEEE	=	the Institute of Electrical and Electronics Engineers
MOSFET	=	metal oxide semiconductor field effect transistor



## บทที่ 1 บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ที่ผ่านมาการให้พลังงานความร้อนแบบต่าง ๆ นั้นใค้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่าง แพร่หลาย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน เช่น อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมการ ้อบแห้ง และการถนอมผลไม้ เป็นต้น ซึ่งแหล่งพลังงานความร้อนที่นำมาใช้นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการใช้แก๊ส การใช้ขคลวดความร้อน และการใช้คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้นโดยเฉพาะ ้อย่างยิ่งแหล่งพลังงานความร้อนจากการใช้คลื่นความถี่วิทยุและความถี่ไมโครเวฟนั้นกำลังได้รับ ้ความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถทำให้วัสดุที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบมีขั้วสั่นและ ทำให้เกิดความร้อนได้อย่างรวคเร็ว (Oka., et al., 2011); (Li, Wang, and Zhu., 2010) โดยการให้ ความร้อนในย่านคลื่นความถี่วิทยุ ดังที่ได้กล่าวมานั้นจะเป็นเทคนิควิธีการให้ความร้อนแก่ไคอิเล็ก ตริกกับวัสคุที่เป็นอโลหะหรือวัสคุที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบมีขั้ว ซึ่งปัจจุบันนั้นได้มีการ ประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการอบแห้ง และอุตสาหกรรมการถนอมผลไม้ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้การให้ ้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกดังกล่าวกับสิ่งมีชีวิตในกลุ่มของศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ ในภาคการเกษตรได้ เช่น มอดข้าวหรือหนอนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในผลิตผลหรือเมล็ดพืช เพื่อกำจัดได้เป็นอย่างดี (Nelson and Stetson., 1974b.); (Nelson., 1996) เนื่องจากโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตคังกล่าวมีของเหลวหรือมี โครงสร้างโมเลกุลที่สามารถเหนี่ยวนำคลื่นความถี่วิทยุให้เกิดเป็นความร้อนได้ (Edward and Elena., 1997)

ดังนั้นจากความสำคัญของปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาและออกแบบการให้ กวามร้อนแก่ไดอิเล็กตริก เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการกำจัดศัตรูพืช โดยผู้วิจัย จะทำการศึกษาการแพร่กระจายคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก โดยทำการศึกษาและออกแบบวงจรการให้กวามร้อนแก่ไดอิเล็กตริกย่านคลื่นความถี่วิทยุที่สามารถ ปรับความถี่ให้เหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบของความถี่และกำลังงานที่ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบวงจรการให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริกย่านคลื่นความถี่วิทยุ ที่สามารถปรับความถี่ให้เหมาะสมกับวัสดุไคอิเล็กตริก (มอดข้าว)

1.2.2 เพื่อทคสอบและวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก
 ที่ออกแบบและสร้างขึ้น

#### 1.3 ข้อตกลง

 1.3.1 ออกแบบวงจรการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกย่านความถี่วิทยุเพื่อให้ได้วงจรที่มี ประสิทธิภาพสูง และความถี่ที่เหมาะสมกับวัสดุไดอิเล็กตริก (มอดข้าว)

1.3.2 ออกแบบและสร้างวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุ

1.3.3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวงจรและการประยุกต์นำไปใช้งานต่อไป

#### 1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1 ศึกษาหาข้อมูลในการออกแบบเครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกย่านความถี่วิทยุ เพื่อให้ได้วงจรที่มีประสิทธิภาพสูงและความถี่ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

- 1.4.2 ออกแบบและสร้างวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุ
- 1.4.3 ทคสอบผลการทคลองและเก็บผลการทคลอง
- 1.4.4 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวงจรและการประยุกต์ใช้เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

#### 1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

- 1.5.1 แนวทางการดำเนินงาน
  - สำรวจปริทัศน์วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

้<sup>วักย</sup>าลัยเทคโนโลยีสุรุง

- สึกษาออกแบบและสร้างวงจรการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก
- กดสอบและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลที่ได้และแก้ไขสรุปผลให้สมบูรณ์
- 4) จัดทำรายงาน
- 5) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

#### 1.5.2 ระเบียบวิธีวิจัย

เป็นงานวิจัยประยุกต์ ซึ่งคำเนินการตามกรอบงานคังต่อไปนี้

สำรวจปริทัศน์วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ออกแบบวิเคราะห์การให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก เพื่อหาคุณสมบัติ ที่เหมาะสมในการนำไปใช้งาน

- วิเคราะห์คุณสมบัติและปรับแต่งจนได้อุปกรณ์ที่สมบูรณ์
- 1.5.3 สถานที่ทำการวิจัย

ห้องวิจัยและปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย อาการเกรื่องมือ 3 (F3) มหาวิทยาลัย เทกโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นกรราชสีมา 30000

- 1.5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  - 1) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  - 2) ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
  - ไวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)
  - 4) เครื่องวิเคราะห์โครงข่ายเวคเตอร์ (Network analyzer)
  - 5) เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม ( Spectrum analyzer)
  - 6) เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ ( Signal Generator)
- 1.5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
  - เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 เก็บรวบรวมผลจากการออกแบบ สร้าง และวัดผลการทดสอบวงจรการให้ กวามร้อนแก่ไดอิเล็กตริก โดยใช้เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมและเครื่องกำเนิดความถื่

## 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ใค้เครื่องต้นแบบสำหรับการให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริก ที่ทำการออกแบบและสร้างขึ้น สามารถนำไปใช้งานได้จริง เช่น การให้ความร้อนในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นต้น

## 1.7 ปริทัศน์วรรณกรรม

เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการคำเนินการวิจัย ตลอคจนปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปสูวัตถุประสงค์หลักที่ได้ตั้งไว้ โดยได้มีการศึกษาผลงานวิจัย ที่ผ่านมาและอาศัยฐานข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งฐานข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้นงานวิจัยนี้เป็นฐานข้อมูลที่มี ชื่อเสียง และได้รับการขอมรับกันอย่างกว้างขวาง เช่น ฐานข้อมูล IEEE นอกจากนี้ยังได้มีการสืบค้น งานวิจัยจากแหล่งอื่น ๆ เช่น จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ท จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยจาก ผลการสืบค้นที่ได้นั้นจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยต่อไป สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะได้ กล่าวถึง ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย คลื่นสนามไฟฟ้าความถี่สูงสำหรับหารให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก รูปแบบแหล่งจ่ายกำลังงาน และลักษณะการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และออกแบบ ลักษณะการให้ความร้อนกับวัสดุไดอิเล็กตริกให้มีความเหมาะสมและให้มีประสิทธิภาพการใช้งาน สูงสุด โดยผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลมีดังหัวข้อต่อไปนี้

สำหรับในส่วนของวงจรแหล่งจ่ายกำลังงานเป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่ง ซึ่งใน งานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการใช้แหล่งกำลังงานคลื่นวิทยุจากหลอดแมกนิตรอน แสดงดังรูปที่ 1.1 โดยจากการศึกษาข้อมูลของการใช้หลอดแมกนิตรอนพบว่า มีประสิทธิภาพการให้กำลังงานไม่สูง มากนัก มีราคาแพง และเริ่มไม่มีการผลิตใช้งานในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหารูปแบบของ แหล่งจ่ายกำลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง รากาไม่แพงและออกแบบง่าย ซึ่งพบว่า จากความก้าวหน้า ทางด้านอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก โดยสามารถออกแบบโดย ใช้อุปกรณ์มอสเฟสเพียงตัวเดียวสามารถให้กำลังงานได้ถึง 1200 วัตต์ (Tsung-Chi, 2010) และ พบว่ามีประสิทธิภาพการทำงานได้ถึงประมาณ 75 % ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต สามารถ ออกแบบให้อยู่ในช่วงการทำงานที่กว้างได้ เนื่องจากสามารถออกแบบให้เหมาะสมในช่วงความถี่ที่ใช้ งานได้ มีกวามกุ้มก่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะนำมาทดแทนการใช้พลังงานจากหลอดแมกนิตรอน ได้อย่างกุ้มค่า



รูปที่ 1.1 หลอดแมกนีตรอนที่ใช้เป็นแหล่งกำลังงานสำหรับให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก

วัสดุไดอิเล็กตริกสามารถทำให้เกิดความร้อนได้โดยการใช้พลังงานที่มากระตุ้นที่อยู่ ในรูปของ "คลื่นสนามไฟฟ้าความถี่สูง" ซึ่งกลไกของความร้อนที่เกิดขึ้นมาจากสนามไฟฟ้าไป กระตุ้นวัสดุที่มีสถานะเป็นกลางทางไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าที่อยู่ภายในตัวกลางวัสดุไดอิเล็กตริกที่มี การสูญเสียนั้น ๆ จากสภาวะสมดุลทำให้เกิดสภาพเป็นไดโพลที่มีผลต่อสนามไฟฟ้าที่กระตุ้นให้เกิด การโพลาไรซ์ตามทิศทางของสนามไฟฟ้านั้น ซึ่งสนามไฟฟ้าที่กระตุ้นเป็นผลทำให้เกิดการกระจาย กำลังงานในรูปของความร้อนภายในตัวกลางวัสดุไดอิเล็กตริกที่มีการสูญเสีย โดยอีกปรากฏการณ์ หนึ่งที่เกิดควบคู่กันคือ ตัวกลางที่มีการสูญเสียสามารถเกิดความร้อนโดยตรงจากการนำไฟฟ้า เนื่องจากการกระจายตัวของอนุภาคไฟฟ้า ภายใต้อิทธิพลของการกระตุ้นจากสนามไฟฟ้าจาก ภายนอก ทำให้เกิดเส้นทางการนำไฟฟ้าขึ้น ซึ่งแสดงดังรูปที่ 1.2



รูปที่ 1.2 การเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าและไคโพลเนื่องจากกลื่นสนามไฟฟ้า

ในรูปที่ 1.2 เป็นการสลับกลับไปมาของการโพลาไรซ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสนามไฟฟ้ามีการ เปลี่ยนแปลงสลับทิศทาง (ขั้ว) ไปมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นกลไกพื้นฐานของการเกิดความร้อนโดย การใช้ "กลื่นสนามไฟฟ้าความถี่สูง" ในการให้ความร้อนกับตัวกลางวัสดุ ไดอิเล็กตริกที่มีการ สูญเสีย โดยสำหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นไปทางการให้ความร้อนเพื่อเป็นการศึกษาความ เป็นไปได้ในการควบคุมแมลง การกำจัดแมลงที่อยู่ในธัญพืช นั่นคือการให้ความร้อนกับกลุ่มแมลง ด้วยกลื่นความถี่วิทยุหรือคลื่นไมโครเวฟ ดังนั้นจึงได้มีการศึกษา ค้นคว้า การให้ความร้อนกับกลุ่มแมลง ไมมลงขึ้น ซึ่งจากงานวิจัยของ Nelson (1996) ได้ทำการวิจัยเรื่องคลื่นความถี่วิทยุและความถี่ ใมโครเวฟที่ 39 MHz และ 2450 MHz ในการหาช่วงความถี่ที่เหมาะสมในการฆ่ามอดข้าวดังแสดง ในรูปที่ 1.3 และ รูปที่ 1.4

Species	Develop- mental Stage	Freq. (MHz)	Medium	Temp.* (°C)	Reference
Rice weevil,	Mixed				
Sitophilus oryzae (L.)	immature	27	Wheat	56	Anglade et al., 1979
	Adult Mixed	39	Wheat	39	Nelson and Whitney, 1960
	immature	39	Wheat	61	Nelson and Whitney, 1960
	Adult	39	Wheat	40	Nelson and Stetson, 1974a
	Adult	2450	Wheat	83	Nelson and Stetson, 1974a
	Adult	2450	Wheat	> 60	Tateya and Takano, 1977
	Pupal	2450	Wheat	> 60	Tateya and Takano, 1977
	Larval	2450	Wheat	> 58	Tateya and Takano, 1977
	Egg	2450	Wheat	> 57	Tateya and Takano, 1977
Granary weevil,	All	13.6	Wheat	62	Benz, 1975
Sitophilus granarius	Egg	13.6	Wheat	61	Benz, 1975
(L.)	Adult	27	Wheat	55	Anglade et al., 1979
	Larval	27	Wheat	58	Anglade et al., 1979
	Pupal	27	Wheat	61	Anglade et al., 1979
	Adult	39	Wheat	41	Nelson and Kantack, 1966
	Adult	39	Wheat	42	Nelson et al., 1966
	Adult	2450	Wheat	86	Anglade et al., 1979
	Adult	2450	Wheat	> 92	Hamid et al., 1968
	Adult	2450	Wheat	> 57	Baker et al., 1956
	Larval	2450	Wheat	> 82	Baker et al., 1956
	Egg	2450	Wheat	> 72	Baker et al., 1956

รูปที่ 1.3 การให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริกย่านความถี่วิทยุและย่านความถี่ไมโครเวฟกับมอดข้าวสาลี จนมีอัตราการตายที่ 99-100%

จากรูปที่ 1.3 จะเป็นการทคสอบกับมอดข้าวและมอดยุ้งในข้าวสาลี จะเห็นว่าที่ความถิ่ 39 MHz ในตัวเต็มวัยของทั้งมอดข้าวและมอดยุ้งจะตายที่ 99 - 100% โดยที่อุณหภูมิในข้าวจะอยู่ที่ ประมาณ 40 องศาเซลเซียส ซึ่งพบว่าช่วงความถิ่นี้ไม่ค่อยมีผลต่อข้าวมาก แต่เมื่อใช้ความถี่ย่าน ใมโครเวฟ 2.45 GHz มอดข้าวและมอดยุ้งก็ตายแต่อุณหภูมิข้าวสาลีสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้ข้าวสาลีเสียหายจากความร้อนได้



รูปที่ 1.4 การใช้คลื่นความถี่ 39 MHz และ 2450 MHz เปรียบเทียบกับอุณหภูมิของข้าว สาลีต่อการตายของมอดข้าว

จากรูปที่ 1.4 เป็นการพิจารณาเปอร์เซ็นต์การตายของมอดข้าวต่ออุณหภูมิของข้าวซึ่งจะเห็น ใค้ชัคถึงอุณหภูมิของข้าวเมื่อมอดข้าวตายที่ 80% ที่ความถี่ 39 MHz จะอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียสและ ถ้าปล่อยไว้เป็นเวลาประมาณ 8 วันก็จะตายเป็น 100% ถ้าอุณหภูมิข้าวอยู่ที่ 50 องศาเซลเซียสมอด ข้าวจะตาย 100% โดยไม่ต้องปล่อยทิ้งไว้ถึง 8 วัน ส่วนที่ความถี่ 2450 MHz อุณหภูมิของข้าวเมื่อ มอดข้าวตาย 100% จะมากกว่า 80 องศาเซลเซียสและจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะทำให้ข้าวเสียหายได้ ดังนั้นจะเห็นว่าย่านความถี่วิทยุสามารถให้ความร้อนได้เหมาะสมมากกว่า ย่านความถี่ไมโครเวฟ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการให้ความร้อน แก่ไดอิเล็กตริกที่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้กับมอดข้าว โดยใช้ ย่านความถิ่วิทยุ และยังสามารถ นำไปประยุกต์กับศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในงานวิจัยของ Nelson (1996) ได้นำเสนอย่านการตอบสนองทางความถี่ของมอดข้าวและ ข้าวสาลีที่มีผลต่อค่าปัจจัยในการสูญเสียยังผลไดอิเล็กตริก (Dielectric loss factor) ดังแสดงใน รูปที่ 1.5 โดยได้นำเสนอช่วงของการตอบสนองของมอดข้าวจะอยู่ในตั้งแต่ช่วงความถิ่ประมาณ 50 kHz ถึงประมาณ 12 GHz แต่จะพบว่าช่วงความถิ่ที่มีค่า ปัจจัยในการสูญเสียยังผลไดอิเล็กตริก ที่ดีที่สุดของมอดข้าวอยู่ที่ความถิ่ประมาณ 39 MHz โดยมีค่าเท่ากับ 2.24 ส่วนข้าวสาลีจะมีค่าน้อย มาก และพบว่าช่องความถิ่ที่มีค่าปัจจัยในการสูญเสียยังผลไดอิเล็กตริกสูงอยู่ในความถิ่ประมาณ 5 MHz ถึงประมาณ 100 MHz จึงเป็นช่วงความถิ่ที่ความเหมาะสมที่จะนำมาวิเคราะห์และออกแบบ ได้ดีที่สุด



รูปที่ 1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการสูญเสียยังผลใดอิเล็กตริกกับความถี่ของมอดข้าว และข้าวสาลี

โดยการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกด้วยคลื่นสนามไฟฟ้าความถี่สูงจำเป็นต้องมีตัวแปร หลักในการพิจารณาซึ่งประกอบด้วยย่านความถี่ที่ใช้งานปัจจัยในการสูญเสียยังผลไดอิเล็กตริก รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นสนามไฟฟ้าเข้าสู่ตัวกลางวัสดุไดอิเล็กตริกที่มีการสูญเสีย และกำลัง งานที่ใช้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบวงจรกำเนิดความถี่และ ตัวปล่อยคลื่นสนามไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สามารถให้กำลัง งานสนามไฟฟ้าไปยังตัวกลางวัสดุไดอิเล็กตริกที่มีการสูญเสีย เพื่อให้เกิดความร้อนขึ้นได้ ดังนั้น งนาดและรูปแบบของตัวสร้างสนามไฟฟ้าจึงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้รูปแบบ การใช้งานและการใช้กำลังงานที่เหมาะสมที่สุด

#### 1.8 รายละเอียดในวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย 5 บท และ ภาคผนวก

บทที่ 1 กล่าวถึง บทนำ กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของ การวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ขอบเขตของการวิจัย วิธีคำเนินการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ รายละเอียดในวิทยานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีวงจรงยายสัญญาณย่านความถิ่วิทยุ ทฤษฎีหลักการให้ความร้อน แก่ไดอิเล็กตริกและหลักการพื้นฐานของการกระจายความร้อนด้วยคลื่นสนามไฟฟ้า บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบวงจรงยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุสำหรับ เครื่องให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริก และการออกแบบตัวปล่อยคลื่นแบบแผ่นเพลต

บทที่ 4 กล่าวถึงผลการทคลองและการวัดทคลองคุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบวงจร วงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านคลื่นความถี่วิทยุสำหรับเครื่องให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริก และการ ให้ความร้อนด้วยแผ่นเพลตกับมอดข้าว

บทที่ 5 กล่าวถึงสรุปผลการวัดการทดลองและคุณสมบัติของการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็ก ตริก โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัยของวงจรในบทต่าง ๆ ทั้งหมด ปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา และแนวทางการพัฒนาในอนาคต



# บทที่ 2

## ทฤษฎีวงจรขยายสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุและการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก

#### **2.1 บทน**ำ

การศึกษา และเข้าใจถึงทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีความสำคัญและ มีประโยชน์ อย่างมากในการคำเนินงาน เพื่อให้เป็นพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจในงาน สามารถใช้เป็น แหล่งอ้างอิงในการคำเนินงานวิจัยนั้น ดังนั้นในบทนี้จึงได้นำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ โดยจะกล่าว ถึงเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์หรือกล่าวอ้างถึงต่อการคำเนินงานวิจัย โดยงานวิจัยนี้จะ ทำการศึกษา คือ หลักการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กทริก ทฤษฎีพื้นฐานของการกระจายความร้อนด้วย กลื่นสนามไฟฟ้า และภาควงจรขยายสัญาณกลื่นความถี่วิทยุกำลังสูงโดยทำการแมตช์ซิ่งกับโหลด ที่เป็นแผ่นเพลตดังแสดงในรูปที่ 2.1 โดยจะกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์หรือกล่าวอ้างถึง ต่อการคำเนินงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหามีความกระชับและชัดเจน



รูปที่ 2.1 โครงสร้างวงจรเครื่องให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริก

#### 2.2 หลักการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก

#### 2.2.1 คุณสมบัติของไดอิเล็กตริก

จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของไคอิเล็กตริกของวัสคุใด ๆ ในการใช้ งานเกี่ยวกับคลื่นความถี่ จะเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบตัวปล่อยคลื่นความถี่และระบบที่ใช้งาน คลื่นความถี่ โดยการศึกษาการเกิดและการแพร่กระจายความร้อนในไดอิเล็กตริก ซึ่งคุณสมบัติของ ใดอิเล็กตริกนั้นจะสามารถอธิบายได้จากพฤติกรรมภายใต้การใช้งานคลื่นที่ความถี่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น ค่าสภาพยอมเชิงซ้อน (Complex permittivity, ɛ\*) หรือที่เรียกว่า "ค่าคงที่ ไดอิเล็กตริกยังผล (dielectric constant)" ซึ่งสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ของสมการที่ 2.1 (Wang1, et.al., 2003)

$$\varepsilon^* = \varepsilon' - j\varepsilon'' \tag{2.1}$$

เมื่อ ɛ<sup>°</sup> คือ ปัจจัยในการสูญเสียยังผล (Dielectric loss factor) โดยสำหรับการ พิจารณาก่าการสูญเสียนั้น จะพิจารณาจากส่วนที่เป็นจินตภาพของก่ากงที่ไดอิเล็กตริก ซึ่งจะขึ้นอยู่ กับก่าของกวามถี่และอุณหภูมิที่ใช้งาน และสามารถนิยามก่าการสูญเสียแทนเจนต์ (Loss tangent) ได้ดังสมการที่ 2.2

$$\tan \delta = \varepsilon'' / \varepsilon' \qquad (2.2)$$

ซึ่งวัสดุ ไดอิเล็กตริกที่เป็นสินค้าเกษตรส่วนใหญ่นั้นจะแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ ย่านความถี่วิทยุและ ไมโครเวฟให้เป็นพลังงานความร้อนโดยความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจาก การทำอันตรกิริยากันระหว่างพลังงาน ไมโครเวฟและตัวกลางที่มีคุณสมบัติเป็น ไดอิเล็กตริกที่มี โครงสร้างโมเลกุลแบบมีขั้วและสามารถเหนี่ยวนำคลื่นความถี่วิทยุให้เกิดเป็นความร้อนได้ ซึ่งสามารถ กำนวณได้จากสมการที่ 2.3 และ 2.4 (Nelson, 1996)

$$P = \rho C_P \frac{\Delta T}{\Delta t}$$
(2.3)

$$\rho C_p \frac{\Delta T}{\Delta t} = 5.563 \times 10^{-11} f E^2 \varepsilon^{"}$$
(2.4)

โดยที่ *P* คือ พลังงานที่เกิดขึ้นในวัสดุไดอิเล็กตริก (W)

722

- $C_p$  คือ ความร้อนจำเพาะ (Specific heat) (J/kg.°C)
- ho คือ ความหนาแน่นของวัสดุ  $(kg/m^3)$
- E คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า (V / m)
- $\Delta t$  คือ ระยะเวลา (s)

- $\Delta T$  คือ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในวัสดุ ( $^{\circ}C$ )
- f คือ ความถี่ (Hz)

#### 2.2.2 กลไกการให้ความร้อนแก้ไดอิเล็กตริก

วัสดุไดอิเล็กตริก (Dielectric) สามารถทำให้เกิดความร้อนได้โดยการป้อนคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปในไดอิเล็กตริก การทำให้เกิดความร้อนเป็นผลมาจากความสามารถของ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำให้เกิดโพลาไรซ์ข้องประจุภายในไดอิเล็กตริก เมื่อทำการป้อนสนามไฟฟ้า สถิต สนามไฟฟ้าสถิตจะทำให้เกิดโพลาไรซ์ขึ้น แต่ในกรณีที่เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสลับพลังงาน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสลับจะทำให้เกิดโพลาไรซ์ขึ้น แต่ในกรณีที่เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสลับพลังงาน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสลับจะทำให้เกิดโพลาไรซ์จิ้น แต่ในกรณีที่เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสลับพลังงาน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสลับจะทำให้เกิดโพลาไรซ์ดังแสดงตามรูปที่ 2.2 และจะทำให้ไดโพลเกิดการ หมุนไปมาตามคาบเวลาของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ป้อนให้ การหมุนของไดโพลที่ทำให้เกิด กวามร้อนโดยเกิดจากความเสียดทานภายในของโมเลกุล โดยโมเลกุลของไดอิเล็กตริกนั้นจะต้องมี ก่าไดโพลโมเมนต์ (Dipole moment) สูงพอ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของการทำให้เกิด ความร้อนในไดอิเล็กตริก ไดอิเล็กตริกที่มีการสูญเสียส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่มีน้ำเป็นองก์ประกอบ

ในสภาวะทั่วไปวัสดุที่เป็นไดอิเล็กตริก สามารถที่จะเก็บพลังงานไฟฟ้าได้ โดยเกิด จากประจุบวกและประจุลบ ที่แยกห่างออกจากกันเนื่องจากการป้อนพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เข้าไปภายในไดอิเล็กตริกซึ่งจะฝืนกับแรงยึดเหนี่ยวของอะตอมหรือโมเลกุล กลไกของการเกิดการ แยกห่างกันของประจุจะขึ้นอยู่กับชนิดของไดอิเล็กตริกและความถี่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ ป้อนให้กับไดอิเล็กตริก จะอธิบายการเกิดโพลาไรซ์ได้ดังนี้



#### รูปที่ 2.2 อะตอมระหว่างประจุบวกต่อประจุลบของตัวกลาง

โดยในงานวิจัยนี้วัสดุที่เป็นไดอิเล็กตริกสำหรับทดลองคือ มอดข้าว จึงทำการศึกษา ถึงกุณสมบัติของมอดข้าว เพื่อนำมาวิเคราะห์สำหรับการออกแบบเครื่องและเก็บผลการทดลอง ต่อไป มอดข้าวตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลดำ ยาวประมาณ 2.0 - 3.0 มิลลิเมตร โดยตัวเมียจะวางไข่ที่เมล็ด พืชขณะที่เมล็ดเริ่มจะสุกแก่ เมล็ดละ 4 - 6 ฟอง แล้วขับเมือกปิดปากรูไว้ ตัวเมียวางไข่ได้ 300 -400 ฟอง ไข่จะฟักในระยะ 3 - 6 วัน เป็นตัวอ่อนสีขาวลำตัวสั้นป้อม และอาศัยกัดกินอยู่ภายในเมล็ด ระยะ ตัวอ่อน 20 - 30 วัน แล้วจึงเข้าคักแด้เป็นเวลา 3 - 7 วัน เมื่อเป็นตัวเต็มวัยแล้ว จะเจาะผิวเมล็ด ออกมา ทำให้เมล็ดที่ถูกมอดข้าวอาศัยอยู่เป็นรู วงจรชีวิตใช้เวลา 30 - 40 วัน ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ นาน 1 - 2 เดือน หรือมากกว่านี้ (Koehler., 2012) ดังแสดงในรูปที่ 2.3 ซึ่งเป็นปัญหาต่อเกษตกรเป็น อย่างมาก โดยมีก่าความร้อนจำเพาะ (*c*) มีก่าเท่ากับ 3.450 *kJ/kg.°C* และ ความหนาแน่นของวัสดุ (*ρ*) มีก่าเท่ากับ 1000 *kg/m*³ (Wang, et al., 2003) ผู้วิจัยจึงใช้หลักการการส่งผ่านสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าเข้าไปยังตัวมอดข้าว โมเลกุลในตัวมอดข้าวจะเกิดการสั่นและเสียดลีกันจนเกิดความร้อน ในตัวมอดข้าว โดยอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในด้วมอดข้าวอยู่ที่ประมาณ 50 องศาเซลเซียสขึ้นไปที่ สามารถส่งผลกระทบกับตัวมอดข้าวและทำให้มอดข้าวตาย (Marijana, et.al., 201)



รูปที่ 2.3 วงจรชีวิตมอดข้าว

# 2.3 หลักการพื้นฐานของการกระจายความร้อนด้วยคลื่นสนามไฟฟ้า 2.3.1 หลักการกระจายคลื่นสนามไฟฟ้า

การพิจารณาตัวปล่อยคลื่นสนามไฟฟ้าสำหรับการให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริกถือ ว่าเป็นส่วนที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นส่วนที่กระจายพลังงานสนามไฟฟ้าเข้าสู่วัสดุไดอิเล็กตริก ให้มี ความเหมาะสม ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงขนาดและปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการกระจายคลื่น สนามไฟฟ้า จากงานวิจัยที่ผ่านมาตัวสร้างสนามไฟฟ้าแบบแผ่นเพลต เป็นลักษณะรูปแบบการให้ ความร้อนมีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับงานวิจัยนี้ เนื่องจากมีการการจายสนามไฟฟ้าระหว่าง แผ่นเพลตมากที่สุด โดยผ่านวัสดุตัวกลางที่มีการสูญเสียหรือวัสดุไดอิเล็กตริก โดยลักษณะของตัว ปล่อยกลื่นแบบแผ่นเพลตสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 รูปแบบตัวปล่อยคลื่นสนามไฟฟ้าแบบแผ่นเพลต

จากรูปที่ 2.4 เป็นลักษณะตัวปล่อยคลื่นสนามไฟฟ้าแบบแผ่นเพลต โดยสามารถ ออกแบบได้จากสมการที่ 2.5 ดังนี้

$$C = \frac{k\varepsilon_0 A}{d} \tag{2.5}$$

d คือ ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลต (m)

ลักษณะของการกระจายคลื่นสนามไฟฟ้าจะมีการกระจายตัวจากแรงดันที่ขั้วบวก ไปยังขั้วลบของแผ่นเพลต โดยความเข้มสนามไฟฟ้า E ที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นเพลตสามารถกำนวณ ได้จากสมการที่ 2.6

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{V}{d}$$
(2.6)

โดยที่ *ɛ* คือ ค่าความซึมซาบได้ของแผ่นเพลต

V คือ แรงดันที่ตกคร่อมระหว่างแผ่นเพลต

*d* คือ ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลต

 $\sigma$  คือ ค่าความนำของวัสดุไคอิเล็กตริก

โดยตัวแปรหลักที่ใช้ในการพิจารณาความเข้มของสานมไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้น ประกอบด้วย แรงดันที่ตกกร่อมระหว่างแผ่นเพลต (V) และ ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลต (d) ดังนั้น การวิเคราะห์แรงดันที่ตกกร่อมระหว่างแผ่นเพลตจึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับการพิจารณา เพื่อทราบ ถึงความเข้มของสนามไฟฟ้า และนำไปสู่การวิเคราะห์การให้ความร้อนต่อวัสดุไดอิเล็กตริกต่อไป

#### 2.3.2 วงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรม (Series resonance circuit)

เนื่องจากโหลดในงานวิจัยนี้เป็นลักษณะแบบแผ่นเพลต จึงได้ทำการใช้หลักการ ของวงจรเรโซแนนซ์เพื่อทำการแมตช์ชิ่ง เพื่อให้ได้กำลังงานที่ตกคร่อมระหว่างแผ่นเพลตมากที่สุด โดยลักษณะพฤติกรรมทางไฟฟ้าของวงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรมจะมีอิมพิแดนซ์ที่ตำแหน่งเร โซแนนซ์ต่ำที่สุด ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านวงจรจะมีค่ามากสุดทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าที่โหลดมี ค่าสูงสุด วิธีการควบคุมกำลังไฟฟ้าทำได้โดยการลดแรงดันที่จ่ายให้วงจร หรือเลื่อนความถี่การใช้ งานให้ต่ำหรือสูงกว่าตำแหน่งเรโซแนนซ์ ค่าอิมพิแดนซ์ของวงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรมดังรูป ที่ 2.5 และมีค่าดังสมการที่ 2.7 และดัง

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{2.7}$$



รูปที่ 2.5 วงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรม

จากสมการ 2.7 จะพบว่า ค่าอิมพิแคนซ์จะขึ้นอยู่กับความถิ่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เนื่องจากค่า  $X_L = 2\pi fL$  และ  $X_c = 1/2\pi fC$  โดยผลรวมของค่ารีแอคแตนซ์จะมีค่าเท่ากับ  $(X_L - X_c)$  ดังนั้นถ้าความถิ่ของแหล่งจ่ายไฟมีค่าเท่ากับความถิ่เรโซแนนซ์จะมีผลทำให้ค่ารีแอค แตนซ์รวมมีค่าเป็นสูนย์  $(X_L = X_c)$  และอิมพิแคนซ์รวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับค่าความต้านทาน (Z=R)

#### 2.4 วงจรขยายสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ

เนื่องจากผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการสร้างแหล่งจ่ายกำลังสูง จึงได้ทำการศึกษา วงจรขยายสัญญาณกลื่นความถี่วิทยุเพื่อทำการออกแบบแหล่งจ่ายกำลังงานสูงย่านกลื่นความถี่วิทยุ โดยวงจรขยายสัญญาณกลื่นความถิ่วิทยุทำหน้าที่ขยายสัญญาณที่ต้องการ สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา ในการออกแบบต้องพิจารณาถึงเสถียรภาพของวงจร อัตราขยายกำลัง กำลังเอาต์พุตซึ่งต้องเลือก กุณสมบัติและชนิดของมอสเฟทให้เหมาะสม รวมทั้งการออกแบบโครงข่ายแมตช์ซิ่งทางด้านอินพุต และเอาต์พุต เพื่อให้ได้วงจรขยายสัญญาณความถิ่สูงที่มีประสิทธิภาพและอัตราขยายกำลังสูงมาก ที่สุด (ชาญชัย ทองโสภา, 2549)

ลักษณะ โดยทั่วไปของวงจรขยายสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุที่ออกแบบเป็นลักษณะเป็น ภาคส่วน โดยประกอบด้วยภาคอินพุตของวงจรขยายสัญญาณ ภาคขยายสัญญาณ และภาคเอาต์พุต ของวงจรขยายสัญญาณ และการออกแบบโครงข่ายแมตช์ชิ่งทั้งภาคอินพุตและเอาต์พุตโดยลักษณะ ของวงจรโครงข่ายแมตช์ชิ่งประกอบด้วย ค่าความต้านทาน (R) ตัวเก็บประจุ (C) และตัวเหนี่ยวนำ (L) โดยด้านอินพุตเป็นวงจรกำลังงานต่ำและด้านเอาต์พุตเป็นส่วนขยายกำลังสูง

#### 2.4.1 คุณลักษณะวงจรขยายสัญญาณ

สิ่งสำคัญสำหรับคุณลักษณะวงจรขยายสัญญาณคือความเป็นเชิงเส้น ประสิทธิภาพ ของวงจรขยายสัญญาณ ความสามารถในการขยายสัญญาณเอาต์พุต และอัตราขยายสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณจะมีลักษณะที่เป็นเชิงเส้นถ้าสัญญาณอินพุตและกำลังขยายสัญญาณเอาต์พุตมี ลักษณะสัญญาณที่เป็นไปในทางเคียวกัน

โดยทั่วไปวงจรงยายสัญญาณจะมีลักษณะ 2 รูปแบบคือวงจรที่เป็นเชิงเส้น (linear amplifier) และ ไม่เป็นเชิงเส้น (non-linear amplifier) สำหรับวงจรในรูปที่ 2.6 เป็นลักษณะรูปแบบ ทั่วไปของวงจรงยายสัญญาณ ซึ่งอัตราขยายสัญญาณ (gain) ที่ได้จากวงจรสามารถหาได้จากสมการ ที่ 2.8 คือส่วนที่เห็นได้ชัดเจนจากการขยายสัญญาณ โดย P<sub>in</sub> เป็นกำลังสัญญาณตรงพอร์ตอินพุต ของวงจรและ P<sub>out</sub> เป็นกำลังขยายสัญญาณเอาต์พุตฝั่งโหลด ซึ่งจะมีค่าความ ต้านทานโหลด R<sub>load</sub> โดยที่ P<sub>out</sub> สามารถกำนวณหาค่าได้จากส่วนประกอบพื้นฐาน จากโหลดกระแส I<sub>load</sub> และโหลด แรงคัน V<sub>load</sub> ดังแสดงในสมการที่ 2.9





$$Gain = 10 log \left(\frac{P_{out}}{P_{in}}\right) \quad dB$$
(2.8)

$$\mathbf{P}_{\text{out}} = \mathbf{I}_{\text{load}} \mathbf{V}_{\text{load}} \tag{2.9}$$

การกระจายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงจากสองสิ่งประกอบกันจากแหล่งจ่าย กำลังไฟฟ้า (power-supply) ซึ่งจะประกอบด้วย V<sub>dd</sub> และ I<sub>dd</sub> และส่วนอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งจ่าย แรงดันไบอัส (V<sub>Bias</sub>) และ (I<sub>Bias</sub>) ซึ่งกำลังเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสามารถหาได้ จากสมการที่ 2.10

$$\mathbf{P}_{dc} = (\mathbf{V}_{Bias} \times \mathbf{I}_{Bias}) + (\mathbf{V}_{dd} \times \mathbf{I}_{dd})$$
(2.10)

การออกแบบวงจรงยายสัญญาณคือการออกแบบเพื่อต้องการได้ประสิทธิภาพ (efficiency) ดีที่สุดโดยได้จากการเปรียบเทียบระหว่างกำลังสัญญาณเอาต์พุตของวงจรและค่าของ กำลังเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งสามารถหาค่าประสิทธิภาพของวงจรงยายสัญญาณ เป็นค่าในรูปของเปอร์เซ็นได้จากสมการที่ 2.11

**H L** H

Efficiency = 
$$\frac{P_{out}}{P_{dc}} \times 100\%$$
 (2.11)

## 2.4.2 โครงสร้างของวงจรขยายสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุคลาสเอบีแบบพุช-พูล (Push - Pull)

หลักการทำงานของวงจรขยายสัญญาณกลิ่นความถิ่วิทยุคลาสเอบีแบบพุช-พูล นิยมใช้ทรานซิสเตอร์ชนิดเดียวกันสองตัวแบ่งกันขยายสัญญาณตัวละครึ่งคาบทำให้ได้อัตราการ ขยายกำลังสูงขึ้น โดยใช้ บาลัน (BALAN : Balance / Unbalance) เป็นอุปกรณ์ในการแบ่งสัญญาณ อินพุตเป็นสองส่วนที่มีเฟสของสัญญาณอินพุตต่างกัน 180 องศา พร้อมทั้งแปลงอิมพิแคนซ์จาก Unbalance 50 โอห์ม เป็น Balance 25 โอห์ม สองสัญญาณ หลังจากนั้นอินพุตแมตช์ซิ่งเน็ตเวิร์คทำ หน้าที่ แมตช์สัญญาณ 25 โอห์ม กับ อินพุตอิมพิแคนซ์ของทรานซิสเตอร์ การแมตช์สัญญาณ ระหว่างทรานซิสเตอร์ไปยังโหลดก็อาศัยหลักการนี้เช่นเดียวกันโครงสร้างของวงจรขยายชนิดนี้สา มารแสดงโครงสร้างดังรูปที่ 2.7 (An1034.,1993)



รูปที่ 2.7 แสดงโครงสร้างของวงจรขยายกำลังสัญาณคลื่นวิทยุแบบพุช - พูล

#### 2.4.3 บาลัน (BALUN)

ในวงจรงยายสัญญาณกลื่นวิทยุแบบ พุช-พูล ต้องการสัญญาณ อินพุตสองส่วน และมีเฟสของกระแสต่างกัน 180 องศา โดยใช้บาลันเป็นตัวแยกสัญญาณและรวมสัญาณ หลักการ ทำงานของ บาลัน สามารถอธิบายได้โดยพิจารณาการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในสายส่ง เช่น สาย โกแอก-เชี่ยล (Coaxial Cable) แสดงดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 แสดงการทำงานของบาลัน

จากรูปที่ 2.8 พิจารณาที่ปลายสายส่ง จุค B และ จุค C ที่เวลาค่าหนึ่ง กระแสไฟฟ้า ที่ใหลเข้าสู่ โหลค RL จุค B และกระแสที่ใหลออกจากโหลค จุค C จะมีปริมาณเท่ากัน แต่ทิศทาง การใหลของกระแสเมื่อเทียบกับกราวค์ ที่จุค D จะพบว่ามีทิศทางตรงกันข้าม หรือกล่าวได้ว่าเฟส ของกระแสมีความแตกต่างกัน 180 องศา ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นประการแรกใน การสร้างบาลัน ประการที่สองที่อาจจะคำนึงในการสร้างบาลันคือ ความยาวของสายส่งหรือความ ยาวของบาลัน ที่จะมีผลต่อเฟสของกระแส พิจารณารูปที่ 2.9



#### รูปที่ 2.9 แสดงโครงสร้างของบาลัน

#### 2.4.4 การเคลื่อนที่ของคลื่นสัญญาณผ่านสายโอแอกเชียล

เมื่อคลื่นวิทยุเคลื่อนที่ผ่านสายโคแอกเชียลความเร็วของคลื่นจะลคลง โดย ก่า*ɛ*, คือก่ากุณสมบัติของตัวกลางใดอิเล็กตริกมีผลต่อการเดินทางของคลื่นสัญญาณในสายโคแอก เชียล ดังแสดงในสมการที่ 2.12 (Stephen F, 1969)

$$V_{p} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{r}}}$$
(2.12)

กุณสมบัติที่สาคัญของสายโคแอกเชียล คือ มีการค่าอิมพีแคนซ์เฉพาะ (Characteristic line impedance) แสดงดังสมการที่ 2.13 ค่าอิมพีแคนซ์เฉพาะจะมีค่าคงที่ตลอด ทุกความยาวสาย และสายโคแอกเชียลยังทำหน้าที่คล้ายตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุเมื่อมี กลื่นสัญญาณเคลื่อนที่ผ่าน ซึ่งสามารถคำนวณหาค่าความเหนี่ยวนำและค่าความจุไฟฟ้านี้ได้จาก สมาการที่ 2.14 และ 2.15 จากคุณสมบัติข้างต้นเราสามารถนาเอาสายโคแอกเชียลไปใช้ในการ ออกแบบวงจรงยายได้
$$Z_{0} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_{0}\mu_{r}}{\varepsilon_{0}\varepsilon_{r}}} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$
(2.13)

โดยที่ a คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำด้านใน (inner conductor)

### b คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำค้านนอก (outer conductor)

ดังแสดงในรูปที่ 2.10



โดยที่ 
$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$$
 (H/m)  
 $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$  (F/m)

โดยปรกติค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของสายโคแอกเชียลจะมีค่าประมาณ 1 ดังนั้นจึงสามารถจัดรูป ให้คำนวณง่ายขึ้นโดยจะได้ดังสมการที่ 216 และ 2.17

$$L = 4.60517 \times 10^{-7} \times \log\left(\frac{b}{a}\right) \text{ (H/m)}$$

$$L = 460.517 \times \log\left(\frac{b}{a}\right) \text{ (nH/m)}$$

$$C = \frac{24.16 \times 10^{-12} \times \varepsilon_r}{\log\left(\frac{b}{a}\right)} \text{ F/m}$$

$$C = \frac{24.16 \times \varepsilon_r}{\log\left(\frac{b}{a}\right)} \text{ pF/m}$$

$$(2.17)$$

จากสมการ 2.16 จะได้ก่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าต่อความยาวสาย 1 เมตร และ จากสมการที่ 2.17 จะได้ก่าความจุไฟฟ้าของความยาวสาย 1 เมตร เพราะฉะนั้นสามารถนำก่าที่ได้ไป หาก่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและก่าความจุไฟฟ้าตามความยาวสายของบาลันที่ต้องการและในการ แมตช์ชิ่งอิมพิแดนซ์โดยใช้ความยาวของสายส่ง

### 2.4.5 มอสเฟตทรานซิสเตอร์ (MOSFET: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

การออกแบบวงจรขยายแบบพุช-พูล ครั้งนี้ให้มอสเฟตเบอร์ BLF578 (AN10800, Application note, Rev. 01, 2009) ซึ่งมีโครงสร้างแสดงดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 แสดงรูปแบบมอสเฟต BLF578

คุณสมบัติของทรานซิสเตอร์เบอร์ BLF578 นั้นคือ มีความแข็งแรง ทนความร้อนที่ สูงและมีประสิทธิภาพสูง เพราะเป็นทรานซิสเตอร์ที่ใช้งานแบบชนิคพุชพูล สามารถทำงานที่ย่าน ความถี่ 10 – 500 MHz ที่แหล่งง่ายไฟ 50 Vdc จากการทคสอบทรานซิสเตอร์ที่ความถี่ 225 MHz สามารถให้กำลังงานแก่โหลคสูงสุค 1200W มีอัตราการขยายประมาณ 24 dB และมีประสิทธิภาพ 71% และที่ความถี่ 108 MHz สามารถให้กำลังงานแก่โหลดได้สูงสุค 1000 W มีอัตราขยายประมาณ 26 dB และมีประสิทธิภาพ 75% และอุปกรณ์นี้มีความไวต่อไฟฟ้าสถิต อีกทั้งยังสามารถทนความ ร้อนได้ถึง 150° และค่าอินพุตและเอาท์พุตอิมพิแคนซ์ของ BLF578 แสดงดังตารางที่ 2.1 และแสดง ในรูปของกราฟจะได้ดังรูปที่ 2.12



คาามถี่(MHz)	อินพุต		เอาท์พุต	
	$Z_i$		$Z_o$	
25	1.176	-j13.262	1.697	-j0.060
50	1.176	-j6.617	1.688	-j0.120
75	1.176	-j4.395	1.674	-j0.178
100	1.176	-j3.280	1.654	-j0.234
125	1.176	-j2.607	1.630	-j0.288
150	1.176	-j2.155	1.600	-j0.338
175	1.177	-j1.830	1.567	-j0.385
200	1.177	-j1.583	1.531	-j0.427
225	1.177	-j1.583	1.491	-j0.466
250	1.178	-j1.233	1.449	-j0.500
275	1.178	-j1.103	1.406	-j0.531
300	1.178	-j0.993	1.361	-j0.556

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงอินพุตอิมพิแคนซ์และเอาท์พุตอิมพิแคนซ์ของ BLF578



รูปที่ 2.12 กราฟแสคงอินพุตและเอาท์พุตอิมพีแคนซ์ของมอสเฟต

### 2.4.6 การแมตช์อิมพีแดนซ์ของวงจรขยายสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ

โดยทั่วไปวงจรกำเนิดสัญญาณความถี่มักจะอยู่ส่วนหน้าของวงจรขยายสัญญาณ ของระบบโดยปกติแล้วจะถูกออกแบบมาสำหรับระบบอิมพีแดนซ์แบบ 50 โอห์ม คุณสมบัติของ วงจรกำเนิดความถี่อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อค่าอินพุตหรือเอาต์พุตอิมพีแดนซ์มีค่าต่างออกไป ดังนั้น การแมตซ์อิมพีแดนซ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่วงจรต่าง ๆ จะต้องมีการเทอร์มิเนตค่าอิมพีแดนซ์ที่เหมาะสม ตลอดช่วงความถี่ เช่นอิมพีแดนซ์วงจรขยายสัญญาณความถี่สูงทั้งทางด้านอินพุตและเอาต์พุต จะแมตช์เข้ากับอิมพีแดนซ์ของระบบเพื่อให้มีการส่งผ่านกำลังงานสูงสุด

วงจรขยายสัญญาณจะมีกำลังงาน อัตราขยาย และประสิทธิภาพที่สูงได้ ต้อง ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งโครงสร้างของวงจรและการออกแบบวงจรที่มีเสถียรภาพ สิ่งสำคัญของการออกแบบวงจรขยายสัญญาณคือการแมตช์อิมพีแดนซ์ท้างด้านอินพุตและเอาต์พุต ของวงจรวงจรขยายสัญญาณ ทั้งนี้ก็เพื่อส่งผ่านกำลังงานในวงจรให้ได้มากที่สุดโดยลักษณะรูปแบบ ของโครงข่ายแมตซ์ชิ่งอิมพีแดนซ์แสดงดังรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.13 โครงข่ายแมตช์ชิ่งอิมพีแคนซ์

การแมตซ์อิมพีแดนซ์ซึ่งจะประกอบด้วยอิมพีแดนซ์ทางด้านเข้าเป็นกู่การแมตซ์กับ สัมประสิทธิ์การสะท้อนจากแหล่งจ่ายทางด้านอินพุตของมอสเฟทแสดงดังรูปที่ 2.14 และ อิมพีแดนซ์ทางด้านออกซึ่งเป็นกู่ของการแมตซ์กับสัมประสิทธิ์การสะท้อนจากแหล่งจ่ายทางด้าน เอาต์พุตของมอสเฟทแสดงดังรูปที่ 2.15 โดยการออกแบบวงจรแมตซ์อิมพีแดนซ์สามารถแมตซ์ อิมพีแดนซ์ได้จากแผนภูมิสมิท (smith chart) โดยลักษณะรูปแบบของแผนภูมิสมิทได้จากการแปลง ค่าโดยแผนภูมิก่า Z = r + jx ลงในระนาบของ  $\Gamma \angle \Phi = u + jv$ 



# รูปที่ 2.14 โครงบ่ายแมตช์ชิ่งอินพุตอิมพีแคนซ์



รูปที่ 2.15 โครงข่ายแมตช์ชิ่งเอาต์พุตอิมพีแดนซ์

ซึ่งจะทำให้ได้ชุดวงกลม ค่าตัวต้านทานคงที่กับวงกลมค่ารีแอ็คแตนซ์คงที่ ดังรูป ที่ 2.8 บนระนาบ u - v เมื่อนำวงกลมทั้งสองชุดมารวมกันจะเป็นดังรูปที่ 2.16





เนื่องจากระนาบ u และ v ของ F ไม่ก่อยได้ใช้ ดังนั้นรูปแบบภาพจึงมีสเกลเป็น โพลาร์ โดยมุมของ F อยู่บนสเกลตามเส้นรอบวงของรูปแบบภาพ ทั้งที่เป็นองศาและเศษส่านของ ความยาวคลื่นและขนาดของ F หาได้จากสเกลใต้รูปแบบภาพ ทำให้แผนภูมิสมิทมีประโยชน์มาก ในการแก้ปัญญาหาของสายส่งและการแมตซ์อิมพีแคนซ์ของวงจรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และง่ายต่อ การออกแบบและการใช้งาน

การกำหนดจุดบนแผนภูมิสมิท ในแต่ละจุดบนแผนภูมิสมิทจะแสดงก่าของ อิมพีแดนซ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นอนุกรมกันในรูปของ Z = R + jX นั่นคือสามารถกำหนดจุดก่า Z ลงบนจุดที่ป็นจุดตัดระหว่างวงกลม R กับวงกลม X ได้เลยดังสมการกำหนดจุดต่าง ๆ

โดยการแมตซ์อิมพีแดนซ์บนแผนภูมิสมิทเมื่อได้ก่าอิมพีแดนซ์ที่จะแมตซ์บน แผนภูมิสมิทแล้วสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของอิมพีแดนซ์ โดยการใช้แผนภูมิสมิทคังนั้นจึง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแมตซ์ได้เป็นอย่างดีเมื่อทราบก่าของ โหลดอิมพีแดนซ์และ อิมพีแดนซ์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถแมตซ์อิมพีแดนซ์ของวงจร โดยใช้โครงข่ายแบบ 2 องก์ประกอบบนแผนภูมิสมิท ซึ่งการแมตซ์อิมพีแดนซ์บนแผนภูมิสมิทมีขั้นตอนคังนี้ ขั้นตอนการแมตซ์อิมพีแดนซ์บนแผนภูมิสมิท

 สำหรับการแมตซ์อิมพีแคนซ์ที่ได้คู่แมตช์แล้วและถ้าค่าที่ได้อยู่ในรูปจำนวน เชิงซ้อน อิมพีแคนซ์ที่ต้องการเมื่อมองจากแหล่งจ่ายนั้นคือ การคอนจูเกตจำนวนเชิงซ้อนของด้าน แหล่งจ่ายอย่างเช่น เมื่ออิมพีแคนซ์ด้านแหล่งจ่ายเท่ากับ 25 - j15 โอห์ม และอิมพีแคนซ์ฝั่งโหลด เท่ากับ 100 - j25 โอห์ม เมื่อมองจากแหล่งจ่ายทำให้ได้คู่แมตช์เป็น 25 + j15 กับ 100 - j25  2. ถ้าค่าที่ต้องการแมตซ์มีค่าใหญ่เกินไปจะต้องทำการนอร์แมลไลซ์ด้วยค่าใด ค่าหนึ่งเพื่อให้ค่าเล็กลงทำให้ง่ายต่อการแมตซ์อิมพีแดนซ์และการกำหนดจุลลงบนแผนภูมิสมิท เช่น จากค่าในข้อที่ 1 สามารถนอร์แมลไลซ์ด้วย 50 ทำให้ได้ อิมพีแดนซ์ด้านแหล่งจ่ายเท่ากับ 0.5 + j0.3 โอห์ม และอิมพีแดนซ์ด้านโหลดเท่ากับ 2 – j0.5 เป็นกู่การแมตช์อิมพีแดนช์

 หลังจากได้คู่การแมตช์อิมพีแดนซ์แล้วสามารถกำหนดจุดบนแผนภูมิสมิทเพื่อ ทำการแมตซ์อิมพีแดนซ์แสดงดังรูปที่ 2.17 แสดงการกำหนดจุดบนแผนภูมิสมิทซึ่งนำก่าจาก ข้อที่ 2 ในการกำหนดจุดบนแผนภูมิสมิท



รูปที่ 2.17 การกำหนดจุดบนแผนภูมิสมิท

4. หลังจากการกำหนดจุดบนแผนภูสมิแล้วสามารถวนหาค่าองค์ประกอบต่าง ๆ จากจุดที่ต้องการแมตซ์อิมพีแดนซ์เพื่อจำกัดค่าของพารามิเตอร์ โดยลักษณะของพารามิเตอร์ที่ได้จาก การวนจะแสดงดังรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.18 ทิศทางการเคลื่อนที่ของการแมตซ์อุปกรณ์บนแผนภูมิสมิท

โดยการวนจากเส้นโค้ง AB เป็นการจำกัดค่า C อนุกรม เส้นโค้ง AC เป็นการจำกัด ค่า C ขนาน เส้นโค้ง DE เป็นการจำกัดค่า L อนุกรม และเส้นโค้ง DF เป็นการจำกัดค่า L ขนาน 5. เมื่อวนหาค่าองค์ประกอบที่ได้แล้วสามารถอ่านค่าที่ขององค์ประกอบจากกา รวนดังแสดงในรูปที่ 2.19 และสามารถนำค่ามาคำนวณดังสมการที่ 2.18 และ 2.19 และแทนค่าที่ได้ ลงในสมการที่ 2.20 และ 2.21 เพื่อที่จะทำให้ได้ก่าองค์ประกอบที่ทำการแมตซ์อิมพีแดซ์ในรูปของ ก่าตัวเก็บประจุ (C) และตัวเหนี่ยวนำ (L)





$$X_{\rm C} = \left[\frac{1}{+jC}\right] \text{(Normalize)}$$
(2.18)

$$X_{L} = [+jL] \text{ (Normalize)}$$
(2.19)

$$L = \frac{X_L}{2\pi f}$$
(2.20)

$$C = \frac{1}{2\pi f X_{c}}$$
(2.21)

โดยการแมตซ์อิมพีแดนซ์บนแผนภูมิสมิทในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นำโปรแกรม Smith V3.10 เข้ามาร่วมในการแมตซ์อิมพีแดนซ์ ซึ่งช่วยให้สะดวก ง่ายขึ้นในการแมตซ์ชิ่ง และผลที่ ได้จากการ วนแผนภูมิสมิทและคำนวณจากสมการกับการใช้โปรแกรมค่าได้มีความใกล้เคียงกัน มากดังแสดงในรูปที่ 2.20 แสดงการแมตซ์อิมพีแดนซ์บนแผนภูมิสมิทโดยใช้โปรแกรม เมื่อเปรียบเทียบกับการวนแผนภูมิสมิทและคำนวณจากสมการ



รูปที่ 2.20 แสดงการแมตช์อิมพีแดนซ์บนแผนภูมิสมิทโดยใช้โปรแกรม Smith V3.10



รูปที่ 2.21 แสดงวงจร โครงข่ายแมตช์อิมพีแคนซ์

จากรูปที่ 2.20 แสดงการแมตช์อิมพีแดนซ์บนแผนภูมิสมิทโดยใช้โปรแกรม Smith V3.10 ซึ่งนอร์แมล ไลซ์ด้วย 50 เช่นเดียวกับรูปที่ 2.19 และเมื่อนำมาคำนวณหาค่าตัว เหนี่ยวนำและค่าตัวเก็บประจุที่ความถี่ที่ต้องการ เช่นที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งค่าตัวเหนี่ยวนำและ ก่าตัวเก็บประจุมีค่าดังนี้ จากการคำนวณค่าตัวเหนี่ยวนำมีค่าเท่ากับ 146.91 nH ค่าตัวเก็บประจุมีค่า เท่ากับ 35.74 pF และจากการใช้โปรแกรมดังแสดงในรูปที่ 2.21 ค่าตัวเหนี่ยวนำมีค่าเท่ากับ 146.9 nH ค่าตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ 35.8 pF จะเห็นว่าค่าที่ได้มีความใกล้เคียงกันมาก การแมตซ์ อิมพีแดนซ์ในส่วนนี้จะใช้การแมตซ์ชิ่งเป็นแบบโครงข่าย L แบบวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน

#### 2.5 สรุป

การออกแบบเครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก ซึ่งในบทนี้ได้กล่าวถึงการศึกษาถึงทฤษฎี พื้นฐานของการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก หลักการพื้นฐานของการกระจายความร้อนด้วยคลื่น สนามไฟฟ้า และสิ่งสำคัญสำหรับการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกคือการออกแบบแผ่นเพลตเพื่อให้ ได้ขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งาน การออกแบบวงจรความถิ่วิทยุสำหรับเครื่องให้ความร้อน แก่ไดอิเล็กตริกเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งจ่ายกำลังงานโดยออกแบบเป็นคลาสเอบีพูชพูล สิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจถึงหลักการทำงานของวงจร ระบบ และโครงสร้างของอุปกรณ์ที่นำมาออกแบบและสร้าง ทฤษฎีของที่เกี่ยวข้องกับวงจรทั้งหมดโดยประกอบไปด้วยทฤษฎีของวงจรภาคกำลังซึ่งได้กล่าวถึง วงจรขยายสัญญาณกำลังสูง ในการออกแบบวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงให้มีประสิทธิภาพและ อัตราขยายสัญญาณที่สูงต้องคำนึงถึงการออกแบบในส่วนของภาควงจรแมตช์อิมพีแดนซ์ ทั้งทางด้านอินพุตและเอาต์พุต เพื่อให้ได้องค์ประกอบตัวอุปกรณ์ที่เหมาะสมของวงจร



# บทที่ 3 การออกแบบวงจรขยายสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุและแผ่นเพลตสำหรับ เครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก

#### 3.1 กล่าวนำ

งานวิจัยบทนี้แสดงการออกแบบเครื่องให้กวามร้อนแก่ไดอิเล็กตริก ซึ่งประกอบด้วย การ ออกแบบวงจรขยายสัญญาณคลื่นความถิ่วิทยุเพื่อเป็นแหล่งจ่ายกำลังงานสูงย่านคลื่นความถิ่วิทยุ และการออกแบบแมตช์ชิ่งโหลดที่เป็นแผ่นเพลต ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ซึ่งแต่ละส่วนใช้ทฤษฎีและ การกำนวณจากสมการที่แสดงในบทที่ 2 เพื่อการออกแบบให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งรายละเอียดของการ ออกแบบได้อธิบายในบทนี้ โดยวัสดุไดอิเล็กตริกในงานวิจัยนี้ใช้มอดข้าวในการพิจารณาเพื่อทำการ กำหนดกวามถี่ที่เหมาะสมและทำการออกแบบวงจรขยายสัญญาณต่อไป



รูปที่ 3.1 โครงสร้างของเครื่องให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริกที่ออกแบบ

### **3.2** การออกแบบวงจรงยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุ

เนื่องจากการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก ต้องใช้แหล่งจ่ายกำลังงานสูงสำหรับส่งผ่านไป ยังโหลด ดังนั้นจึงทำการออกแบบวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถิ่วิทยุเพื่อเป็นแหล่งจ่าย กำลัง โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ความถิ่ 65 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งได้ทำการพิจารณาจากรูปที่ 1.5 ซึ่งค่าความถิ่ที่ 65 เมกะเฮิรตซ์ยังมีความเหมาะสมและอยู่ในช่วงที่ให้ความร้อนแก่มอดข้าวได้ดี เมื่อ สังเกตถึงจุดตัดของปัจจัยการสูญเสียระหว่างมอดข้าวกับข้าวพบว่าปัจจัยการสูญเสียของข้าว ที่จุดตัด 65 เมกะเฮิรตซ์มีค่าน้อยซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิที่เกิดในข้าวน้อยตามไปด้วย โดยงานวิจัยนี้ ใช้มอสเฟท เบอร์ BLF578 ที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์รับสัญญาณอินพุตประมาณ 0.19 - 9 วัตต์ จากวงจรกำเนิดสัญญาณความถี่และกำหนดใบอัสแรงดันที่ขาเดรนเท่ากับ 48 โวลต์และแรงดันที่ขา เกทเท่ากับ 1.2 - 1.5 โวลต์ ออกแบบเป็นคลาสเอบีและออกแบบวงจรแมตช์ชิ่งอิมพีแดนซ์ เพื่อให้ กำลังงานและให้วงจรมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด กำหนดอิมพีแดนซ์ด้านอินพุตและด้านเอาต์พุตเท่ากับ 50 โอห์ม โดยการออกแบบได้จากการกำนวณจากทฤษฎีในบทที่ 2 ดังต่อไปนี้

การกำนวณหาก่าอินพุตและเอาต์พุตอิมพิแดนซ์ของมอสเฟต อิมพิแดนซ์ของมอสเฟต ประกอบด้วยอินพุตอิมพิแดนซ์และเอาต์พุตอิมพิแดนซ์เมื่ออินพุตอิมพิแดนซ์วัดจากขาเกตและ เอาต์พุตอิมพิแดนซ์วัดจากขาเดรน เนื่องจากต้องการออกแบบวงจรขยายที่ 65 เมกะเฮิรตซ์ จึงต้อง หาอิมพิแดนซ์ที่กวามถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งในการกำนวณหา จำเป็นต้องรู้ก่าอินพุตอิมพีแดนซ์และ เอาต์พุตอิมพิแดนซ์ของมอสเฟตในช่วงก่าที่มากกว่าและน้อยกว่าก่าที่ต้องการทั้ง 2 ก่าก่อน ซึ่งสามารถหาได้จากรูปตารางที่ 2.1 และ รูปที่ 2.12 มากำนวณหาอินพุตอิมพีแดนซ์และเอาต์พุต อิมพิแดนซ์ได้ดังสมการ 3.1

$$\frac{f_{\max} - f_{\min}}{[\text{Re}], [\text{Im}]_{\max} - [\text{Re}], [\text{Im}]_{\min}} = \frac{f_{\max} - f_x}{[\text{Re}], [\text{Im}]_{\max} - x}$$
(3.1)

เมื่อ $f_{max}$ คือ ค่าความถี่ที่อยู่ในช่วงที่สูงกว่าค่า  $f_x$  $f_{min}$ คือ ค่าความถี่ที่อยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าค่า  $f_x$  $[Re], [Im]_{max}$ คือ ค่าจำนวนจริงหรือค่าจำนวนจินตภาพของ  $f_{max}$  $[Re], [Im]_{max}$ คือ ค่าจำนวนจริงหรือค่าจำนวนจินตภาพของ  $f_{min}$  $f_x$ คือ ค่าความถี่ที่เราต้องการxคือ ค่าจำนวนจริงหรือค่าจำนวนจินตภาพของ  $f_x$ 

การคำนวณหาอินพุตอิมพิแคนซ์ของมอสเฟตที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ (Z<sub>i</sub>) จากรูปตารางที่ 3.1 จะเห็นได้ว่า ที่ความถี่ 75 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ก่า Z<sub>i</sub> = 1.176 – j4.395 และที่ความถี่ 50 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ก่า Z<sub>i</sub> = 1.176 – j6.617 จาก Z<sub>i</sub> ที่ความถี่ทั้งสองข้างต้น สามารถนำมาหาค่าจำนวนจินตภาพของ อินพุตอิมพิแคนซ์ที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ได้ดังนี้

75-50	_	75-65
- <i>j</i> 4.395-(- <i>j</i> 6.617)	_	-j4.395 - x
25	=	10
j2.222		-j4.395 - x
(25)(-j4.395 - x)	=	(10)(j2.222)
- <i>x</i>	=	$\frac{j22.22}{25} + j4.395$
X	=	- <i>j</i> 5.284

จากการคำนวณจะ ได้ค่าจำนวนจินตภาพของอินพุตอิมพิแดนซ์ที่ค่าความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ เท่ากับ – *j*5.284 และจากรูปที่ 2.12 จะเห็นได้ว่าค่าจำนวนจริงของอินพุตอิมพีแดนซ์ตั้งแต่ช่วง ความถี่ 25 ถึง 150 เมกะเฮิรตซ์ มีค่าคงที่ ที่ 1.176 ตลอดทั้งช่วงความถี่ จึงสามารถสรุปได้ว่า ค่าจำนวนจริงของอินพุตอิมพิแดนซ์ที่ค่าความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ 1.176 ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นจะได้ก่าอินพุตอิมพิแดนซ์ที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ คือ

 $Z_i = 1.176 - j5.284$ 

การคำนวณหาเอาต์พุตอิมพิแคนซ์ของมอสเฟตที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ (z,) จากตาราง ที่ 2.1 จะเห็นได้ว่าที่ความถี่ 75 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ค่า z, = 1.674 – j0.178 และที่ความถี่ 50 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ค่า z, = 1.688 – j0.120 จาก z, ที่ความถี่ทั้งสองข้างต้น สามารถนำมาหาค่าจำนวนจริงของ เอาต์พุตอิมพิแคนซ์ที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ได้ดังนี้

<sup>"ยา</sup>ลัยเทคโนโลยจ

75-50	_	75-65
1.674 - 1.688	_	1.674 - x
25	_	10
-0.014	-	1.674 - x
(25)(1.674 - x)	=	(10)(-0.014)
- <i>x</i>	=	$\frac{-0.14}{25}$ - 1.674
x	=	1.680

จากการคำนวณจะ ได้ค่าจำนวนจริงของเอาต์พุตอิมพิแคนซ์ที่ค่าความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ เท่ากับ 1.680 และจาก Z, ที่ความถี่ทั้งสองข้างด้น สามารถนำมาหาค่าจำนวนจินตภาพของเอาต์พุต อิมพิแคนซ์ที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ ได้ดังนี้

75-50	_	75-65
-j0.178 - (-j0.120)	-	-j0.178 - x
25	_	10
-j0.058	_	-j0.178 - x
(25)(-j0.178 - x)	=	(10)(-j0.058)
- <i>x</i>	=	$\frac{-j0.58}{25} + j0.178$
x	=	- <i>j</i> 0.155

จากการคำนวณจะ ได้ค่าจำนวนจินตภาพของเอาต์พุตอิมพิแคนซ์ที่ค่าความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ เท่ากับ – j0.155 จากการคำนวณทั้งสองข้างต้นจะ ได้ก่าเอาต์พุตอิมพิแคนซ์ที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ คือ

 $Z_o = 1.680 - j0.155$ 

ตารางที่ 3.1 แสดงค่าอินพุต / เอาต์พุตอิมพิแดนซ์ ที่ได้จากการคำนวณ

อินพุตอิมพิแคนซ์ (โอห์ม) :	เอาต์พุตอิมพิแคนซ์ (โอห์ม) :	
1.176 – <i>j</i> 5.284	<b>J 1</b> .680 – <i>j</i> 0.155	

# 3.2.1 การออกแบบบาลันโดยการวนแผนภูมิสมิท

การออกแบบบาลันอินพุตจากการคำนวณ จากรูปที่ 2.7 โดยที่ตำแหน่งของอินพุต ของวงจรอินพุตบาลันนั้นจะมีอิมพีแดนซ์อินพุตของวงจรบาลันอินพุตเท่ากับ 50 โอห์มและ อิมพีแดนซ์เอาต์พุตของวงจรอินพุตบาลันคือ 25 โอห์ม ทำการนอร์แมลไลซ์ด้วย 50 จะได้ อิมพีแดนซ์อินพุตบาลันเท่ากับ 1 และอิมพีแดนซ์เอาต์พุตบาลันเท่ากับ 0.5 แล้วนำค่าที่ได้จากการ นอร์แมลไลซ์พลีอตลงบนแผนภูมิสมิท โดยกำหนดจุด A และ B และลากเส้นจาก A ไปยังจุด B เพื่อ จำกัดค่าจริงแสดงดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 การหาค่าความยาวบนแผนภูมิสมิทเพื่อจำกัดค่าจริงค้านบาลันอินพุต

จากนั้นหาก่าความยาวของแต่ละเส้นที่ลากจาก A ถึง B จากรูปที่ 3.2 โดยเส้นโค้ง BC คือการจำกัดก่าเพื่อหาก่า L อนุกรม มีก่า X<sub>L</sub> = 0.49 เส้นโค้ง CA คือการจำกัดก่า C ขนาน X<sub>c</sub> = 0.99 และสามารถนำก่าที่ได้กำนวณหาก่าจริงดังสมการที่ 2.18 และ 2.19 ดังนี้

$$\mathbf{X}_{c} = \left[\frac{1}{+jC}\right]$$
(Normalize)

$$X_{L} = [+jL]$$
 (Normalize)

จะได้

$$X_{c} = \left[\frac{1}{0.99}\right] (50) = 50.50 \ \Omega$$

$$X_{L} = [0.49] (50) = 24.5 \Omega$$

การออกแบบที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ค่าองค์ประกอบจากการคำนวณโดยสมการที่ 2.20 และ 2.21 ต่อไปนี้

$$L = \frac{X_{L}}{\omega}$$
 use  $C = \frac{1}{\omega X_{C}}$ 

ดังนั้นจะได้

$$C = \frac{1}{2\pi (65 \times 10^6)(50.50)} = 48.48 \text{ pF}$$

$$L = \frac{24.5}{2\pi (65 \times 10^6)} = 59.98 \text{ nH}$$

ดังนั้นได้ก่าองก์ประกอบด้านอินพุตดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 วงจรโครงข่ายแมตช์ซิ่งบาลันอินพุต

การออกแบบบาลันเอาต์พุตจากการกำนวณ โดยที่ตำแหน่งของอินพุตของวงจร อินพุตบาลันนั้นจะมีอิมพีแดนซ์อินพุตของวงจรบาลันอินพุตเท่ากับ 25 โอห์มและอิมพีแดนซ์ เอาต์พุตของวงจรอินพุตบาลันคือ 50 โอห์ม ทำการนอร์แมลไลซ์ด้วย 50 จะได้อิมพีแดนซ์อินพุต บาลันเท่ากับ 0.5 และอิมพีแดนซ์เอาต์พุตบาลันเท่ากับ 1 แล้วนำค่าที่ได้จากการนอร์แมลไลซ์พล็อต ลงบนแผนภูมิสมิทโดยกำหนดจุด A และ B และลากเส้นจาก A ไปยังจุด B เพื่อจำกัดก่าจริงแสดง ดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 การหาค่าความยาวบนแผนภูมิสมิทเพื่อจำกัดค่าจริงค้านบาลันเอาต์พุต

จากนั้นหาค่าความยาวของแต่ละเส้นที่ลากจาก <sub>A</sub> ถึง B จากรูปที่ 3.4 โดยเส้นโค้ง CA คือ การจำกัดก่าเพื่อหาก่า L อนุกรม มีก่า X<sub>L</sub> = 0.49 เส้นโค้ง BC คือการจำกัดก่า C ขนาน X<sub>c</sub> = 0.99 และสามารถนำค่าที่ได้กำนวณหาก่าจริงดังนี้

$$X_{c} = \left[\frac{1}{0.99}\right] (50) = 50.50 \ \Omega$$

$$X_{L} = [0.49] (50) = 24.5 \Omega$$

การออกแบบที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ค่าองค์ประกอบจากการคำนวณ ดังนั้นจะได้

$$C = \frac{1}{2\pi (65 \times 10^6)(50.50)} = 48.48 \text{ pF}$$

$$L = \frac{24.5}{2\pi (65 \times 10^6)} = 59.98 \text{ nH}$$

ดังนั้นได้ก่าองก์ประกอบด้านอินพุตดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 วงจร โครงข่ายแมตช์ซิ่งบาลันเอาต์พุต

### **3.2.2** การออกแบบแมตช์ชิ่งอิมพีแดนซ์โดยการวนแผนภูมิสมิท

การออกแบบวงจรแมตช์ชิ่งอิมพิแคนซ์ทางด้านอินพุต จะทำหน้าที่แมตช์ อิมพีแคนซ์ระหว่างวงจรอินพุตบาลันกับอินพุตของทรานซิสเตอร์ นั้นคือก่า 25 + j0 โอห์ม กับ1.176 - j5.284 โอห์ม ทำการนอร์แมล ไลซ์ด้วย 50 จะได้อินพุตอิมพีแคนซ์แมตช์ชิ่งเท่ากับ 0.5 และอินพุต ของทรานซิสเตอร์เท่ากับ 0.023 - j0.105 แล้วนำค่าที่ได้จากการนอร์แมล ไลซ์พล็อตลงบนแผนภูมิ สมิท โดยกำหนดจุด A และ B และลากเส้นจาก A ไปยังจุด B เพื่อจำกัดค่าจริงแสดงดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 การหาค่าความยาวบนแผนภูมิสมิทเพื่อจำกัดค่าจริงด้านแมตซ์ซิ่งอิมพีแดนซ์อินพุต

จากนั้นหาค่าความยาวของแต่ละเส้นที่ลากจาก A ถึง B จากรูปที่ 3.6 โดยเส้นโค้ง AC คือการจำกัดค่าเพื่อหาค่า L อนุกรม มีค่า X<sub>L</sub> = 0.20 เส้นโค้ง CB คือการจำกัดค่า C ขนาน X<sub>c</sub> = 8.90 และสามารถนำค่าที่ได้คำนวณหาค่าจริงดังนี้

$$X_{c} = \left[\frac{1}{8.90}\right] (50) = 5.61 \,\Omega$$

 $X_{L} = [0.20] (50) = 10 \Omega$ 

การออกแบบที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ค่าองค์ประกอบจากการคำนวณ ดังนั้นจะได้

$$C = \frac{1}{2\pi (65 \times 10^6)(5.61)} = 436.45 \text{ pF}$$

$$L = \frac{10}{2\pi (65 \times 10^6)} = 24.48 \text{ nH}$$

ดังนั้นได้ก่าองก์ประกอบด้านอินพุตดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 วงจร โครงข่ายแมตช์ชิ่งอิมพีแคนซ์อินพุต

การออกแบบวงจรแมตช์ชิ่งอิมพิแคนซ์ทางค้านเอาต์พุต จะทำหน้าที่แมตช์ อิมพีแคนซ์ระหว่างเอาต์พุตของทรานซิสเตอร์กับวงจรเอาต์พุตบาลัน นั้นคือค่า 1.680 - j0.155 โอห์ม กับ 25 + j0 โอห์ม ทำการนอร์แมลไลซ์ค้วย 50 จะได้เอาต์พุตของทรานซิสเตอร์เท่ากับ 0.033 - j0.003 และเอาต์พุตบาลันเท่ากับ 0.5 แล้วนำค่าที่ได้จากการนอร์แมลไลซ์พล็อตลงบนแผนภูมิสมิท โดยกำหนดจุด A และ B และลากเส้นจาก A ไปยังจุด B เพื่อจำกัดค่าจริงแสดงดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 การหาก่ากวามยาวบนแผนภูมิสมิทเพื่อจำกัดก่าจริงด้านแมตซ์ซึ่งอิมพีแดนซ์เอาต์พุต

จากนั้นหาค่าความยาวของแต่ละเส้นที่ลากจาก A ถึง B จากรูปที่ 3.8 โดยเส้นโค้ง CA คือการจำกัดค่าเพื่อหาค่า L อนุกรม มีค่า X<sub>L</sub> = 0.12 เส้นโค้ง BC คือการจำกัดค่า C ขนาน X<sub>c</sub> = 7.36 และสามารถนำค่าที่ได้คำนวณหาค่าจริงดังนี้

$$X_{c} = \left[\frac{1}{7.36}\right] (50) = 6.79 \ \Omega$$

$$X_{L} = [0.12] (50) = 6 \Omega$$

้การออกแบบที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ค่าองค์ประกอบจากการคำนวณ ดังนั้นจะได้

$$C = \frac{1}{2\pi (65 \times 10^{6})(6.79)} = 360.60 \text{ pF}$$
$$L = \frac{6}{2\pi (65 \times 10^{6})} = 14.69 \text{ nH}$$

ดังนั้นได้ค่าองก์ประกอบด้านอินพุตดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 วงจร โครงข่ายแมตช์ชิ่งอิมพีแคนซ์เอาต์พุต

### 3.2.3 การออกแบบบาลันโดยใช้โปรแกรม Smith V3.10

การออกแบบบาลันนั้น จะต้องเลือกใช้สายโคแอคเซียลที่เหมาะสมตาม ความสามารถของสาย เช่น ถ้าออกแบบบาลันทางด้านเอาต์พุตซึ่งเป็นด้านที่รับกำลังของสัญญาณสูง ก็ควรที่จะเลือกใช้สายโคแอคเซียลที่สามารถรับกำลังของสัญญาณที่สูงได้ตามไปด้วย เป็นต้น บาลันมีหน้าที่แยกสัญญาณอินพุตออกเป็นสองสัญญาณ โดยที่ตำแหน่งของวงจรบาลันนั้นจะมี อิมพีแดนซ์เท่ากับ 50 โอห์มและอินพุตอิมพิแดนซ์ของอินพุตแมตซ์ชิ่งเน็ตเวิร์คแต่ละซีกมีค่าเป็น 25 โอห์ม ซึ่งในที่นี้จะเลือกใช้สาย Semi Rigid Coaxial Cable RG405 ในการออกแบบบาลัน ทางด้านอินพุต และเลือกใช้สาย Coaxial Cable RG402 ในการออกแบบบาลันทางด้านเอาต์พุต และ สามารถกำนวณก่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและก่าความจุไฟฟ้าของสายส่งสัญญาณได้จากสมการที่ 2.12 และ 2.13 ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2

การออกแบบบาลันทางด้านอินพุต โดยที่ตำแหน่งของอินพุตของวงจรอินพุต บาลันนั้นจะมีอิมพีแคนซ์เท่ากับ 50 โอห์มและอิมพีแคนซ์เอาต์พุตของวงจรอินพุตบาลันคือ 25 โอห์ม โดยที่จะทำการออกแบบวงจรอินพุตบาลันด้วยแมตช์อิมพีแคนซ์ระหว่าง 50 โอห์มฝั่ง อินพุตกับ 25 โอห์มฝั่งเอาต์พุตของวงจรบาลัน ในวงจรขยายสัญญาณคลื่นความถี่ย่านวิทยุที่ จะเลือกใช้สาย Semi Rigid Coaxial Cable RG405 ซึ่งมีอิมพีแคนซ์ที่ 50 โอห์ม และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำด้านใน (inner conductor, a) เท่ากับ 0.56 mm. เส้นผ่านศูนย์ กลาของตัวนำด้านนอก (outer conductor, b) เท่ากับ 2.19 mm. และ Dielectric เป็น PTFE ซึ่งจะมีก่า  $\varepsilon_r = 2.1$  และจะใช้โปรแกรม Smith V3.10 เพื่อกำนวณหาก่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและก่าความจุ ไฟฟ้าในวงจรบาลัน ดังแสดงในรูปที่ 3.10 และตารางที่ 3.2



รูปที่ 3.10 แสดงการวนแผนภูมิสมิทเพื่อหาค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้า ของวงจรบาลันทางด้านอินพุต

Point	$Z(\Omega)$	Q	Frequency (MHz)
DP 1	(50.000 + j00.000)	0.000	65
DP 2	(25.000 + j00.000)	0.000	65
TP 3	(25.000 + j25.000)	1.000	65
TP4	(50.000 – j00.000)	0.000	65

ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงค่าองค์ประกอบในแผนภูมิสมิทของวงจรบาลันทางค้านอินพุต



รูปที่ 3.11 วงจรโครงข่ายแมตช์ซิ่งของวงจรบาลันทางค้านอินพุต

จากที่ได้ทราบค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำด้านนอก (b) = 2.19 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำด้านใน (a) = 0.56 มิลลิเมตร และ Dielectric เป็น PTFE ซึ่งจะมีค่า ε, = 2.1 สามารถนำมาคำนวณค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าได้ดังนี้

ค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า :

$$L = 460.517 \times \log\left(\frac{b}{a}\right), \ L = 460.517 \times \log\left(\frac{2.19}{0.56}\right), \ L = 272.626 \text{ nH/m}$$

ค่าความจุไฟฟ้า :

$$C = \frac{24.16 \times \varepsilon_r}{\log\left(\frac{b}{a}\right)}, \ C = \frac{24.16 \times 2.1}{\log\left(\frac{2.19}{0.56}\right)}, \ C = 85.702 \text{ pF/m}$$

เพราะฉะนั้นที่ความยาวสาย 1 เมตร มีค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าเท่ากับ 272.626 nH/m และมีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 85.702 pF/m จากรูปที่ 3.11 จะเห็นว่าต้องการสายที่มีค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า 61.2 nH เพราะฉะนั้นต้องตัดสายให้ได้ความยาว  $x = \frac{1 \times 61.2}{272.626}$  เท่ากับ 224 มิลลิเมตร และสามารถคำนวณค่า ความจุไฟฟ้าของสายได้จาก  $C = 85.702 \times 0.224 = 19.197$  pF และจากรูปที่ 3.3 จะต้องใช้ค่าความจุ ไฟฟ้าเท่ากับ 49.0 pF เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มค่าความจุไฟฟ้าเข้าไปในวงจรอีก 29.803 pF หรือ ประมาณ 30 pF จะได้ดังรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 แสดงกวามยาวของสายโกแอกเซียลและก่ากวามจุไฟฟ้าสำหรับแมตซ์ชิ่งบาลันอินพุต

การออกแบบบาลันทางค้านเอาต์พุต โดยในการออกแบบนั้นจะคล้ายกับการ ออกแบบวงจรอินพุตบาลัน ซึ่งจะทำการแมตช์อิมพีแคนซ์ระหว่าง 25 โอห์มกับ 50 โอห์ม ในวงจรขยายสัญญาณความถี่ย่านวิทยุ จะเลือกใช้สาย Coaxial Cable RG402 ซึ่งมีอิมพีแคนซ์ที่ 50 โอห์ม และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำด้านใน (a) เท่ากับ 0.91 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำด้านนอก (b) เท่ากับ 4.55 มิลลิเมตร และ Dielectric เป็น PTFE ซึ่งจะมี ก่า *c*, = 2.1 และจะใช้โปรแกรม Smith V3.10 เพื่อคำนวณหาค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและ ก่าความจุไฟฟ้าในวงจรบาลัน ดังแสดงในรูปที่ 3.13 และตารางที่ 3.3



รูปที่ 3.13 แสดงการวนแผนภูมิสมิทเพื่อหาค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าของ วงจรบาลันทางค้านเอาต์พุต

ตารางที่ 3.3 ตารางแสดงก่าองก์ประกอบในแผนภูมิสมิทของวงจรบาลันทางค้านเอาต์พุต

Point	$Z(\Omega)$	Q	Frequency (MHz)
DP 1	(25.000 + j0.000)	0.000	65
DP 2	(50.000 + j0.000)	0.000	65
TP 3	(24.985 – j25.000)	1.001	65
TP 4	(24.985 – j00.005)	0.000	65



รูปที่ 3.14 วงจร โครงข่ายแมตช์ชิ่งของวงจรบาลันทางค้านเอาต์พุต

จากที่ได้ทราบค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำด้านนอก (b) = 4.55 mm, เส้นผ่าน ศูนย์กลางของตัวนำด้านใน (a) = 0.91 mm และ Dielectric เป็น PTFE ซึ่งจะมีค่า *e<sub>r</sub>* = 2.1 สามารถ นำมากำนวณค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าได้ดังนี้

ค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า :

$$L = 460.517 \times \log\left(\frac{b}{a}\right), \ L = 460.517 \times \log\left(\frac{4.55}{0.91}\right), \ L = 321.9 \text{ nH/m}$$

ค่าความจุไฟฟ้า :

$$C = \frac{24.16 \times \varepsilon_r}{\log\left(\frac{b}{a}\right)}, C = \frac{24.16 \times 2.1}{\log\left(\frac{4.55}{0.91}\right)}, C = 72.584 \text{ pF/m}$$

เพราะฉะนั้นที่ความยาวสาย 1 เมตร มีค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าเท่ากับ 321.9 nH/m และมีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 72.584 pF/m

จากรูปที่ 3.14 จะเห็นว่าต้องการสายที่มีค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า 61.2 nH เพราะฉะนั้นต้องตัดสายให้ได้ความยาว  $x = \frac{1 \times 61.2}{321.9}$  เท่ากับ 190.12 มิลลิเมตร และสามารถคำนวณ ค่าความจุไฟฟ้าของสายได้จาก C = 72.584 × 0.190 = 13.79 pF และจากรูปที่ 3.6 จะต้องใช้ค่าความจุ ไฟฟ้าเท่ากับ 49.00 pF เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มค่าความจุไฟฟ้าเข้าไปในวงจรอีก 35.21 pF หรือ ประมาณ 33 pF ดังแสดงในรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 แสดงความยาวของสายโคแอคเซียลและค่าความจุไฟฟ้าสำหรับแมตซ์ชิ่งบาลันเอาต์พุต

### 3.2.4 การออกแบบวงจรแมตช์ชิ่งอิมพิแดนซ์โดยใช้โปรแกรม Smith V3.10

การออกแบบวงจรแมตช์ชิ่งอิมพิแคนซ์ทางด้านอินพุต จะทำหน้าที่แมตช์ อิมพีแคนซ์ระหว่างวงจรอินพุตบาลันกับอินพุตของทรานซิสเตอร์ นั้นคือค่า 25 + j0 โอห์ม กับ 1.176 - j5.284 โอห์ม การออกแบบวงจรแมตช์ชิ่งอิมพิแคนซ์ทางด้านอินพุตนี้ จะเลือกใช้สาย Semi Rigid Coaxial Cable M17/152 ในการออกแบบ ซึ่งจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เส้นผ่าน ศูนย์กลางของตัวนำด้านใน (a) เท่ากับ 0.53 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำด้านนอก (b) เท่ากับ 1.45 มิลลิเมตร และ Dielectric เป็น PTFE ซึ่งจะมีค่า  $\varepsilon_{,} = 2.1$  และจากที่ได้ทำการ คำนวณหาค่าอินพุตอิมพิแคนซ์ไว้ข้างต้นที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์จะได้ค่า  $Z_{,} = 1.176 - j5.284$  นำไป หาค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ ในโปรแกรม Smith V3.10 ดังแสดงใน รูปที่ 3.16 และตารางที่ 3.4



### รูปที่ 3.16 แสดงการวนแผนภูมิสมิทเพื่อหาค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและความจุไฟฟ้าของวงจร แมตช์ชิ่งอิมพิแคนซ์ทางค้านอินพุต

Point	$Z(\Omega)$	Q	Frequency (MHz)
DP 1	(25.000 + j0.000)	0.000	65
DP 2	(1.176 - j5.284)	4.493	65
TP 3	(1.176 + j5.314)	4.519	65
TP 4	(25.185–j0.364)	0.014	65

ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงก่าองก์ประกอบในแผนภูมิสมิทของวงจรแมตช์ชิ่งอิมพิแคนซ์ด้านอินพุต



# รูปที่ 3.17 วงจร โครงข่ายแมตช์ชิ่งอิมพิแคนซ์ทางด้านอินพุต

จากที่ได้ทราบค่า b = 1.45 มิลลิเมตร, a = 0.53 มิลลิเมตร และ Dielectric เป็น PTFE ซึ่งจะมีค่า *ɛ*, = 2.1 สามารถนำมาคำนวณค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าได้ ดังนี้

ค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า :

$$L = 460.517 \times \log\left(\frac{b}{a}\right), L = 460.517 \times \log\left(\frac{1.45}{0.53}\right), L = 201.245 \text{ nH/m}$$

ค่าความจุไฟฟ้า :

$$C = \frac{24.16 \times \varepsilon_r}{\log\left(\frac{b}{a}\right)}, \ C = \frac{24.16 \times 2.1}{\log\left(\frac{1.45}{0.53}\right)}, \ C = 116.1 \text{ pF/m}$$

เพราะฉะนั้นที่ความยาวสาย 1 เมตร มีค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าเท่ากับ 201.245 nH/m และมีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 116.1 pF/m

จากรูปที่ 3.17 จะเห็นว่าต้องการสายที่มีค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า 26.0 nH เพราะฉะนั้นต้องตัดสายให้ได้ความยาว  $x = \frac{1 \times 26}{201.245} = 129$  มิลลิเมตร และสามารถคำนวณค่าความ จุไฟฟ้าของสายได้จาก  $C = 116.1 \times 0.129 = 14.977$  pF และจากรูปที่ 3.9 จะต้องใช้ค่าความจุไฟฟ้า เท่ากับ 440.7 pF เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มค่าความจุไฟฟ้าเข้าไปในวงจรอีก 425.723 pF หรือประมาณ 425 pF ดังแสดงในรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 แสดงกวามยาวของสาย โกแอกเซียลและก่ากวามจุไฟฟ้าสำหรับแมตซ์ชิ่งด้านอินพุต

การออกแบบวงจรแมตช์ชิ่งอิมพิแดนซ์ทางด้านเอาต์พุต ซึ่งจะมีหน้าที่แมตช์ อิมพีแดนซ์ระหว่างด้านเอาต์พุตของทรานซิสเตอร์กับอินพุตของวงจรเอาต์พุตบาลัน นั้นคือระหว่าง ก่าของ 1.680 - j0.155 โอห์ม กับ 25 + j0 โอห์มจะเลือกใช้สาย Coaxial Cable EZ-141-25 ในการ ออกแบบ ซึ่งจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำด้านใน (a) เท่ากับ 1.2 mm. เส้น ผ่านศูนย์กลางของตัวนำด้านนอก (b) เท่ากับ 2.87 mm. และ Dielectric เป็น PTFE ซึ่งจะมีก่า  $\varepsilon_{,} = 2.1$  และจากที่ได้ทำการคำนวณหาก่าเอาท์พุตอิมพิแคนซ์ไว้ข้างต้นที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ จะได้ก่า  $Z_{,} = 1.680 - j0.155$  นำไปหาก่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์ ในโปรแกรม Smith V3.10 ดังแสดงในรูปที่ 3.19 และตารางที่ 3.5



รูปที่ 3.19 แสดงการวนแผนภูมิสมิทเพื่อหาก่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและก่าความจุไฟฟ้าของ วงจรแมตช์ชิ่งอิมพิแดนซ์ทางด้านเอาต์พุต .

ตารางที่ 3.5 ตารางแสดงก่าองก์ประกอบในแผนภูมิสมิทของวงจรแมตช์ซิ่งอิมพิแคนซ์ด้านเอาต์พุต

Point	$Z(\Omega)$	Q	Frequency (MHz)
DP 1	(1.680 - j0.155)	0.092	65
DP 2	(25.000 + j0.000)	0.000	65
TP 3	(1.679 - j6.258)	3.727	65
TP 4	(1.679 + j0.132)	0.078	65



รูปที่ 3.20 วงจร โครงข่ายแมตช์ชิ่งอิมพิแคนซ์ทางค้านเอาต์พุต

จากที่ทราบค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำค้านนอก (b) = 2.87 mm, เส้นผ่าน ศูนย์กลางของตัวนำค้านใน (a) = 1.2 mm และ Dielectric เป็น PTFE ซึ่งจะมีค่า  $\varepsilon_{_{\!f}}$  = 2.1 สามารถ นำมาคำนวณค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้าได้ดังนี้

ค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า :

$$L = 460.517 \times \log\left(\frac{b}{a}\right), \ L = 460.517 \times \log\left(\frac{2.87}{1.2}\right), \ L = 174.54 \text{ nH/m}$$

ค่าความจุไฟฟ้า :

$$C = \frac{24.16 \times \varepsilon_r}{\log\left(\frac{b}{a}\right)}, \ C = \frac{24.16 \times 2.1}{\log\left(\frac{2.87}{1.2}\right)}, \ C = 133.87 \text{ pF/m}$$

เพราะฉะนั้นที่ความยาวสาย 1 เมตร มีค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าเท่ากับ 174.54 nH/m และมีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ 133.87 pF

จากรูปที่ 3.20 จะเห็นว่าต้องการสายที่มีค่าความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า 15.0 nH เพราะฉะนั้นต้องตัดสายให้ได้ความยาว  $x = \frac{1 \times 15.0}{174.54} = 85.94$  มิลลิเมตร และสามารถคำนวณค่า ความจุไฟฟ้าของสายได้จาก  $C = 133.87 \times 0.085 = 11.378$  pF และจากรูปที่ 3.12 จะต้องใช้ค่าความจุ ไฟฟ้าเท่ากับ 365 pF เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มค่าความจุไฟฟ้าเข้าไปในวงจรอีก 353.622 pF หรือ ประมาณ 330 pF ดังแสดงในรูปที่ 3.21



รูปที่ 3.21 แสดงความยาวของสายโคแอกเซียลและค่าความจุไฟฟ้าสำหรับแมตซ์ชิ่งด้านเอาต์พุต

# **3.2.5** วงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุที่ความถี่ 65 เมกะเฮิรตซ์

ในการออกแบบวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุ จะนำเอาการออกแบบ วงจรที่ได้คำนวณมาจากข้างต้นมาประกอบให้เป็นวงจรขยายสัญญาณวิทยุ โดยจะคิดแยกเป็นวงจร ทางด้านอินพุตและวงจรทางด้านเอาต์พุตและใช้มอสเฟท เบอร์ BLF578 เป็นตัวขยายสัญญาณ โดยจะ ใบอัสที่ขาเดรน 48 โวลต์ โดยการออกแบบใช้แผ่นวงจรพิมพ์ RF35 ที่มีความหนา 0.76 มิลลิเมตร โดยแผ่นทองแดงหนาประมาณ 0.035 มิลลิเมตร *ɛ*, เท่ากับ 3.5 มีขนาดความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และความกว้างเท่ากับ 5.5 เซนติเมตร เชื่อมต่อด้วยสายโกแอกเซียลทั้งด้านอินพุตและ เอาต์พุต ระบายความร้อนด้วยแผ่นทองแดงหนา 6 มิลลิเมตร

วงจร ใบอัส คือการจ่ายไฟให้กับวงจร ซึ่งมอสเฟทเบอร์ BLF578 เป็น ทรานซิสเตอร์ชนิด LDMOS โดยถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่สัญญาณความถิ่สูงและแรงคันสูง การใบอัสของทรานซิสเตอร์ชนิด LDMOS จะทำการใบอัสสองส่วน คือใบอัสที่ขาเกตและใบอัสที่ ขาเครน การใบอัสทรานซิสเตอร์ชนิดนี้จะใบอัสเพื่อรักษาระดับของ I<sub>DQ</sub> ไม่ให้เปลี่ยนแปลงมาก โดยการที่จะรักษาระดับของ I<sub>DQ</sub> นั้นจะทำได้โดยการรักษาระดับแรงดันที่ขาเกตของทรานซิสเตอร์ ให้กงที่ โดยจะใช้วงจรรักษาระดับแรงคัน (Voltage regulator) ในการคงค่าแรงดันที่ขาเกต ซึ่งจะมี ค่าประมาณ 1.2-1.5 โวลต์ ส่วนที่ขาเดรนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 48 โวลต์ โดยวงจรไบอัสที่ขาเครน ถึจะมีตัวเหนี่ยวนำค่ามาก ๆ (Choke) เพื่อเอาไว้ป้องกันสัญญาณกระแสสลับไม่ให้เข้ามากวน สัญญาณกระแสตรงได้ และยังมีตัวเก็บประจุต่อคร่อมกราวด์เพื่อปรับสัญญาณไฟเลี้ยงวงจร กระแสตรงให้เรียบ ดังแสดงในรูปที่ 3.22



รูปที่ 3.22 โครงสร้างของวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์ชนิด LDMOS

ในการออกแบบวงจรไบอัสนี้ จะเลือกใช้ ไอซี 7805 ในการออกแบบวงจรรักษา ระดับแรงดันที่ขาเกตร่วมกับวงจรรักษาระดับแรงดันอย่างง่ายที่ใช้ซีเนอร์ไดโอดเบอร์ 1N4708 กับ ตัวต้านทานปรับค่าได้ขนาด 1000 โอห์ม โดยอินพุตของวงจรรวมนี้จะแบ่งแรงดันมาจากขาเครน 48 โวลต์ แล้วใช้ตัวต้านทานขนาด 10 กิโลโอห์ม ต่ออนุกรมเพื่อลดแรงดันและกระแส โดยเมื่อป้อน แรงดันที่ประมาณ 1.25 โวลต์ ระดับกระแส I<sub>DQ</sub> จะอยู่ที่ประมาณ 60 มิลลิแอมป์และในการออกแบบ วงจรไบอัสที่ขาเครนนั้นจะมีระดับแรงดัน 48 โวลต์ โดยเราจะใช้ตัวเหนี่ยวนำที่มีก่ามาก ๆ มาต่อ อนุกรมเพื่อป้องกันไฟกระแสสลับเข้ามากวนไฟกระแสตรง และยังใช้ตัวเก็บประจุต่อคร่อมกับ กราวด์เพื่อปรับให้ไฟกระแสตรงเรียบมากขึ้น วงจรไบอัสที่ขาเครนนั้นต้องการอุปกรณ์ที่สามารถ ทนความร้อนและกระแสที่สูงได้ โดยที่กระแสที่ไหลผ่านนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 0-15 แอมป์ ขึ้นกับ ระดับสัญญาณอินพุตของวงจรขยายด้วย ซึ่งวงจรขยายกำลังสัญญาณกลิ่นกวามถิ่วิทยุด้านอินพุต แสดงดังรูป 3.23


รูปที่ 3.23 วงจรไบอัสทรานซิสเตอร์ LDMOS ที่ออกแบบ

วงจรขยายสัญญาณย่านคลื่นความถี่วิทยุด้านอินพุต ในวงจรแมตช์ชิงอินพุตของ วงจรขยายชนิดพุช-พูล นั้นจะมีอยู่สองวงจรคือแมตช์ชิงอินพุตของด้านซีกบวกและซีกลบ โดยใน แต่วงจรจะมีตัวเก็บประจุที่ต่อลงกราวด์อยู่ดังนั้นจะนำตัวเก็บประจุเหล่ามานั้นมารวมกัน จะได้ก่าตัว เก็บประจุของวงจรแมตช์ชิงอินพุตใหม่เป็น 425 + 425 = 850 pF ประกอบด้วย วงจรบาลัน วงจรขยายสัญญาณ วงจรไบอัส รวมไปถึงการออกแบบหาแมตช์ชิ่งอิมพิแคนซ์ ดังแสดงใน รูปที่ 3.24



# รูปที่ 3.24 วงขยายสัญญาณกำลังส่งสูงย่านความถี่วิทยุด้านอินพุต

โดยสามารถอธิบายอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรได้ดังตารางที่ 3.6

อุปกรณ์	รายละเอียด
B1	Semi Rigid Coaxial Cable RG405, 224 mm
T1, T2	M17/152 Semi Rigid Coaxial Cable M17/152, 129 mm
C1	30 pF
C2, C3	4.7 nF
C4	850 pF
C5, C6	10 µF
C7, C8, C9	1 μF
C10, C11	100 µF
C12	100 nF
R1,R2	10 Ω
R3	ตัวต้านทานปรับค่าได้ 1k Ω (W103)
R4	lk Ω

ตารางที่ 3.6 ตารางแสดงก่าต่าง ๆ ของวงจรขยายกำลังส่งสัญญาณกลื่นวิทยุด้านอินพุต

อุปกรณ์	รายละเอียด
R5	220 Ω
R6	2k $\Omega$
D1	ซีเนอร์ไคโอค 1N4708, 3.3V
D2	ใดโอคเปล่งแสง LED
D3	1N4001
Q1	7805 Voltage regulator
Q2	BLF578

ตารางที่ 3.6 แสดงค่าต่าง ๆ ของวงจรขยายกำลังส่งสัญญาณคลื่นวิทยุด้านอินพุต (ต่อ)

วงจรขยายสัญญาณย่านคลื่นความถี่วิทยุวิทยุด้านเอาต์พุต การรวมกันของวงจร เอาต์พุตแมตช์ชิงและวงจรเอาต์พุตบาลันนั้น จะมีตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมกันอยู่และอยู่ในตำแหน่ง เดียวกัน นั้นคือตัวเก็บประจุขนาด 330pF ของวงจรเอาต์พุตบาลัน และตัวเก็บประจุ 330 pF ของวงจรเอาต์พุตแมตช์ชิง ดังนั้นเราจะทำการรวมให้เป็นตัวเก็บประจุตัวเดียว เราจะได้ค่าตัวเก็บ ประจุใหม่เป็น 165pF (*C* = (330×330) / (330+330) = 165*pF*) มีหลักการทำงานและการ ออกแบบที่คล้ายกันกับวงจรอินพุตเพียงแต่ไม่มีการออกแบบวงจรไบอัสแสดงดังรูปที่ 3.25



รูปที่ 3.25 วงขยายสัญญาณกำลังส่งสูงย่านความถี่วิทยุด้านเอาต์พุต

โดยสามารถอธิบายอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรได้ดังตารางที่ 3.7

อุปกรณ์	รายละเอียด
Q2	BLF578
T3, T4	Coaxial Cable EZ-141, 85.94 mm
B2	Coaxial Cable RG402, 190 mm
C13, C14	330 pF
C15, C16	165 pF
C17, C18, C21	100 nF
C19, C20	2.2 μF
C22	Electrolyte 220 µF, 63V
C23	4.7 nF
C24	33 pF
LI	AWG 12 – 10Turn $\phi$ 10mm
L2	AWG 12 Through ferrite
R11	1 Ω
E.	19

ตารางที่ 3.7 ตารางแสดงก่าต่าง ๆ ของวงจรขยายกำลังส่งสัญญาณกลิ่นวิทยุด้านเอาต์พุต

จากการออกแบบของวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงแต่ละส่วนข้างต้นทำให้ได้ ลักษณะของวงจรชุดเดียวดังรูปที่ 3.26



รูปที่ 3.26 วงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุ

เมื่อทราบถึงวงจรงยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุและค่าต่าง ๆ ของตัว อุปกรณ์ที่จะนำมาลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ จึงได้ทำการเขียนลายบนแผ่นวงจรพิมพ์ FR35 ดังแสดงใน รูปที่ 3.27



รูปที่ 3.27 แผงวงจรพิมพ์ที่พร้อมลงอุปกรณ์

สำหรับตัวต้ำนทานและตัวเก็บประจุใช้เป็นแบบ SMD (Surface Mount Device) ซึ่งข้อดีคือตัวอุปกรณ์มีขนาดเล็ก เหมาะกับการใช้งานที่วงจรความถี่สูง เนื่องจากลดความเหนี่ยวนำ และความจุไฟฟ้าแฝงที่เกิดขาอุปกรณ์ การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ทำได้ง่าย และสายส่งสัญญาณ สำหรับแมตช์ชิ่งอิมพีแดนซ์เมื่อลงอุปกรณ์เรียบร้อยทั้ง 2 ชุดจะแสดงดังรูปที่ 3.21 และแผงวงจร ดังกล่าวจะนำไปวางบนแผ่นระบายกวามร้อนแสดงดังรูปที่ 3.28



รูปที่ 3.28 แสดงแผงวงขยายสัญญาณกำลังส่งสูงย่านคลื่นวิทยุเมื่อลงอุปกรณ์สำเร็จ



รูปที่ 3.29 วงจรที่ประกอบสำเร็จพร้อมทั้งติดตั้งระบบระบายกวามร้อน

จากรูปที่ 3.29 แสดงวงจรที่ออกแบบและทำการลงอุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบระบาย ความร้อนซึ่งเป็นสิ่งคัญมากเนื่องจากความร้อนที่เกิดภายในวงจรและตัวอุปกรณ์มีความร้อนที่สูง มาก นำไปติดตั้งลงกล่องพร้อมชุดพรีแอมป์ดังแสดงในรูปที่ 3.30



รูปที่ 3.30 วงจรงยายสัญญาณที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์

# **3.3** การออกแบบแมตช์ชิ่งแผ่นเพลตสำหรับเครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก

การออกแบบแผ่นเพลตสำหรับเครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก ซึ่งใช้การแมตช์ชิ่ง RLC เรโซแนนซ์แบบอนุกรม แผ่นเพลตเป็นแผ่นทองแดงโดยขนาดของแผ่นเพลตที่ใช้ในการทดลองนี้ มีความกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร และระยะระหว่างแผ่นเพลตเท่ากับ 0.5 เซนติเมตร จึงทำ การคำนวณหาก่าความจุไฟฟ้าที่เกิดระหว่างแผ่นเพลตสองเพลตและก่าความเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นใน วงจรเพื่อทำการแมตช์ชิ่งดังแสดงในรูปที่ 3.31 และรูปที่ 3.32 สามารถกำนวณหาก่าพารามิเตอร์ได้ จากสมการที่ 2.5 ดังที่ได้กล่าวได้ในบทที่ 2 ดังต่อไปนี้

$$C = \frac{k\varepsilon A}{d}$$

$$C = \frac{4 \times 8.854 \times 10^{-12} \times (0.0025 \text{ m}^2)}{0.005 \text{ m}}$$

C = 17.70 pF

พิจารณาการออกแบบแผ่นแพลท จากการคำนวณหาค่าความจุไฟฟ้า จากสมการที่ 2.7 จาก บทที่ 2 ซึ่งจะเป็นสูตรที่ทำการหาแมตชิ่งอิมพิแคนซ์ สามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้ ที่ความถี่เท่ากับ 65 เมกะเฮิรตซ์ และแผ่นเพทลที่มีค่าความประจุไฟฟ้าเท่ากับ 17.70 pF ลำดับต่อมาทำการคำนวณหาค่าความเหนี่ยวนำภายในวงจร

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$65MHz = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L)(17.70pF)}}$$

$$L = 339 \text{ nH} = 0.339 \ \mu\text{H}$$

$$\boxed{65 \text{ MHz} \quad L = 339 \text{ nH}} \qquad \boxed{Heating plate} \quad Heating plate} \quad L = 339 \text{ nH}$$

รูปที่ 3.31 แสดงการค่าตัวอุปกรณ์ที่ทำการแมตซ์ชิ่งแผ่นเพลตสำหรับการให้ความร้อนแก่ ใดอิเล็กตริก



รูปที่ 3.32 แผ่นเพลตที่ใช้ในการทดลองจริง

การพิจารณาตัวปล่อยคลื่นสนามไฟฟ้าสำหรับการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกถือว่าเป็น ส่วนที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นส่วนที่กระจายพลังงานสนามไฟฟ้าเข้าสู่วัสดุไดอิเล็กตริกดังที่กล่าว มาข้างต้น ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงขนาดและปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยคลื่น สนามไฟฟ้า จากงานวิจัยที่ผ่านมาตัวปล่อยคลื่นสนามไฟฟ้าแบบแผ่นเพลต เป็นลักษณะตัวปล่อย กลื่นที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับงานวิจัยนี้ เนื่องจากมีการปล่อยคลื่นสนามไฟฟ้าระหว่าง แผ่นเพลตโดยผ่านวัสดุตัวกลางที่มีการสูญเสียหรือวัสดุไดอิเล็กตริก ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพต่อการ ให้ความร้อนมากที่สุด

## **3.3.1** การวิเคราะห์การส่งผ่านความร้อนแก่วัสดุไดอิเล็กตริก

การพิจารณาความเข้มสนามไฟฟ้า ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความ ร้อนภายในตัวกลางที่มีการสูญเสียหรือวัสดุไดอิเล็กตริก โดยสามารถพิจารณาการคำนวณหา อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของวัสดุไดอิเล็กตริก วัสดุไดอิเล็กตริกจะแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ย่านความถี่วิทยุและ ไมโครเวฟให้เป็นพลังงานความร้อน โดยความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการทำอันตรกิริยากัน ระหว่างพลังงานและตัวกลางที่มีคุณสมบัติเป็นไดอิเล็กตริกที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบมีขั้วและ สามารถเหนี่ยวนำคลื่นความถี่วิทยุให้เกิดเป็นความร้อนได้ โดยพลังงานที่เกิดขึ้นในวัสดุไดอิเล็กตริก สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2.3 ในบทที่ 2 คือ  $P = \rho c \frac{\Delta T}{\Delta t}$ 

เมื่อทราบถึงพลังงานที่เกิดขึ้นภายในวัสดุไดอิเล็กตริก จึงสามารถนำมาสู่การ กำนวณหากวามเข้มสนามไฟฟ้าภายในที่ต้องใช้เพื่อทำให้เกิดกวามร้อนกับวัสดุไดอิเล็กตริกโดย สามารถกำนวณได้จากสมการที่ 2.4 ในบทที่ 2 โดยทำการจัดรูปใหม่จะได้  $E = \sqrt{rac{P}{5.563 imes 10^{-11} f arepsilon^{-1}}}$ 

## 3.3.2 การวิเคราะห์พลังงานที่เกิดขึ้นในไดอิเล็กตริก

เพื่อให้ทราบถึงขนาดของพลังงานที่ใช้ในการให้ความร้อนแก่วัสดุไดอิเล็กคริกที่ เหมาะสมและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานงานมากที่สุด จึงได้มีการคำนวณหาอัตราการให้ ความร้อนกับวัสดุไดอิเล็กตริก ซึ่งใช้มอดข้าวเป็นไดอิเล็กตริกตัวอย่าง ในการให้ความร้อน โดยจาก การศึกษาปริทัศน์วรรณกรรมในบทที่ 1 ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสขึ้นไป มอดจะได้รับผลกระทบ และจะเริ่มตายซึ่งต้องใช้เวลาค่อยข้างนาน ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการให้มอดข้าวตายโดยใช้เวลา น้อยที่สุด จึงได้ทำการคำนวณให้ตัวมอดข้าวเกิดอุณหภูมิภายในตัวอยู่ที่ 60 องศาเซลเซียส และให้ อุณหภูมิเริ่มต้นที่อุณหภูมิเท่ากับ 25 °C โดยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของเวลาที่ 5 วินาที โดยที่ก่า ความร้อนจำเพาะของมอดข้าว (*c*) มีก่าเท่ากับ 3450 kJ/kg.°C และ ความหนาแน่นของวัสดุ ( $\rho$ ) มีก่าเท่ากับ 1000 kg/m³ ดังนั้น จากสมการที่ 4.1 จึงสามารถกำนวณหาพลังงานที่เกิดขึ้นภายในตัว มอดข้าว (P) ได้ดังนี้

$$P = 1000(kg / m^{3}) \times 3.450(kJ/kg.^{\circ}C) \frac{(60 - 25)^{\circ}C}{5 \text{ sec}}$$

โดยค่าที่ได้เป็นพลังงานที่ใช้ในหน่วยปริมาตรที่เป็นตารางเมตร แต่จากการสำรวจ ปริทัศน์วรรณกรรมมอดข้าวมีขนาดตัวโดยมาตรฐาน กว้าง 1 มิลลิเมตร ยาว 3 มิลลิเมตร และ สูง 1 มิลลิเมตร ดังนั้นมอดข้าวจึงมีปริมาตรเท่ากับ 3 (mm)<sup>3</sup> ดังนั้นเมื่อคำนวณหาพลังงาน ที่เหมาะสมกับปริมาตรของตัวมอดที่เวลา 5 วินาที จึงเท่ากับ 72.42 W และจากการกำนวณที่เวลา ใด ๆ ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 10 วินาที สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.8

กำลังงานที่เกิดขึ้นในตัวมอดข้าว (W) เวลา (s) 362.25 1 2 181.12 3 120.75 4 90.56 72.42 5 60.37 6 51.75 7 8 45.28 40.25 9 10 36.22

ตารางที่ 3.8 ค่าความหนาแน่นของกำลังงานที่เกิดขึ้นในตัวมอดข้าว ณ เวลาใด ๆ

จากตารางที่ 3.8 แสดงการคำนวณหาค่าอัตราพถังงานที่เกิดขึ้นในตัวมอดข้าว ในเวลาตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 10 วินาที ซึ่งได้จากการคำนวณจากสมการที่ 2.3 ซึ่งสามารถแสดงค่าเป็น กราฟแสดงความสัมพันธ์ได้ดังรูปที่ 3.33 ซึ่งพบว่าถ้าต้องการให้มอดข้าวตายเร็วต้องให้พลังงานที่ เกิดขึ้นในตัวมอดข้าวมากขึ้นด้วยในทางตรงกันข้ามเมื่อต้องการให้มอดข้าวตายในเวลาช้าลงทำให้ ใช้พลังงานน้อยลงซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของงาน



รูปที่ 3.33 ความสัมพันธ์ของพลังงานที่เกิดขึ้นในตัวมอดข้าวต่อเวลา

# 3.3.3 การพิจารณาพลังงานและความถี่ที่เหมาะสมต่ออัตราการเกิดความร้อนแก่ ใดอิเล็กตริก

โดยจากปริทัศวรรณกรรมในบทที่ 2 ในงานวิจัยของ Nelson (1996) ได้นำเสนอ ช่วงความถี่ที่เหมาะสมและค่าปัจจัยในการสูญเสียยังผลไดอิเล็กตริกของมอดข้าวไว้ ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีแนวคิดที่จะหาช่วงความถี่ที่ทำให้สามารถใช้พลังงานน้อยที่สุดและเหมาะสมที่สุดจากกราฟ ดังกล่าว โดยใช้สมการที่ (2.3) และ (2.4) ในการหาความสัมพันธ์ ซึ่งเมื่อใช้เวลา 5 วินาที ดังนั้น ก่าพลังงานที่เกิดขึ้นในตัวมอดข้าว (P) เท่ากับ 72.42 วัตต์ และใช้การปรับเปลี่ยนช่วงความถี่และ ก่าปัจจัยในการสูญเสียยังผลไดอิเล็กตริกจากรูปที่ 1.5 ทำให้สามารถคำนวณก่าได้ดังตารางที่ (4.2)

f(MHz)	$\mathcal{E}^{"}$	<i>E</i> (V/m)
40	2.35	117.68
45	2.30	112.15
50	2.24	107.81
55	2.22	103.25
60	2.20	99.30
65	2.18	95.84
70	2.00	96.42
75	1.85	96.83
80	1.73	96.98

ตารางที่ 3.9 ค่าความเข้มสนามไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการให้ความร้อนในตัวมอดข้าวในแต่ละช่วง ความถี่โดยใช้เวลา 5 วินาที

ในตารางที่ 3.9 เป็นการแสดงผลการคำนวณหาก่าความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ต้อง ใช้ในการฆ่ามอดข้าวของแต่ละช่วงความถี่เพื่อนำไปวิเคราะห์ถึงระดับการใช้กำลังงานที่เหมาะสม ต่อความถี่ โดยได้กำนวณก่าที่ใช้ในช่วงเวลาเท่ากับ 5 วินาที พบว่าระดับพลังงานที่ใช้น้อยที่สุดอยู่ ที่ช่วงความถี่ประมาณ 65 MHz มีระดับความเข้มของสนามไฟฟ้าเท่ากับ 95.84 V/m เมื่อเทียบกับ งานวิจัยที่ผ่านมา ใช้ที่ความถี่ประมาณ 39-40 MHz พบว่าต้องใช้ความเข้มของสนามไฟฟ้า ถึงประมาณ 117.68 V/m เพื่อให้ง่ายต่อการดูการเปลี่ยนแปลของแต่ละช่วง สามารถเขียนกราฟแสดง ความสัมพันธ์ เพื่อได้ดังรูปที่ 3.34 ได้ดังนี้



รูปที่ 3.34 ค่าความเข้มสนามไฟฟ้าที่ใช้ในการให้ความร้อนในตัวมอดข้าวในแต่ละช่วงความถี่ โดยใช้เวลา 5 วินาที

จากความสัมพันธ์ข้างค้นผู้วิจัยจึงใช้ความถี่ 65 เมกะเฮิตรซ์และใช้ค่าปัจจัยในการ สูญเสียยังผลไดอิเล็กตริก เท่ากับ 2.18 (Nelson., 1996) ในการคำนวณหาความเข้มสนามไฟฟ้าที่ต้อง ใช้ในช่วงเวลา 1 วินาที ถึง 10 วินาที โดยจากสมการที่ 2.4 สามารถคำนวณหาความเข้มสนามไฟฟ้า ที่ต้องใช้ที่เวลาต่าง ๆ แสดงได้ดังนี้

ที่ อุณหภูมิเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส พลังงานที่เกิดขึ้นในตัวมอดข้าวเท่ากับ 181.12 W และที่เวลา 5 วินาที สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$E = \sqrt{\frac{72.42}{5.563 \times 10^{-11} 65 \times 10^6 \times 2.18}}$$

2 -

$$E = 95.84 \, (V/m)$$

เมื่อคำนวณหาความเข้มสนามไฟฟ้าที่เหมาะสมกับปริมาตรของตัวมอดที่เวลา 5 วินาที จึงได้เท่ากับ 95.84 V/m และจากการคำนวณที่เวลาใด ๆ ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 10 วินาที สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.10

เวลา (s)	กำลังงานที่เกิดขึ้นในตัวมอดข้าว (W)	ความเข้มสนามไฟฟ้า (V/m)
1	362.25	214.37
2	181.12	151.61
3	120.75	123.76
4	90.56	107.18
5	72.42	95.84
6	60.37	87.51
7	51.75	81.02
8	45.28	75.79
9	40.25	71.45
10	36.22	67.78

ตารางที่ 3.10 ก่าความความเข้มของสนามไฟฟ้าที่เวลาใค ๆ

จากตารางที่ 3.10 แสดงการคำนวณหาค่าความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นและทำให้ ตัวมอดข้าวเกิดความร้อน ในเวลาตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 10 วินาที ซึ่งได้จากการคำนวณจากสมการที่ (2.4) โดยระยะเวลาที่ต้องการพิจารณาในการฆ่ามอดข้าวในงานวิจัยนี้ ซึ่งสามารถแสดงค่าเป็นกราฟ แสดงความสัมพันธ์ได้ดังรูปที่ 3.35



## รูปที่ 3.35 ความสัมพันธ์ของความเข้มสนามไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการฆ่ามอดข้าวต่อเวลา

จากรูปที่ 3.35 แสดงให้เห็นว่า เมื่อต้องการให้มอดข้าวตายเร็วต้องให้ความเข้ม สนามไฟฟ้ามากขึ้นด้วยในทางตรงกันข้ามเมื่อต้องการให้มอดข้าวตายในเวลาช้าลงต้องใช้ความเข้ม สนามไฟฟ้าน้อยลงด้วย

# 3.3.4 การวิเคราะห์กำลังงานของเครื่องสำหรับการให้ความร้อนแก้ใดอิเล็กตริก

เมื่อทราบถึงความเข้มสนามไฟฟ้าที่เกิดความร้อนในตัวมอดข้าวที่ได้กล่าวไว้ ข้างต้นและทำให้ในตัวมอดข้าวเกิดความร้อนตาย เพื่อให้ง่ายต่อการทดลองและเก็บผลการทดลอง จึงทำการคำนวณกำลังงานที่ต้องใช้ให้อยู่ในรูปของกำลังงานของเครื่อง โดยพิจารณาจากโหลดที่ทำ การแมตช์ซิ่งเป็นวงจร RLC เรโซแนนซ์แบบอนุกรมดังแสดงในรูปที่ 2.5 เริ่มทำการคำนวณหา แรงดันที่ตกกร่อมระหว่างแผ่นเพลตภายในวงจรเรโซแนนซ์ได้จาก  $V_c = IX_c$  โดย  $X_c = 1/2\pi fC$ และแผ่นเพลทที่ทำการออกแบบมีก่ากวามจุไฟฟ้า (C) เท่ากับ 17.70 pF ดังนั้นจะได้

$$X_{c} = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_{c} = \frac{1}{2\pi (65MHz)(17.70 \, pF)}$$

$$X_{c} = 138.44 \quad \Omega$$

ต่อจากนั้นทำการคำนวณหาแรงคันที่ตกคร่อมระหว่างแผ่นเพลตจากสมการที่ 2.6 คือ *E* = *V* / *d* โดยค่าความเข้มสนามไฟฟ้า (E) จากการคำนวณคังตารางที่ 3.9 ยกตัวอย่างที่เวลา 5 วินาทีมีค่าเท่ากับ 95.84 โวลต์ต่อเมตร จะได้

$$V_c = Ed$$
$$V_c = 95.84 \times 5$$
$$V_c = 479.20 \text{ V}$$

ต่อมาทำการคำนวณกระแส ไฟ (I) ภายในวงจร RLC เรโซแนนซ์แบบอนุกรมที่ ระยะเวลา 5 วินาทีโดย V<sub>c</sub>= 479.20 โวลต์ และ X<sub>c</sub>= 138.33 โอมห์ จากการคำนวณข้างต้นจะได้

$$I = \frac{V_c}{X_c}$$
$$I = \frac{479.20}{138.44}$$

I = 3.46 A

ต่อมาทำการคำนวณหากำลังงานเอาต์พุตของแหล่งจ่ายได้จาก P = IV ที่ระยะเวลา 5 วินาที โดยที่แรงดันจากพาวเวอร์ซัพพลาย (V) เท่ากับ 48 โวลต์ และกระแสไฟภายในวงจรเท่ากับ 3.46 แอมป์ จะได้

```
P = IVP = (3.46A) \times (48V)
```

ดังนั้น P=166.14 W

เมื่อคำนวณหากำลังงานของแหล่งง่ายที่เหมาะสมกับปริมาตรของมอดข้าวที่เวลา 5 วินาที ได้เท่ากับ 166.14 วัตต์ และจากการคำนวณที่เวลาใด ๆ ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 10 วินาที สามารถ แสดงได้ดังตารางที่ 3.11

ตารางที่ 3.11 แสดงผลการกำนวณแรงดันตกกร่อม กรแสภายในวงจรและกำลังงานของแหล่งจ่าย ที่ เวลาใด ๆ

เวลา (t)	ความเข้ม สนามไฟฟ้า (V/m)	แรงดันตกคร่อม แผ่นเพลท (V)	กระแสภายใน วงจรเร โซแนนซ์ (A)	กำลังงานของ แหล่งจ่าย (W)
1	214.37	1071.85	7.74	371.63
2	151.61	758.05	5.47	262.83
3	123.76	618.80	4.46	214.55
4	107.18	535.90	3.87	185.80

ເວຄາ (t)	ความเข้ม สนามไฟฟ้า (V/m)	แรงคันตกคร่อม แผ่นเพลท (V)	กระแสภายใน วงจรเร โซแนนซ์ (A)	กำลังงานของ แหล่งจ่าย (W)
5	95.84	479.20	3.46	166.14
6	87.51	437.55	3.16	151.70
7	81.02	405.10	2.92	140.45
8	75.79	378.95	2.73	131.38
9	71.45	357.25	2.58	123.86
10	67.78	338.90	2.44	117.50

ตารางที่ 3.11 แสดงผลการคำนวณแรงคันตกคร่อม กระแสภายในวงจรและกำลังงานของ แหล่งจ่าย ที่เวลาใด ๆ (ต่อ)

จากตารางที่ 3.11 แสดงการกำนวณหาก่าแรงดันตกกร่อมระหว่างแผ่นเพลต กระแสภายในวงจร RLC เร โซแนนซ์และกำลังงานของแหล่งจ่าย ในเวลาตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 10 วินาที โดยระยะเวลาที่ต้องการพิจารณาในการฆ่ามอดข้าวในงานวิจัยนี้ ซึ่งสามารถแสดงก่าเป็น กราฟแสดงกวามสัมพันธ์ได้ดังรูปที่ 3.36 จะพบว่าเมื่อเพิ่มกำลังงานของแหล่งจ่าย กวามเข้ม สนามไฟฟ้าก็จะมากขึ้นตามด้วย



รูปที่ 3.36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งจ่ายกำลังงานกับความเข้มสนามไฟฟ้า



รูปที่ 3.37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งจ่ายกำลังกับระยะเวลา

จากรูปที่ 3.37 จากการคำนวณ พบว่ามอดข้าวตายที่เวลา 1 วินาทีต้องใช้กำลังงาน จากแหล่งจ่าย 371.63 วัตต์ มอดข้าวตาย ที่ 5 วินาทีต้องใช้กำลังงานจากแหล่งจ่าย 166.14 วัตต์ มอด ข้าวตายที่ 10 วินาทีต้องใช้กำลังงานจากแหล่งจ่าย 117.50 วัตต์ เป็นต้น

#### 3.4 สรุป

การให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจถึงหลักการทำงานของวงจร ระบบ และ โครงสร้างของอุปกรณ์ที่นำมาออกแบบและสร้าง ประกอบไปด้วย ภาควงจรขยายกำลัง สัญญาณออกแบบด้วยมอสเฟท เบอร์ BLF578 เป็นคลาสเอบีแบบพุชพูล โดยจะมีการพิจารณาถึง อิมพีแดนซ์ด้านเข้าและด้านออกและกำลังด้านเข้าและด้านออก สำหรับภาคเอาต์พุตที่เป็นแผ่นเพลต โดยการออกแบบแผ่นเพลตสำหรับการให้ความร้อนของเครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกย่าน กลื่นความถี่วิทยุ พิจารณาการใช้แผ่นเพลตที่เป็นแผ่นทองแดงที่สามารถเกิดการกระจายตัวของ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีที่สุดและเหมาะสมกับงานมากที่สุดและพิจารณาการเรโซแนนซ์ของภาค วงจรซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้กำลังงานส่งผ่านไปยังโหลดที่เป็นแผ่นเพลตได้มากที่สุด

## บทที่ 4

#### การวัดและผลการทดลอง

#### 4.1 กล่าวนำ

จากการกล่าวถึงการออกแบบวงจรเครื่องให้ความร้อนแบบใคอิเล็กตริกในบทที่ผ่านมา โดยการใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์และออกแบบ สำหรับในบทนี้จึงกล่าวถึงการทคลองและผลการ ทคสอบสำหรับเครื่องให้ความร้อนแก่ไคอิเล็กตริกที่ได้ออกแบบเพื่อยืนยันการออกแบบและ วิเกราะห์ผลการทคสอบที่ได้ โดยประกอบด้วยการวัดผลสองส่วนหลัก คือ วงจรขยายสัญญาณกำลัง สูงโดยใช้เครื่องวิเกราะห์สเปกตรัม (Spectrum Analyzer) และเครื่อง (Service Monitor) ในการวัด ทดสอบ ในการทคลองวงจรขยายกำลังส่งสัญญาณย่านคลื่นความถี่วิทยุนี้ ทำการทคลองที่ก่าความถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ์ และทำการวัดกำลังของสัญญาณอินพุต กำลังของสัญญาณเอาต์พุต นำค่าที่ได้มา กำนวณหาอัตราขยายและประสิทธิภาพการทำงานของวงจร และทคสอบการให้ความร้อนแก่ ใดอิเล็กตริก ซึ่งไดอิเล็กตริกที่ใช้อ้างอิงในการทคลองและเก็บผลการทคลองกือมอดข้าว

# 4.2 การวัดและเก็บผลการทดลองวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุ สำหรับเครื่องให้ความร้อนแก้ใดอิเล็กตริก

## 4.2.1 วงจรขยายสัญญาณกำลังสูงย่านความถี่วิทยุ

ลักษณะวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงรับสัญญาณอินพุตจากวงจรขับกำลังสัญญาณ และใช้แรงคันไฟฟ้าขาเครนเท่ากับ 48 โวลต์และแรงคันที่ขาเกทเท่ากับ 1.2-1.5 โวลต์ สำหรับภาค วงจรนี้ได้ทคลองวัคผลวงจรขยายสัญญาณกำลังสูง ซึ่งได้วัคสัญญาณอินพุต สัญญาณเอาต์พุต กำลังสัญญาณอินพุต กำลังสัญญาณเอาต์พุต และนำผลที่ได้กำนวณก่าอัตราขยายและประสิทธิภาพ ของวงจรขยายสัญญาณกำลังสูง ในรูปที่ 4.1 บล๊อกไดอะแกรมแสดงลักษณะการทคลองวงจร ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดสัญญาณกวามถี่ (Signal Generator MACRONI 2032) เครื่อง Service Monitor วงจรขับกำลังสัญญาณ และวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงและในรูปที่ 4.2 แสดงการวัดผล วงจรขยายสัญญาณกำลังสูงโดยลักษณะจะเป็นดังนี้ ในส่วนแรกเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ จ่ายสัญญาณอินพุต ให้กับวงจรขับกำลังสัญญาณจากนั้นเอาต์พุตที่ได้จากวงจรขับกำลังสัญญาณจะ เป็นอินพุตให้กับวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงและเชื่อมต่อเอาต์พุตกับเครื่อง Service Monitor สำหรับแสดงผลการทดลอง



## รูปที่ 4.1 แสดงบล๊อกใดอะแกรมแสดงลักษณะการทดลองวงจรขยายสัญญาณกำลังสูง



รูปที่ 4.2 แสดงการวัดผลการทดลองวงจรขยายสัญญาณกำลังสูง

ในขั้นตอนแรกสำหรับทคสอบวงจรขยายสัญญาณ จะทำการทคสอบวงจรขยาย สัญญาณที่กำลังวัตต์ต่ำเพื่อทำการทคสอบความถี่ของวงจรขยายว่าสามารถทำการขยายสัญญาณได้ดี ที่ความถี่ที่ได้ทำการออกแบบไว้ โดยเริ่มทำการจ่ายสัญญาณอินพุตเข้า ทำการวัคสัญญาณอินพุตและ เอาต์พุต โดยใช้เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมด้วยการใช้โพรบจิ้มวัคสัญญาณของวงจรซึ่งผลที่ได้แสดง ดังรูปที่ 4.3 แสดงสัญญาณอินพุต และ 4.4 แสดงสัญญาณเอาต์พุต

50	Q	AC	SENSE:INT	1	ALIGN OFF		01:09:39	PM Mar 03, 2014
Center Freq	65.000000 M	t: RF PNO: Fast IFGain:Low	Trig: Free Atten: 20	Run dB	Avg Type:	Log-Pwr	T	VEL23456 VPEWWWWWWW DETNNNNNN
10 dB/div						м	kr1 65.00 -10	0 0 MHz 51 dBm
0.00								
-10.0				<b>∳</b> ¹				
-20.0				А				
-30.0				}				
-40.0								
-50.0								
-60.0								
-70.0	treated to be the	Air diaisi la cha a	and the second second	WUQ.	adduct the state	والمراجع والمراجع	il for a diffet	anitik di
-80.0			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					
Center 65.00 Res BW 750 F	MHz (Hz		VBW 750 kHz			Swee	Span p 1.00 ms	81.60 MHz (1001 pts)
MSG					STATUS 🐼	RF Alignment	Failure	

# รูปที่ 4.3 แสดงสัญญาณอินพุตของวงจรขยายสัญญาณ

100	50 Q		AC	SENSE:INT	ΔA	LIGN OFF		01:12:5	0 PM Mar 03, 2014
Center	Freq 65.00000	D MHZ Input: RF F IF	PNO: Fast Gain:Low	Trig: Free Atten: 26 d	Run 18	Avg Type:	Log-Pwr		DET N N N N N N
10 dB/div							M	1kr1 65.00 33	00 0 MHz
					1				
6.00					}				
-5.00					\				
					l l				
-15.0									
-25.0				$\vdash$					
-35.0									
45.0									
-55.0	L. L. L. Martin	ah in	1. 11.	1.16	al and	1.1	.1		. In a life of
-65.0	w. Litter bland faller					i An Albain			
-75.0		<u>iil "I</u> ili		1000,044,0	ra. bible i		Li L	الأربا الألال	11.2.2.1
		, m			<b>!</b> !	" <sup>  </sup> "			لالاه
Center Res BW	65.00 MHz / 750 kHz		VBV	N 750 kHz			Swee	Span ep 1.00 ms	81.60 MHz
MSG						STATUS C	RE Alianment	Failure	

รูปที่ 4.4 แสดงสัญญาณเอาต์พุตของวงจรขยายสัญญาณ

ต่อมาทำการทดสอบย่านความถี่ของวงจรขยายสัญญาณ โดยทดสอบที่กำลังอินพุต 0.5 วัตต์ แล้วใช้เครื่อง Service Monitor ในการวัดสัญญาณเอาต์พุต ทำการเปลี่ยนความถี่ไปเรื่อย ๆ เพื่อหาความถี่ที่วงจรขยายสัญญาณทำงานได้ดีที่สุด จากรูปที่ 4.5 จะแสดงค่าอัตราการขยายของ วงจรขยายที่ออกแบบเทียบกับความถี่ตั้งแต่ 60 – 80 เมกกะเฮิรตซ์ ซึ่งพบว่า ความถี่ที่ออกแบบไว้ คือความถี่ 65 เมกกะเฮิรตซ์อยู่ในย่านที่มีอัตราการขยายที่สูง อยู่ที่ประมาณ 15.51 dB ที่ความถี่ 65 เมกกะเฮิรตซ์ ดังนั้นจากการทดสอบที่วัตต์ต่ำสามารถแสดงให้เห็นว่าวงจรขยายที่ออกแบบนี้ สามารถใช้งานได้ดีในย่านความถี่ 65 เมกกะเฮิรตซ์



รูปที่ 4.5 เปรียบเทียบอัตราขยายสัญญาณช่วงความถี่ 60 - 80 เมกกะเฮิรตซ์ที่กำลังงานต่ำ

ลำดับต่อมาทำการทดสอบวงจรงยายสัญญาณโดยทำการเพิ่มกำลังงานสัญญาณ อินพุตไปเรื่อย ๆ เทียบกำลังงานสัญญาณเอาต์พุต โดยจะทำการทดสอบวงจรงยายแล้วนำก่าที่ได้มา กำนวณหาก่าอัตรางยายและก่าประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 4.1

OSC (dBm)	P <sub>in</sub> (W)	V <sub>s</sub> (V)	I <sub>s</sub> (A)	P <sub>out</sub> (W)
-10	0.19	48	0.89	2
-9	0.22	48	1.13	5
-8	0.38	โยเทคโ48ลย์สุรา	1.54	9
-7	0.51	48	1.79	15
-6	0.77	48	2.02	24
-5	1.01	48	2.55	36
-4	1.15	48	2.78	42
-3	1.37	48	2.97	51
-2	1.77	48	3.98	74
-1	2.02	48	4.58	93
0	2.35	48	5.12	112
1	2.96	48	5.50	128
2	3.42	48	6.77	164

ตารางที่ 4.1 ก่าจากการทคลองวงจรขยายสัญญาณที่กวามถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ์

OSC (dBm)	P <sub>in</sub> (W)	V <sub>s</sub> (V)	I <sub>s</sub> (A)	P <sub>out</sub> (W)
3	3.88	48	7.22	185
4	4.25	48	48 7.81	
5	4.78	48	8.25	228
6	5.14	48	9.05	254
7	6.19	48	10.54	302
8	7.04	48	11.84	340
9	8.2	48	13.20	385
10	9.3	48	14.30	420

ตารางที่ 4.1 ค่าจากการทคลองวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ์ (ต่อ)

จากตารางที่ 4.1 สามารถนำค่าต่างๆ มากำนวณหากำลังของสัญญาณอินพุต (dBm) กำลังของสัญญาณเอาต์พุต (dBm) อัตราขยายและประสิทธิภาพของวงจรได้ด้วยสมการที่ได้กล่าวไว้ ในบทที่ 2 ซึ่งจะได้ก่าต่าง ๆ ดังนี้

OSC (dBm)	P <sub>in</sub> (dBm)	P <sub>out</sub> (dBm)	Gain (dB)	Efficiency (%)
-10	19.54	33.01	<b>5</b> 10.22	04.63
-9	23.42	36.98	13.56	09.21
-8	25.79	39.54	13.74	12.02
-7	27.07	41.76	14.68	17.24
-6	28.86	43.80	14.93	24.48
-5	30.04	45.56	15.51	29.14
-4	30.60	46.23	15.62	31.19
-3	31.36	47.07	15.70	35.46
-2	32.48	48.69	16.21	38.47
-1	33.05	49.68	16.63	42.03
0	33.71	50.49	16.78	45.30
1	34.71	51.07	16.77	48.21

ตารางที่ 4.2 ค่าที่ได้จากการคำนวณของวงจรงยายสัญญาณที่ความถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ์

OSC (dBm)	P <sub>in</sub> (dBm)	P <sub>out</sub> (dBm)	Gain (dB)	Efficiency (%)
2	35.34	52.14	16.80	50.23
3	35.88	52.67	16.78	53.14
4	36.28	53.13	16.85	54.71
5	36.79	53.57	16.78	57.34
6	37.10	54.04	16.93	58.25
7	37.47	54.80	16.88	59.49
8	38.47	55.34	16.83	59.67
9	39.13	55.85	16.71	60.62
10	39.68	56.23	16.54	61.05

ตารางที่ 4.2 ค่าที่ได้จากการคำนวณของวงจรขยายสัญญาณที่ความถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ์ (ต่อ)

และจากตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 จะสามารถนำมาสร้างกราฟเปรียบเทียบ



รูปที่ 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของสัญญาณเอาต์พุต (P<sub>out</sub>) กับกำลังของสัญญาณ อินพุต (P<sub>in</sub>) ที่กวามถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 4.6 จะเห็น ได้ว่าเมื่อป้อนกำลังของสัญญาณอินพุตให้กับวงจรมากขึ้น ก่ากำลังของสัญญาณเอาต์พุตก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย



รูปที่ 4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราขยาย (Gain) กับกำลังของสัญญาณเอาต์พุต (P<sub>out</sub>) ที่ความถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 4.7 จะเห็นได้ว่าที่กำลังงานเอาต์พุตช่วงประมาณ 2 - 90 วัตต์ อัตราขยาย จะไม่คงที่ แต่จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และอัตราขยายจะค่อนข้างคงที่เมื่อกำลังของสัญญาณ อินพุตอยู่ที่ประมาณ 100 วัตต์ โดยที่อัตราขยายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15 - 16 dB



รูปที่ 4.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน (Effiiciency) กับกำลังเอาต์พุต (P<sub>ou</sub>) ที่ความถี่ 65 เมกะเฮิร์ตซ์

จากรูปที่ 4.8 จะเห็นได้ว่าเมื่อกำลังงานเอาต์พุตมากขึ้น ค่าประสิทธิภาพการทำงาน ของวงจรก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยที่กำลังงานเอาต์พุตและค่าประสิทธิภาพการทำงานของวงจร จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มทำงานและเริ่มนิ่งเมื่อถึงจุดทำงานของวงจร ประสิทธิภาพ สูงสุดอยู่ที่ 61.05 เปอร์เซนต์ โดยประสิทธิภาพของคลาสเอบีพุชพูลจะอยู่ระหว่างประสิทธิภาพ ของคลาสเอและคลาสบี คืออยู่ระหว่าง 50 - 78.5 เปอร์เซนต์ ซึ่งประสิทธิภาพของวงจรขยาย สัญญาณที่ทำการออกแบบนี้มีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 60 เปอร์เซนต์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (Cripps Steve C., 1999)

### 4.3 การวัดและเก็บผลการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกด้วยแผ่นเพลต

สำหรับการวัดผลการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกด้วยแผ่นเพลตซึ่งจะให้ความร้อนกับมอด ข้าว โดยมีการเตรียมอุปกรณ์แสดงดังรูปที่ 4.9 แสดงบล๊อกไดอะแกรมลักษณะการวัดผลการให้ ความร้อนด้วยแผ่เพลตและการวัดทดสอบผลดังแสดงดังรูปที่ 4.10 ซึ่งประกอบด้วย วงจรขับกำลัง สัญญาณ โดยรับสัญญาณมาจากเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ จากนั้นเอาต์พุตที่ได้จากวงจรขับกำลัง สัญญาณ จากนั้นส่งต่อสัญญาณไปยังภาควงจรขยายสัญญาณ และเชื่อมต่อกับภาควงจรการ ให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกผ่านแผ่นเพลตเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยที่วงจรขยาย สัญญาณกำลังสูง จะกำหนดไบอัสแรงดันไฟฟ้าขาเดรนเท่ากับ 48 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าขาเกทเท่ากับ 1.2 - 1.5 โวลต์ สำหรับการทดลองการให้ความร้อนด้วยขดลวดเหนี่ยวนำนี้ ได้ทดลองที่ กวามถี่ 65 เมกกะเฮิรตซ์ โดยใช้กำลังงานขนาดต่างๆดังแสดงการวัดผลดังต่อไปนี้



#### รูปที่ 4.9 บล๊อกไดอะแกรมแสดงลักษณะการวัดผลการให้กวามร้อนด้วยแผ่นเพลต



รูปที่ 4.10 การวัดผลการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกกับมอดข้าว

การทดลองการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกกับมอดข้าวที่ขนาดของแผ่นเพลตมีความ กว้าง 5 เซนติเมตร ความยาว 5 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างเพลต 0.5 มิลลิเมตร ที่ความถี่ 65 เมกกะเฮิรตซ์ เทียบกับเวลาที่ใช้ 10 วินาที กำลังงานเริ่มต้น 20 วัตต์ทำการเพิ่มกำลังงาน ครั้งละ 20 วัตต์ไปเรื่อย ๆ จนพบกำลังงานสูงสุดที่มอดข้าวตาย 100 เปอร์เซนต์ โดยการทดลองแต่ ละครั้งจะทำการทดลองซ้ำเดิมจำนวน 3 ครั้ง และแต่ละครั้งใช้มอดข้าวจำนวน 10 ตัว ซึ่งผลลัพธ์ ที่ได้ แสดงดังตารางที่ 4.3 และสามารถแสดงก่าเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ได้ดังรูปที่ 4.11



เวลา (วินาที)	พลังงาน (วัตต์)	จำนวนมอด ข้าวที่ ทคลอง (ตัว)	จำา กรั้ง สี่ 1	นวนมอดฯ กี่ตาย (ตัว ครั้ง ส่ว	ข้าว ) ครั้ง	อัตราการตาย ของมอดข้าว โดยเฉลี่ย (%)
10	20	10	W 1	M 2	11.5	0
10	20	10	0	0	0	0
10	40	10	0	2	1	0
10	60	10	0	0	0	0
10	80	10	2	1	2	13.3
10	100	10	7	5	8	66.67
10	120	10	9	9	8	93.3
10	140	10	10	10	10	100
10	160	10	10	10	10	100
10	180	10	10	10	10	100
10	200	10	10	10	10	100

ตารางที่ 4.3 แสดงอัตราการตายของมอดข้าวโดยใช้เวลา 10 วินาทีที่กำลังงาน 20 - 200 วัตต์



# รูปที่ 4.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตายของมอดข้าวเทียบกับกำลังงานที่ใช้ที่ เวลา 10 วินาที

จากตารางที่ 4.3 และรูปที่ 4.11 พบว่าที่กำลังงานต่ำกว่า 140 วัตต์ยังมีมอดข้าวที่มีชีวิตอยู่ และที่กำลังงานตั้งแต่ 140 วัตต์อัตราการตายของมอดข้าวอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเมื่อเทียบกับผล จากการคำนวณดังตารางที่ 3.10 ที่เวลา 10 วินาทต้องใช้กำลังงาน 117.50 วัตต์

ต่อมาทำการทดลอง เทียบกับเวลาที่ใช้ 5 วินาที กำลังงานเริ่มต้นทำการอ้างอิงจากการ กำนวณเนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องการผลการตายของมอดข้าว 100 เปอร์เซนต์ ซึ่งกำลังงานจากการ กำนวณคือ 166.14 วัตต์เพื่อเป็นการลดจำนวนการทดลอง ดังนั้นในการทดลองที่ใช้เวลา 5 วินาที ใช้กำลังเริ่มต้นที่ 140 วัตต์และทำการเพิ่มกำลังงานครั้งละ 20 วัตต์ไปจนพบกำลังงานสูงสุดที่มอด ข้าวตาย 100 เปอร์เซนต์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ แสดงดังตารางที่ 4.4 และสามารถแสดงก่าเป็นกราฟแสดง กวามสัมพันธ์ได้ดังรูปที่ 4.12 พบว่าที่กำลังงานต่ำกว่า 200 วัตต์ยังมีมอดข้าวที่มีชีวิตอยู่ และ ที่พลังงานตั้งแต่ 200 วัตต์อัตราการตายของมอดข้าวอยู่ที่ 100 เปอร์เซนต์

เวลา (วินาที)	พลังงาน (วัตต์)	จำนวนมอด ข้าวที่ ทดลอง (ตัว)	จำน ครั้ง ที่ 1	วนมอดข้ ตาย (ตัว) กร้ง ที่ 2	ำวที่ ครั้ง ที่ 3	อัตราการตาย ของมอดข้าว โดยเฉลี่ย (%)
5	140	10	4	4	3	36.67
5	160	10	7	5	8	66.67
5	180	10	8	9	10	90.00
5	200	ยาลัย10คโนโล	10	10	10	100
5	220	10	10	10	10	100
5	240	10	10	10	10	100

ตารางที่ 4.4 แสดงอัตราการตายของมอดข้าวโดยใช้เวลา 5 วินาทีที่กำลังงาน 140 - 240 วัตต์



รูปที่ 4.12 แสดงกวามสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตายของมอดข้าวเทียบกับกำลังงานที่ใช้ที่ เวลา 5 วินาที

ต่อมาทำการทดลอง เทียบกับเวลาที่ใช้ 1 วินาที กำลังงานเริ่มต้นทำการอ้างอิงจากการ กำนวณลือ 371.63 วัตต์ ดังนั้นในการทดลองที่ใช้เวลา 1 วินาที ใช้กำลังเริ่มต้นที่ 340 วัตต์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ แสดงดังตารางที่ 4.5 และสามารถแสดงก่าเป็นกราฟแสดงกวามสัมพันธ์ได้ดัง รูปที่ 4.13 พบว่าที่กำลังงานต่ำกว่า 200 วัตต์ยังมีมอดข้าวที่มีชีวิตอยู่ และที่พลังงานตั้งแต่ 200 วัตต์ อัตราการตายของมอดข้าวอยู่ที่ 100 เปอร์เซนต์

เวลา (วินาที)	พลังงาน (วัตต์)	จำนวนมอด ข้าวที่ ทคลอง (ตัว)	จำน ครั้ง ที่ 1	วนมอดข้ ตาย (ตัว) กรั้ง ที่ 2	ัาวที่ ครั้ง ที่ 3	อัตราการตาย ของมอดข้าว โดยเฉลี่ย (%)
1	340	10	3	3	2	26.67
1	260	10	7	4	6	56.67
1	280	10	9	10	9	93.33
1	400	10	10	10	10	100
1	420	10	10	10	10	100

ตารางที่ 4.5 แสดงอัตราการตายของมอดข้าวโดยใช้เวลา 1 วินาทีที่กำลังงาน 340 - 420 วัตต์



รูปที่ 4.13 แสดงกวามสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตายของมอดข้าวเทียบกับกำลังงานที่ใช้ที่ เวลา 1 วินาที

การวัดผลการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกสำหรับฆ่ามอดข้าวที่ขนาดของแผ่นเพลตมีความ กว้าง 5 เซนติเมตร ความยาว 5 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างเพลต 0.5 มิลลิเมตร ที่ความถี่ 65 เมกกะเฮิรตซ์ ขนาดกำลังงาน 20 - 420 วัตต์ เทียบกับเวลาที่ใช้ 1, 5 และ 10 วินาที โดยการทดลองแต่ละครั้งใช้มอดข้าวจำนวน 10 ตัว นำมาวาดกราฟแนวโน้มเพื่อเปรียบเทียบกับผล จากการกำนวณ ซึ่งผลที่ได้แสดงดังในรูป 4.14



รูปที่ 4.14 แสดงการเปรียบเทียบผลการคำนวณและผลการวัคจริง

จากรูปที่ 4.14 พบว่าผลของการทดลองจริงมีแนวโน้มตามผลของการคำนวณ โดยที่ ระยะเวลาการให้ความร้อน 10 วินาทีต้องใช้กำลังงานมากกว่า 140 วัตต์มอดข้าวจะตาย 100 เปอร์เซนต์ และที่ระยะเวลา 1 วินาทีต้องใช้กำลังงานมากกว่า 400 วัตต์มอดข้าวจะตาย 100 เปอร์เซนต์ ซึ่งผลการทดลองจริงจะมีการใช้กำลังงานที่สูงกว่าผลจากการคำนวณเนื่องจาก สามารถเกิดได้หลายปัจจัยทั้งสภาพอากาศภายนอกในขณะทดลอง กำลังงานที่สูญเสียภายในวงจร เป็นต้น

#### 4.4 สรุป

บทนี้ได้นำเสนอการวัดและผลการทดลองของวงจรขยายสัญญาณย่านความถิ่วิทยุสำหรับ เครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก โดยได้วัดสัญญาณกำลังงานของภาควงจรขยายสัญญาณกำลังสูง และการให้ความร้อนกับวัสดุไดอิเล็กตริกซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้มอดข้าวสำหรับใช้ในการทดลอง ซึ่งผล การวัดภาควงจรขยายสัญญาณกำลังสูงที่ความถิ่ 65 เมกะเฮิร์ตซ์ จะมีขนาดกำลังงานประมาณ 420 วัตต์ มีอัตราขยายสัญญาณเฉลี่ยประมาณ 16.54 dB ประสิทธิภาพรวมของวงจรประมาณ 61.05 เปอร์เซนต์ และสำหรับภาควงจรการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกด้วยแผ่นเพลต ที่ขนาดของ แผ่นเพลตมีความกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตรและระยะห่างระหว่างเพลตเท่ากับ 5 มิลลิเมตร พบว่าถ้าต้องการให้มอดข้าวตายโดยใช้เวลาที่น้อยต้องให้พลังงานที่เกิดขึ้นในตัวมอด ข้าวมากขึ้นด้วย

ะ<sub>หาวักยาลัยเทคโนโลยีสุรบ</sub>ัง

# บทที่ 5

# สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

# 5.1 สรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์

วิทขานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการวิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ และเปรียบเทียบผลของการ วัดผลวงจรความถี่วิทขุสำหรับเครื่องให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก การวิจัยเริ่มจากการศึกษาเนื้อหา และความสำคัญของปัญหา ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ขอบเขตของการวิจัย และประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับจากงานวิจัย จากนั้นศึกษาทฤษฎีของวงจรย่านความถี่วิทขุสำหรับ การให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริกด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของการให้ ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก ทฤษฎีวงจรขยายสัญญาณกำลังสูง ออกแบบวงจร และสร้างวงจรความถี่ วิทขุสำหรับการให้ความร้อนแก่ไดอิเล็กตริก โดยจากการศึกษาลักษณะวงจรประกอบด้วย ภาควงจรขยายสัญญาณกำลังสูงและภาคสำหรับเป็นแหล่งจ่ายกำลังให้กับตัวปล่อยคลื่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านแผ่นเพลต และในส่วนของการทดลองและผลการทดลองจะวัดเป็นสอง ส่วนในส่วนแรกวัดในส่วนของ วงจรขยายสัญญาณกำลังสูงและในส่วนที่สองวัดการให้ความร้อน แก่วัสดุไดอิเล็กตริกโดยใช้ตัวปล่อยคลื่นแบบแผ่นเพลต

จากการวัดผลวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงที่ความถี่ 65 เมกะเฮิตรซ์พบว่ามีกำลังงานสูงสุด ประมาณ 420 วัตต์ มีอัตราการขยายสัญญาณเฉลี่ยประมาณ 16 dB มีประสิทธิภาพรวมของวงจร ประมาณ 61% และสำหรับการทดสอบการให้ความร้อนแก่ไดอีเล็กตริกผ่านแผ่นเพลตกับมอดข้าวที่ มีขนาดความกว้างเท่ากับ 5 เซนติเมตร ยาวเท่ากับ 5 เซนติเมตร และระยะระหว่างแผ่นเพลท เท่ากับ 0.5 เซนติเมตร ที่ความถี่ 65 เมกะเฮิตรซ์ ที่ได้ทำการออแบบนั้นเป็นความถี่ที่เหมาะสม เนื่องจากการทดลองที่ความถี่ 65 เมกะเฮิตรซ์ ที่ได้ทำการออแบบนั้นเป็นความถี่ที่เหมาะสม เนื่องจากการทดลองที่ความถี่ 65 เมกะเฮิตรซ์ ที่ได้ทำการออแบบนั้นเป็นความถี่ที่เหมาะสม เนื่องจากการทดลองที่ความถี่ต่าง ๆ โดยใช้กำลังงาน 100 วัตต์ ระยะเวลาที่ใช้ 10 วินาที เท่ากัน พบว่าที่กวามถี่ 65 เมกะเฮิตรซ์ มีอัตราการตาขของมอดข้าวสูงที่สุดคือ 67.66 เปอร์เซนต์ และ ความร้อนที่เกิดขึ้นในข้าวมีอุณหภูมิต่ำที่สุดคือ 37.16 องศาเซลเซียส ต่อมาทำการทดสอบที่ความถี่ 65 เมกะเฮิตรซ์ โดยใช้กำลังงานจากวงจรขยายสัญญาณกำลังสูงขนาดตั้งแต่ 20 - 420 วัตต์ เป็นเวลา 1 - 10 วินาที ในการให้ความร้อนกับมอดข้าว ซึ่งผลที่ได้คือที่ระยะเวลาการให้ความร้อน 10 วินาที ต้องใช้กำลังงานมากกว่า 140 วัตต์มอดข้าวจะตาย 100 เปอร์เซนต์ เป็นด้น โดยกำลังงานที่ใช้ในการทดลอง จริงต้องใช้กำลังงานที่สูงกว่ากำลังงานที่ได้จากการคำนวณ เนื่องจากปัจจัยการสูญเสียต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็นการสูญเสียจากสายส่งกำลังงาน ความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในขณะทำ การทดสอบเนื่องทำการทดสอบในระบบเปิด เป็นต้น สรุปผลที่ได้จากการทดสอบวงจรขยายสัญญาณย่านคลื่นความถี่วิทยุที่ได้สร้างและ ออกแบบมีกำลังงาน อัตราขยาย และประสิทธิภาพที่ดีและเมื่อนำไปทดสอบการให้ความร้อน กับมอดข้าวพบว่าสามารถทำให้มอดข้าวตาย 100 เปอร์เซนต์

## 5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

การออกแบบวงจรงขยายสัญญาณกลื่นความถิ่วิทยุสำหรับเครื่องให้ความร้อนแก่ ใดอิเล็กตริก ในส่วนของวงจรงยายสัญญาณกำลังสูงจากการทคลองจะเห็นได้ว่าปัญหาใหญ่ ๆ ในการออกแบบวงจรนี้คือความร้อนของตัวทรานซิสเตอร์ การแมตซ์ชิ่งโหลดเอาต์พุต และจากการ ทดลองจะเห็นได้ว่าอัตรางยายและประสิทธิภาพการทำงานเป็นดังที่ได้ออกแบบไว้ แต่จะเห็นว่าได้ กำลังของสัญญาณเอาท์พุตประมาณ 420 วัตต์เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากเมื่อทำการเพิ่มกำลังของ สัญญาณอินพุตมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลให้ทรานซิสเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น และอาจจะทำให้วงจร เกิดการเสียหายได้ และการที่วงจรมีอุณหภูมิสูงนั้นอาจเนื่องมากจากระบบระบายความร้อนไม่ สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่าที่ควร และในส่วนของภาควงจรตัวปล่อยคลื่นการออกแบบแผ่น เพลตมีผลต่อการให้ความร้อนอย่างมาก ดังนั้นการออกแบบจึงควรกำนึงถึงความเหมาะสมกับการ ใช้งานเพื่อให้ได้กำลังงานที่ดีที่สุดสำหรับนำไปใช้งานต่อไป

## 5.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต

แนวทางการพัฒนาต่อไปของวงจรขยายสัญญาณคลื่นความถิ่วิทยุสำหรับเครื่องให้ความ ร้อนแก่ไดอิเล็กตริกสามารถออกแบบโดยการเพิ่มส่วนของวงจรขยายสัญญาณให้มากขึ้นอีกเพื่อเพิ่ม กำลังและประสิทธิภาพของวงจร และสามารถออกแบบให้วงจรมีกำลังงานสูงสำหรับนำไปสู่การ ประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่อไปได้

#### รายการอ้างอิง

- ชาญชัย ทองโสภา. (2549). <mark>การออกแบบวงจรคลื่นความถี่วิทยุ.</mark> เอกสารประกอบการสอน สำนัก วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- An1034., (1993). Three Balun Designs for Push Pull Amplifiers., Semiconductor Application Note Rev0 Motorola, Freescale Semiconductor, Inc
- Cripps Steve C., (1999)., **RF Power Amplifiers for Wireless Communications**., Artech House, ISBN 0 89006 989 1
- C. Li, J. Wang, and J. Zhu, (2010). Experiment and Theoretical Study on Thermal Performance of Honeycomb Ceramic Regenerative Heat Exchanger, Power and Energy Engineering Conference (APPEEC) Asia-Pacific,p. 1-6
- H. Oka, S. Uchidate, N. Sekino, Y. Namizaki, K. Kubota, H. Osada, F.P. Dawson, and J.D.Lavers,
   (2011). Electromagnetic Wave Absorption Characteristics of Half Carbonized
   Powder Type Magnetic Wood, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 47, p. 3078-3070
- Marijana PražiĆ GoliĆ, Goran AndriĆ and Petar KljajiĆ., (2011)., Effects of 50°C temperature on Sitophilus granarius (L.), Sitophilus oryzae (L.) and Sitophilus zeamais (Motsch.) Pestic. Phytomed. (Belgrade), 26(3), 2011, 221–227
- Nelson, S. O. and L. E. Stetson. (1974b.). Possibilities for controlling insects with microwaves and lower frequency RF energy. *IEEE Trans. Microwave Theory Tech n.* MTT-22(12): 1303-130.
- Nelson S O (1996). Review and assessment of radio-frequency and microwave energy for stored-grain insect control. Transactions of the ASAE, 39, 1475–1484.
- Nelson, S. O. (1991)., Dielectric properties of agricultural products Measurements and applications, IEEE Trans. Elect. Insul., Vol.26, pp. 845-869.
- P.G. Koehler, W.H. Kern and J.L. Castner., (2012)., Rice Weevil, University of Florida, IFAS Extension, Reviseed.
- P.M. Edward and S. K. Elena., (1997),: Aminopeptidase-Like Activity in Hemolymph Plasma from Larvae of the Gypsy Moth, Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) Comp Biochem Physiol, Vol. 116B, p. 11–18.

- S. Wang1; J. Tang1; J.A. Johnson2; E. Mitcham3; J.D. Hansen4; G. Hallman5; S.R. Drake6;Y.Wang1, (2002)., "Dielectric Properties of Fruits and Insect Pests as related to Radio Frequency and Microwave Treatments", Journal of Food Engineering 57 (2003) 257–268)
- Stephen F. Adam and Hewlett., (1969)., MICROWAVE THEORY AND APPICATIONS AN10800., Application note, Rev. 01,13 October 2009 "Using the BLF578 in the 88 MHz to 108 MHz FM band.
- Tsung-Chi Yu, Chaoen Wang, Lung-Hai Chang, Ming-Chyuan Lin, Meng-Shu Yeh., (2010)., THE DEVELOPMENT OF HIGH POWER SOLID-STATE AMPLIFIER IN NSRRC, Proceedings of IPAC'10, Kyoto, Japan.

Wang, S., Tang, J., Cavalieri, R. P., Davis, D. C. (2003)., Differential Heating of Insects in Dried Nuts and Fruits Associated with Radio Frequency and Microwave
Treatments. American Society of Agricultural Engineers, Transactions of the ASAE, Vol. 46(4): 1175–1182.


## ภาคผนวก ก

# รายละเอียดข้อมูลทรานซิสเตอร์เบอร์ BLF578



# BLF578

Power LDMOS transistor

Rev. 02 — 4 February 2010

Product data sheet

#### 1. Product profile

#### 1.1 General description

A 1200 W LDMOS power transistor for broadcast applications and industrial applications in the HF to 500 MHz band.

#### Table 1. Application information

Mode of operation	f	VDS	PL	Gp	ηο
	(MHz)	(V)	(W)	(dB)	(%)
CW	108	50	1000	26	75
pulsed RF	225	50	1200	24	71

CAUTION

This device is sensitive to ElectroStatic Discharge (ESD). Therefore care should be taken during transport and handling.

#### 1.2 Features

- Typical pulsed performance at frequency of 225 MHz, a supply voltage of 50 V and an  $I_{Dq}$  of 40 mA, a  $t_p$  of 100  $\mu$ s with  $\delta$  of 20 %:
  - Output power = 1200 W
  - Power gain = 24 dB
  - Efficiency = 71 %
- Easy power control
- Integrated ESD protection
- Excellent ruggedness
- High efficiency
- Excellent thermal stability
- Designed for broadband operation (10 MHz to 500 MHz)
- Compliant to Directive 2002/95/EC, regarding Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

#### 1.3 Applications

- Industrial, scientific and medical applications
- Broadcast transmitter applications







# **BLF578**

Power LDMOS transistor

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
IDSX	drain cut-off current	V <sub>GS</sub> = V <sub>GS(th)</sub> + 3.75 V; V <sub>DS</sub> = 10 V	58	70	-	A
IGSS	gate leakage current	V <sub>GS</sub> = 11 V; V <sub>DS</sub> = 0 V	-	-	280	nA
R <sub>DS(on)</sub>	drain-source on-state resistance	V <sub>GS</sub> = V <sub>GS(th)</sub> + 3.75 V; I <sub>D</sub> = 16.66 A	•	0.07		Ω
Crs	feedback capacitance	V <sub>GS</sub> = 0 V; V <sub>DS</sub> = 50 V; f = 1 MHz	-	3	-	pF
C <sub>iss</sub>	input capacitance	V <sub>GS</sub> = 0 V; V <sub>DS</sub> = 50 V; f = 1 MHz	-	403	-	pF
Coss	output capacitance	V <sub>GS</sub> = 0 V; V <sub>DS</sub> = 50 V; f = 1 MHz	-	138	-	pF

#### Table 7. RF characteristics

Mode of operation: pulsed RF;  $t_p = 100 \ \mu s$ ;  $\delta = 20 \ \%$ ;  $f = 225 \ MHz$ ; RF performance at  $V_{DS} = 50 \ V$ ;  $I_{Dq} = 40 \ mA$ ;  $T_{case} = 25 \ C$ ; unless otherwise specified; in a class-AB production test circuit.

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Тур	Мах	Unit
Gp	power gain	P <sub>L</sub> = 1200 W	23	24	25.4	dB
RLin	input return loss	P <sub>L</sub> = 1200 W	14	17.5	-	dB
ηD	drain efficiency	P <sub>L</sub> = 1200 W	68	71	-	%











NXP Semicondu	ctors			BLF578
				Power LDMOS transistor
Table 9.         List of com           For production test circl         Printed-Circuit Board (F           thickness copper plating         Circuit Board (F	nponents uit, see <u>Figure 11</u> and <u>Figure 12</u> . PCB): Rogers 5880; s <sub>r</sub> = 2.2 F/m; hei g = 35 µm.	ght = 0.79 mm; Cu (top/botto	m n	netallization);
Component	Description	Value		Remarks
C1, C2, C11, C12	multilayer ceramic chip capacitor	4.7 μF		TDK4532X7R1E475Mt020U
C2, C3, C27, C28	multilayer ceramic chip capacitor	100 nF		Murata X7R 250 V
C5, C7, C8, C21, C22	multilayer ceramic chip capacitor	1 nF	[1]	
C6	multilayer ceramic chip capacitor	30 pF	[1]	
C9, C10, C13, C15	multilayer ceramic chip capacitor	62 pF	[1]	
C14	multilayer ceramic chip capacitor	36 pF	[1]	
C16, C17	multilayer ceramic chip capacitor	24 pF	[1]	
C18	multilayer ceramic chip capacitor	30 pF	[1]	
C19	multilayer ceramic chip capacitor	27 pF	[1]	
C20	multilayer ceramic chip capacitor	9.1 pF	[1]	
C23	multilayer ceramic chip capacitor	13 pF	[1]	
C24	multilayer ceramic chip capacitor	16 pF	[1]	
C25, C26	electrolytic capacitor	220 μF; 63 V		
L1, L2	3 turns 1 mm copper wire	D = 2 mm; length = 3 mm		
L3, L12	stripline			(L $\times$ W) 15 mm $\times$ 2.4 mm
L4, L5, L10, L11	stripline			(L $\times$ W) 47 mm $\times$ 10 mm
	stripline			(L $\times$ W) 8 mm $\times$ 15 mm
L6, L7, L8, L9		20.0814		
L6, L7, L8, L9 R1, R2	metal film resistor	2 12; U.O VV		
L6, L7, L8, L9 R1, R2 R3, R4	metal film resistor metal film resistor	20 Ω; 0.6 W		
L6, L7, L8, L9 R1, R2 R3, R4 R5, R6	metal film resistor metal film resistor metal film resistor	20 Ω; 0.6 W 1 Ω; 0.6 W		

[1] American Technical Ceramics type 100B or capacitor of same quality.

Product data sheet

BLF578\_2

Rev. 02 — 4 February 2010

© NXP B.V. 2010. All rights reserved. 9 of 14





Power LDMOS transistor

### 10. Abbreviations

Table 10.	Abbreviations
Acronym	Description
CW	Continuous Wave
EDGE	Enhanced Data rates for GSM Evolution
GSM	Global System for Mobile communications
HF	High Frequency
LDMOS	Laterally Diffused Metal-Oxide Semiconductor
LDMOST	Laterally Diffused Metal-Oxide Semiconductor Transistor
RF	Radio Frequency
TTF	Time To Failure
VSWR	Voltage Standing-Wave Ratio

### 11. Revision history

Document ID	Release date	Data sheet status	Change notice	Supersedes
BLF578_2	20100204	Product data sheet	-	BLF578_1
Modifications:	<ul> <li>Table 1 on j</li> <li>Section 1 o</li> <li>Table 4 on j</li> <li>Table 5 on j</li> <li>Table 5 on j</li> <li>Table 5 on j</li> <li>Figure 1 on</li> <li>Table 6 on j</li> <li>Table 6 on j</li> <li>Table 7 on j</li> <li>Section 8.2</li> </ul>	page 1: added information f n page 1: changed typical v page 2: changed maximum page 3: changed value of R page 3: added information a page 3: added figure. page 3: added figure. page 3: added values vor V page 3: changed values vor V page 4: changed some valu .1 on page 6: changed some	for CW performance. value of $\eta_D$ . value of $I_D$ . $h_{(j-c)}$ . about $Z_{th(j-c)}$ . GSq- ue of $I_{DSX}$ . ies. ies graphs.	
BLF578_1	20081211	Objective data sheet	-	-

Product data sheet

BUF578\_2

Rev. 02 — 4 February 2010

Power LDMOS transistor

**BLF578** 

#### 12. Legal information

#### 12.1 Data sheet status

Document status[1][2]	Product status	Definition
Objective [short] data sheet	Development	This document contains data from the objective specification for product development.
Preliminary [short] data sheet	Qualification	This document contains data from the preliminary specification.
Product [short] data sheet	Production	This document contains the product specification.

[1] Please consult the most recently issued document before initiating or completing a design.

[2] The term 'short data sheet' is explained in section "Definitions".

[3] The product status of device(s) described in this document may have changed since this document was published and may differ in case of multiple devices. The latest product status information is available on the internet at URL http://www.rup.com.

#### 12.2 Definitions

Draft — The document is a draft version only. The content is still under internal review and subject to formal approval, which may result in modifications or additions. NXP Semiconductors does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of information included herein and shall have no liability for the consequences of use of such information.

Short data sheet — A short data sheet is an extract from a full data sheet with the same product type number(s) and title. A short data sheet is intended for quick reference only and should not be relied upon to contain detailed and full information. For detailed and full information see the relevant full data sheet, which is available on request via the local NXP Semiconductors sales office. In case of any inconsistency or conflict with the short data sheet, the full data sheet shall prevail.

Product specification — The information and data provided in a Product data sheet shall define the specification of the product as agreed between NXP Semiconductors and its customer, unless NXP Semiconductors and customer have explicitly agreed otherwise in writing. In no event however, shall an agreement be valid in which the NXP Semiconductors product is deemed to offer functions and qualities beyond those described in the Product data sheet.

#### 12.3 Disclaimers

Limited warranty and liability — Information in this document is believed to be accurate and reliable. However, NXP Semiconductors does not give any representations or warranties, expressed or implied, as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information.

In no event shall NXP Semiconductors be liable for any indirect, incidental, punitive, special or consequential damages (including - without limitation - lost profits, lost savings, business interruption, costs related to the removal or replacement of any products or rework charges) whether or not such damages are based on tort (including negligence), warranty, breach of contract or any other legal theory.

Notwithstanding any damages that customer might incur for any reason whatsoever, NXP Semiconductors' aggregate and cumulative liability towards customer for the products described herein shall be limited in accordance with the *Terms and conditions of commercial sale* of NXP Semiconductors.

Right to make changes — NXP Semiconductors reserves the right to make changes to information published in this document, including without limitation specifications and product descriptions, at any time and without notice. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof.

Suitability for use — NXP Semiconductors products are not designed, authorized or warranted to be suitable for use in medical, military, aircraft, space or life support equipment, nor in applications where failure or malfunction of an NXP Semiconductors product can reasonably be expected to result in personal injury, death or severe property or environmental damage. NXP Semiconductors accepts no liability for inclusion and/or use of NXP Semiconductors products in such equipment or applications and therefore such inclusion and/or use is at the customer's own risk.

Applications — Applications that are described herein for any of these products are for illustrative purposes only. NXP Semiconductors makes no representation or warranty that such applications will be suitable for the specified use without further testing or modification.

NXP Semiconductors does not accept any liability related to any default, damage, costs or problem which is based on a weakness or default in the customer application/use or the application/use of customer's third party customer(s) (hereinafter both referred to as "Application"). It is customer's sole responsibility to check whether the NXP Semiconductors product is suitable and fit for the Application planned. Customer has to do all necessary testing for the Application in order to avoid a default of the Application and the product. IXP Semiconductors does not accept any liability in this respect.

Limiting values — Stress above one or more limiting values (as defined in the Absolute Maximum Ratings System of IEC 60134) will cause permanent damage to the device. Limiting values are stress ratings only and (proper) operation of the device at these or any other conditions above those given in the Recommended operating conditions section (if present) or the Characteristics sections of this document is not warranted. Constant or repeated exposure to limiting values will permanently and irreversibly affect the quality and reliability of the device.

Terms and conditions of commercial sale — NXP Semiconductors products are sold subject to the general terms and conditions of commercial sale, as published at <u>http://www.nxp.com/profile/terms</u>, unless otherwise agreed in a valid written individual agreement. In case an individual agreement is concluded only the terms and conditions of the respective agreement shall apply. NXP Semiconductors hereby expressly objects to applying the customer's general terms and conditions with regard to the purchase of NXP Semiconductors products by customer.

No offer to sell or license — Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents or other industrial or intellectual property rights.

Export control — This document as well as the item(s) described herein may be subject to export control regulations. Export might require a prior authorization from national authorities.

Non-automotive qualified products — Unless the data sheet of an NXP Semiconductors product expressly states that the product is automotive qualified, the product is not suitable for automotive use. It is neither qualified nor tested in accordance with automotive testing or application requirements. NXP Semiconductors accepts no liability for inclusion and/or use of non-automotive qualified products in automotive equipment or applications.

In the event that customer uses the product for design-in and use in automotive applications to automotive specifications and standards, customer (a) shall use the product without NXP Semiconductors' warranty of the

BLF578\_2 Product data sheet

Rev. 02 — 4 February 2010

© NXP B.V. 2010. All rights reserved. 12 of 14

# **BLF578**

Power LDMOS transistor

#### 12.4 Trademarks

Notice: All referenced brands, product names, service names and trademarks are the property of their respective owners.

product for such automotive applications, use and specifications, and (b) whenever customer uses the product for automotive applications beyond NXP Semiconductors' specifications such use shall be solely at customer's own risk, and (c) customer fully indemnifies NXP Semiconductors for any liability, damages or failed product claims resulting from customer design and use of the product for automotive applications beyond NXP Semiconductors' standard warranty and NXP Semiconductors' product specifications.

#### 13. Contact information

For more information, please visit: http://www.nxp.com

For sales office addresses, please send an email to: salesaddresses@nxp.com

BLF578\_2 Product data sheet

Rev. 02 — 4 February 2010

© NXP B.V. 2010. All rights reserved. 13 of 14

**BLF578** Power LDMOS transistor

#### 14. Contents

1	Product profile	1
1.1	General description	1
1.2	Features	1
1.3	Applications	1
2	Pinning information	2
3	Ordering information	2
4	Limiting values	2
5	Thermal characteristics	3
6	Characteristics	3
6.1	Ruggedness in class-AB operation	4
7	Application information	5
7.1	Reliability	5
8	Test information	6
8.1	Impedance information	6
8.2	RF performance	6
8.2.1	1-Tone CW pulsed	6
8.3	Test circuit	8
9	Package outline	10
10	Abbreviations	11
11	Revision history	11
12	Legal information	12
12.1	Data sheet status	12
12.2	Definitions	12
12.3	Disclaimers	12
12.4	Trademarks	13
13	Contact information	13
14	Contents	14



Please be aware that important notices concerning this document and the product(s) described herein, have been included in section Legal information'.

© NXP B.V. 2010. For more information, please visit, http://www.rxp.com For sales office addresses, please send an email to: salesaddresses@rxp.com Date of release: 4 February 2010 Document identifier: BLF578\_2

## ภาคผนวก ก

# รายชื่อบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่



# บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Ratniyomchai, K., Santalunai, S., Thosdeekoraphat, T. and Thongsopa, C. (2013). Optimization of Capacitor Copper Plate for Dielectric Heating to Eliminate Insect. Applied Mechanics and Materials Vol. 343 (2013) pp 101-105.



Applied Mechanics and Materials Vol. 343 (2013) pp 101-105 Online available since 2013/Jul/31 at www.scientific.net © (2013) Trans Tech Publications, Switzerland doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.343.101

#### Optimization of Capacitor Copper Plate for Dielectric Heating to Eliminate Insect

Kongsak Ratniyomchai<sup>a</sup> Samran Santalunai<sup>b</sup> Thanaset Thosdeekoraphat<sup>c</sup> and Chanchai Thongsopa<sup>d</sup>

School of Telecommunication Engineering, Suranaree University of Technology Nakhonratchasima 30000, Thailand

<sup>a</sup>k.ratniyomchai@gmail.com, <sup>b</sup>santalunai.sja@gmail.com, <sup>c</sup>thanaset@sut.ac.th, <sup>d</sup>chan@sut.ac.th

Keywords: Dielectric heating, Series resonance, Eliminate insect, Plate capacitor

**Abstract.** This paper presents the optimization of dielectric heating by using capacitor copper plate material. It has dimension of 50x50 mm. and the distance between plates is 3 mm. This work is used for preheating of insect and pests. Considering the RLC resonance circuit and the power per heating area, the rice weevils are used for sample dielectric. While the power transfer is varied from 10 - 80 watt and resonance frequency at 65 MHz for analysis, the rice weevils are died when the power transfer are more than 70 watt in 1 second. Moreover, It the power transfer is decrease, the period of time is increase. Approximate 10 watt of power transfer, the plate copper has less power so the rice weevils are breaking. Therefore, the power transfer has an effect on the heating area, which is the relation of the fast time.

#### Introduction

In recent years, the heating technology has been developed for many applications. This technology can be used for all of industry and household, which are such as ceramic industry and preserved industry. The source of heating power has various types, which are gas, induction heating, radio frequency, and microwave frequency. Especially, the heating source from radio frequency. Because the radio frequency range is reacted with molecule structure, the molecular quake is occurred. And the molecular quake is the cause of rapidly and regularly heat. The preheating by using radio frequency is preheating technical for pole molecular structure, it is famous application [1,2] The dielectric heating is used to induce the frequency wave and is transmit the power into lossless dielectric medium by using plate capacitor. The plate capacitor is the medium which is radiated the electric field. It has an effect and dielectric material which is the heating. The main parameter of resonance frequency, radiation pattern of wave in the loss factor dielectric, and power. The important parameter is the characteristic of dielectric which is related with the frequency [3,4]. The part of plate capacitor is importance because it used for optimize the power. Because of the problem of insect in agriculture, the chemicals are used to solve a problem for agriculture [5]. But is has the chemical which leaf over a product. From this paper, the organism of pest has a liquid which induce radio frequency and then the heating is occurred [6]

In this paper, the dielectric heating is presented by using capacitor copper plate material, it use for clear up the pest. Considerity, the copper plate which has the dimension of 50x50 mm. and has the distance between plate of 3 mm. Moreover, the rice weevils are used for sample dielectric. When the power source approximate 70 watt, the rice weevils are heat very fast and it is dead in 1 second. Conversely, if the power source is low, the period of time is increased. Therefore, the power source an effect on the heating area, which if the both of thing is satisfied, the period of time is decreased.

#### **Dielectric heating**

The material property known as the loss factor  $\varepsilon$  is the ability of the dielectric material to convert the applied electric field into heat. The higher the loss factor is, the easier the dielectric material is tobe affected by dielectric heating. Materials with a loss factor greater than 0.02 are generally considered

All rights reserved. No part of contents of this paper may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the written permission of TTP, www.tbp.net. (ID: 171.5.138.9-07/01/14.03.47.49)

#### Construction Materials and Computer Engineering II

for dielectric heating [7]. However, temperature can sometimes increase the loss factor of some. products. The permittivity denoted by the symbol  $\varepsilon$  is the ability of a dielectric material to be polarized. Dividing the permittivity by the permittivity of free space  $\varepsilon_0 = 88 \times 10^{10} F/m$  resulted in the relative permittivity (dielectric constant). the dielectric constant vary with the frequency applied and the temperature of the material. The power absorbed by the material is the value of heat generated through the material and is represented as Eq. 1

$$P = E^2 \sigma = 2\pi f E^2 \varepsilon_0 \varepsilon^2 \tag{1}$$

Where, P is power density (W/m<sup>3</sup>), *E* is rms electric field strength in the material (V/m),  $\sigma$  is conductivity (1  $\Omega$ m), *f* is applied frequency (Hz)  $\varepsilon_0$  is permittivity of free space (F/m) and  $\varepsilon'$  is loss factor. The rate of temperature increase (C/s). It is represented as Eq. 2 Where, *c* is specified heat of the material (kJ/kg °C) and  $\rho$  is density of the material (kg/m<sup>3</sup>)

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{P}{\rho c} \tag{2}$$

The penetration depth is defined as the depth at which the power bas decayed to 0.368 (l/e) of its maximum value [8]. It may vary depending on the loss factor and the frequency used. Usually, the higher the loss factor is, the lower the penetration depth will be. As wavelength increases, the penetration depth increases as well. The relationship between wavelength and penetration depth is expressed as Eq. 3 where,  $d_p$  is penetration depth (cm) and c is speed of light (3x10<sup>8</sup>)

$$d_{p} = \frac{c}{2\pi f \sqrt{2\varepsilon \left[\sqrt{1 + (\varepsilon' / \varepsilon')^{2}} - 1\right]}}$$
(3)

#### **Capacitance of parallel plates**

For the dielectric heating, it is high efficiency heating technical. It use the principle of alter noting electric field between anode and cathode of plate capacitor. The material heating is placed between anode and cathode of electric field, which the molecular of dielectric material is continually reversed pole at the resonance frequency for the reverse direction of pole. Because of the fiction of molecular movement, the dielectric material is rapidly heat. The structure of the plate capacitor is show in Fig. 1.



Fig. 1 The structure of the plate capacitor

The capacitance of plate can be calculated by Eq. 4, where A is plate area, d is distance between plates and  $\varepsilon$  is permittivity of material. The electric field between two large parallel plates is given by Eq.5, where  $\sigma$  charge density and V is voltage difference between the two plates. [7]

$$C = \frac{\varepsilon A}{d} \tag{4}$$

102

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{V}{d} \tag{5}$$

#### **Circuit configurations**

The RLC resonance circuit is used to design the dielectric heating analysis is shown in Fig. 2(a). It can be analyze the circuit, which bring about the voltage in plate capacitor  $(V_c)$  and put across inductance  $(V_t)$  From equation  $XC = 1/(2\pi fC)$ ,  $XL = 2\pi fL$ ,  $V_c = IXC$  and  $V_L = IXC$  In addition,  $V_c$  is equal  $V_t$  at the resonance circuit. The dimension of plate is 50×50 mm. and the distance between plate (d) is 3 mm. The plate capacitor value can be calculated from Eq. 4, which is 7.38 pF. Moreover, the induction value is 0.81 µH at the resonance frequency. And then, the calculation of power that is used for analyze the plate capacitor voltage  $(V_c)$ , is illustrated in Fig. 2(b). When the dielectric heating is prospered and the power is increased, so the voltage that is put across plate capacitor is directed variation with the power.



Fig. 2 (a) RLC series resonance circuit and (b) Voltage is put across capacitance of power

#### Thermal analysis of dielectric material

Analysis of dielectric heating reproduces dielectric material as rice weevil, which rice weevil has the temperature of 48 °C or 120 °F [9], it can assassinate the rice weevil at this temperature. The specified heat of the material (*c*) has value of 3.45 (kJ/kg °C) and the density of the material  $\rho$  of 1000 kg/m<sup>3</sup> From Eq. 2, the power density per time can be calculated, the temperature is 48 °C in 60 second. After that, electric field energy (*E*) is calculated from Eq.1, when the resonance frequency of 65 MHz and loss factor of 2.1 [10], the electric field energy can shown in Fig. 3(a). Furthermore, Fig. 3(b) shows the analysis of power for dielectric heating. We found that, the power transfer is decrease; the period of time is increase. Approximate 70 watt of power transfer, the rice weevils are died in 1 second.

103



Fig. 3 (a) Electric field energy per time and (b) Power calculate per time

#### **Experimental Results**

To verify the calculation results, the dielectric heating is tesed by using RLC series resonance circuit and electical power is 10 - 80 watt, resonance frequency at 65 MHz. On  $50 \times 50$  mm. Plate capacitor and distance between plate of 3 mm. For dielectric heating, it uses the 5 rice weevils for dielectric and tested by 2 case are used the rice weevils in plate capacitor before transfer source and after transfer source. The mesurement of time is 60 second and the power is increased from 10 watt to 80 watt. It seem that the dielectric heating as shown in Fig. 4(a). Finally, the calculation and measurement results is satisfied, as shown in Fig. 4(b).



Fig. 4. (a) The dielectric tested setup and (b) The Result of Power calculate per time and Power measurement

In fig.4 (b) When compare the result of power calculate and power measurement. We found that, the results of measurement have tended in the direction of the calculation. When the power source is high, the rice weevils are heat very fast and it is dead very fast too case all. The rice weevils are died when the power transfer are more than 70 watt in 1 second. Conversely, if the power source is low, the period of time is increased. Therefore, the power source an effect on the heating area, which if the both of thing is satisfied, the period of time is decreased.

#### Conclusions

In this paper, presents the optimization of dielectric heating by using RLC series resonance circuit and electrical power is 10-80 watt, resonance frequency at 65 MHz and tested by using capacitor copper plate material, it use for clear up the pest. Considerate, the copper plate which has the dimension of 50x50 mm. and has the distance between plate of 3 mm. Moreover, the 5 rice weevils

#### **Applied Mechanics and Materials Vol. 343**

are used for sample dielectric by 2 case are used the rice weevils in plate capacitor before transfer source and after transfer source. the rice weevils are heat very fast and it is dead in 1 second case all, when the power source are more than 70 watt. Conversely, if the power sources are low, the period of time is increased. Therefore, the power source an effect on the heating area, which if the both of thing is satisfied, the period of time is decreased.

#### **Acknowledgements**

This work was supported by Suranaree University of Technology (SUT) and by the Office of the Higher Education under NRU project of Thailand.

#### References

- H. Oka, S. Uchidate, N. Sekino, Y. Namizaki, K. Kubota, H. Osada, F.P. Dawson, and J.D. Lavers,: Electromagnetic Wave Absorption Characteristics of Half Carbonized Powder-Type Magnetic Wood, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 47, (2011), p. 3078-3070
- [2] C. Li, J. Wang, and J. Zhu,: Experiment and Theoretical Study on Thermal Performance of Honeycomb Ceramic Regenerative Heat Exchanger, Power and Energy Engineering Conference (APPEEC) Asia-Pacific, (2010), p. 1-6
- [3] B. Sonerud, T. Bengtsson, J. Blennow and S.M. Gubanski, Dielectric heating in insulating materials subjected to voltage waveforms with high harmonic content, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 16, (2009), p. 926-933
- [4] Y. Okamoto, R. Himeno, K. Ushida, A. Ahagon and K. Fujiwara,: A Dielectric Heating Analysis Method With Accurate Rotational Motion of Stirrer Fan Using Nonconforming Mesh Connection, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 44, (2008), p. 806-809,
- [5] J. Larry Zettler and F. H. Arthur,: Chemical control of stored product insects with fumigants and residual treatments, Crop Protection Vol.1, (2000), p. 577-582
- [6] P.M. Edward and S. K. Elena,: Aminopeptidase-Like Activity in Hemolymph Plasma from Larvae of the Gypsy Moth, Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) Comp Biochem Physiol, Vol. 116B, (1997) p. 11–18
- [7] V. Komarov,: Dielectric and Thermal Properties of Materials at Microwave Frequencies, Handbook, Artech House, 2012
- [8] S. Wang, J. Tang, J.A. Johnson, E. Mitcham, J.D. Hansen, G. Hallman, S.R. Drake, and Y. Wang,: Dielectric Properties of Fruits and Insect Pests as related to Radio Frequency and Microwave Treatments, Biosystems Engineering, Vol. 85, (2003), p. 201-212
- [9] O. Sitophilus and P. G. Koehler,: Rice Weevil, University of Florida, IFAS Extension, Reviseed 2012
- [10] Nelson, O. Stuart,: Agricultural applications of dielectric measurements, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 13, (2006), p.688-702



# ประวัติผู้เขียน

นายคงศักดิ์ รัตน์นิยมชัย เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ที่อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2546 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี 2550

ในปี พ.ศ. 2553 ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และขณะที่ศึกษาในระดับปริญญาโท ได้มีผลงานวิชาการที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับนานาชาติ 1 ฉบับในปี 2556 ในงาน Applied Mechanics and Materials (ICSCMCE 2013) ในหัวข้อ "Optimization of Capacitor Copper Plate for Dielectric Heating to Eliminate Insect"

